## Bericht der Frühjahrstagung der Studiengruppe für Elektronische Instrumentierung 29. bis 31. März 2004, im DESY Hamburg



Herausgeber: Dr.-Ing. F. Wulf HMI-B 599 Berlin, Mai 2004

ISSN 0936 - 0891

## Bericht der Frühjahrstagung der Studiengruppe für Elektronische Instrumentierung 29. bis 31. März 2004, im DESY Hamburg



Herausgeber: Dr.-Ing. Friedrich Wulf HMI-B 599 Berlin, Mai 2004

ISSN 0936 - 0891

Hahn-Meitner-Institut Berlin, Abteilung Experimentsysteme / DS Glienicker Str. 100

14109 Berlin



## E

### **Teilnehmerliste**

NameInstitutBadura, Dr. EugenGSI DarmstadtBeck, Dr. DietrichGSI Darmstadt

Becker, Heinz Privat

Bloenningen, Dr. Fred Bustec Computer GmbH

Borutta, Dr. Hans TÜV Thüringen Brand, Dr. Holger GSI Darmstadt

Brandt, Bernd-August Privat

David, Dörte DESY Hamburg

Dickinson, Andrew Racal Instruments GmbH

Drochner, Dr. Matthias Forschungszentrum Jülich GmbH, ZEL

Düring, Arp Nico von Plein & Baus GmbH

Gemmeke, Prof.Dr. Hartmut
Goettmann, Walter
Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH
Grimm, Bernhard
Haeupke,
Hering, Stephan

Forschungszentrum Karlsruhe IPE
Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH
Max-Planck-Institut für Astronomie
Struck Innovative Systeme SIS GmbH
powerBridge Computer Vertriebs GmbH

Hermes, Normen Forschungszentrum Jülich GmbH Hoffmann, Hans-Jürgen Forschungszentrum Jülich GmbH

Holler, Dr. York DESY Hamburg

Hombach, Thomas Forschungszentrum Jülich GmbH Hürttlen, Werner Forschungszentrum Jülich GmbH

Jamal, Rahman National Instruments
Kammering, Raimund DESY Hamburg

Kiel, Dr. Lenze AG

Kleines, Harald Forschungszentrum Jülich GmbH Koch, Karsten Dr. Gesellschaft für Schwerionenforschung

Kordtomeikel, Dirk Beckhoff Industrie Elektronik

Krause, Helmut Universität Hamburg II Inst. f. Experimentalphysik

Leich, Dr. Holger DESY Hamburg

Meier Schulz - Electronic GmbH

Müller, Dr. Klaus Forschungszentrum Jülich GmbH Nelkner, Jürgen Schulz - Electronic GmbH

Notz, Dr. Dieter DESY Hamburg

Nowack, Dr. Ing. Gerd Ruhr-Universität Bochum

Przybilla, Waldemar Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH Rausch, Rainer Forschungszentrum Jülich GmbH

Reinecke, Matthias DESY Hamburg

Richter, Dr. Mathias Gesellschaft für Schwerionenforschung Richter, Günter Hahn-Meitner-Institut Berlin GmbH Rönpage, Thomas National Instruments Germany GmbH

Rüschmann, Gustav Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut .f .Kernphysik

Schoeneburg, Bernd DESY Hamburg

Schütt, Jürgen Universität Hamburg II Inst. f. Experimentalphysik

Simrock, Stefan DESY Hamburg



## E

## **Teilnehmerliste**

Spelthann, Hans Dieter Acqiris Data Conversion Instruments

Stolper, Matthias DESY Hamburg

Stork, Raimund Powerbridge Computer Vertriebs GmbH

Thiemer, Uwe GSI Darmstadt Vetrov, Dr. Petr DESY Hamburg

Walter von, Peter Universität Heidelberg, Physikalisches Institut

Wulf, Dr. FriedrichHahn-Meitner-Institut Berlin GmbHWüstner, Dr. PeterForschungszentrum Jülich GmbH, ZELZillikens, Hans-PeterForschungszentrum Jülich GmbH



## E

Vorträge Kapitel Seite Begrüßung und Organisatorisches Dr. Friedrich Wulf I-XV 0 Ein elektronisches Logbuch – Entwicklung und Erfahrungen 1 - 11 1 Raimund Kammering, DESY Architektur eines Interlok - Systems für TTF2 / XFE 2 12 - 27 H. Leich, DESY **Hermes Recoil Detektor** 3 Mathias Reinecke, DESY Digitale Hochfrequenzregelung für den UV-FEL 28 - 58Stefan Simrock, DESY Temperaturmessung unter 5K, Cryokontroller 59 - 70 Bernd Schoeneburg, DESY Die Historie der SEI-Tagungen 71 - 85Bernd-August Brandt **Professional Data Acquisition And Control** 86 - 98 Fred Blönningen, RACAL / BUSTEC Maximale Skalierbarkeit mit LabVIEW 99 -114 Von der einfachen Datenerfassungsapplikation bis hin zur FPGA-Lösung Thomas Rönpage, National Instruments **EtherCat** 9 115-133 Dirk Kordtomeikel, Beckhoff **Ethernet Powerlinks Übersicht** 10 134-146 Wolfgang Schnurbusch, Ethernet Powerlink, Firma Lenze Neue Busstandards, PCI-X, Infiniband, VME 2eSST 11 147-167 Stefan Hering, Thomas Holzapfel, powerbridge Computer "Neue Produkte" 12 168-176 Raymond Chevalley, Acgiris Messung des Echtzeitverhaltens von Simatic S7 Steuerungen im Kontext 13 177-195 physikalischer Experimente Harald Kleines, FZJ ZEL Roadmap und Grenzen der Halbleitertechnik 14 196-209 Prof. Dr. H. Gemmeke, FZK IPE Messplatz für Laserinduzierte HF-Leitfähigkeit 210-213 15 Günter Richter, HMI-Berlin Parallelkursregelung schneller, mobiler Roboter 16 214-222 Dr. Gerd Nowack, Ruhr-Universität Bochum Serielle Datenübertragung zeitkritischer Signale für Multidetektoren 17 223-234 Waldemar Przybilla, HMI-Berlin

## **Einleitung**

F. Wulf, HMI-Berlin

Der Bericht der Studiengruppe für Elektronische Instrumentierung von der Frühjahrstagung 2004 enthält 17 Vorträge, die vom 29. bis 31. März 2004 am DESY in Hamburg gehalten wurden. Ich danke allen Vortragenden und Autoren für die ausgezeichneten Beiträge und deren Dokumentationen. Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. D. Notz und Kollegen für die ausgezeichnete Organisation und interessante Gestaltung des Rahmenprogramms.

Dank der intensiven Recherche von Herrn Bernd-August Brandt (Sekretär dieser Tagung von 1967 bis 1994) konnte die Entstehung und der Beginn dieser Tagungsreihe genau belegt werden. Die SEI Tagung am DESY in Hamburg ist somit die 88. Tagung der Studiengruppe. Herr Brandt hat in seinem Vortrag "Historie der SEI-Tagungen" mit großer Sorgfalt die einzelnen Aspekte seit Beginn dieser Tagung zusammengestellt. Zu beachten sind auch die weiteren Aktivitäten die aus der "Keimzelle" der 60er Jahre entstanden sind. Bemerkenswert ist weiterhin die Tatsache, dass im Mittel die Beteilung an den Sitzungen sich von 1961 bis heute kaum geändert hat. An dieser Stelle nochmals meinen Dank an Herrn B.-A. Brandt für die umfassende und sorgfältige Zusammenstellung über die Historie der SEI-Tagungen.

Neben den spezifischen Fachthemen wurden die derzeitigen und zukünftigen Lösungen zur schnellen Übertragung von Daten über Kabel- und Backplaneverbindungen vorgestellt. Hierbei sind die seriellen Verbindungen mit ihren hohen Datenraten (u.a. Infiniband 12x ermöglicht eine Bruttodatenrate von 60 Gb/s) stark im Vormarsch. PCI-Express vereinheitlicht die I/O Struktur für Grafik, Netzwerk und Massenspeicher mit einer Bandbreite von derzeit 8 GB/s.

Ethernet für Echtzeitanwendungen führt immer weiter zur Ablösung der unterschiedlichen Feldbussysteme, wobei es auch hierbei mehr als 11 Varianten auf dem Markt gibt. Ethernet Powerlink bietet mit der fortgeschrittenen Standardisierung (Version 2.0, Nov. 2003) und der starken Industriebeteiligung eine zukunftsträchtige Lösung. Durch EtherCAT wird eine kostengünstige Lösung für den Anschluss einzelner I/O Module/Kanäle an das Ethernet mit hoher Datenrate und geringem time jitter ermöglicht. Die EtherCAT Cips sind für Ende 2004 angekündigt. Die Skalierbarkeit von LabVIEW wird durch die FPGA-Programmierung weiter vorangetrieben. Einen Ausblick über die zukünftige Entwicklung der Mikro-Nano Technologie zeigt, dass die Grenzen in den nächsten 10-20 Jahren noch nicht erreicht werden. Es gibt also weiterhin viel zu tun.

Für die kommende Herbsttagung vom 27.9. - 29.9.2004 im Forschungszentrum Rossendorf (Zentralabteilung Forschungstechnik) ist geplant, die Themen EMV und CE-Zeichen sowie bleifreies Löten in den Vordergrund zu stellen.

Berlin, Juni 2004



Ausstellung



Eröffnungsrede Friedrich Wulf









H. Leich



**Mathias Reinecke** 



Stefan Simrock



Bernd Schoeneburg



Fred Blönningen



**Bernd-August Brandt** 



Thomas Rönpage



Wolfgang Schnurbusch



Thomas Holzapfel



**Stefan Hering** 



**Raymond Chevalley** 



**Harald Kleines** 



H. Gemmeke



Günter Richter



**Gerd Nowack** 







Abschlussrede Friedrich Wulf



Gruppenbild

DOOCS

TESLA

# Ein elektronisches Logbuch Entwicklung und Erfahrungen

Raimund Kammering -MVP- DESY Hamburg

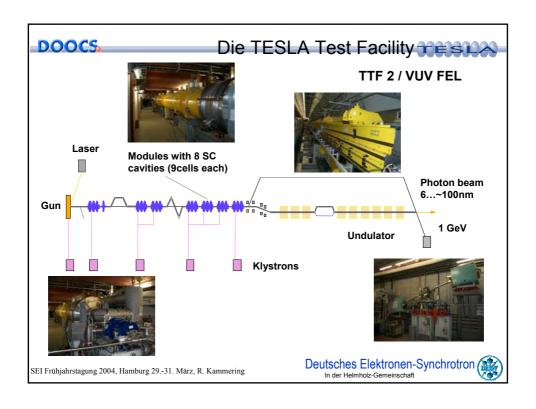
SEI Frühjahrstagung 2004, Hamburg 29.-31. März, R. Kammering



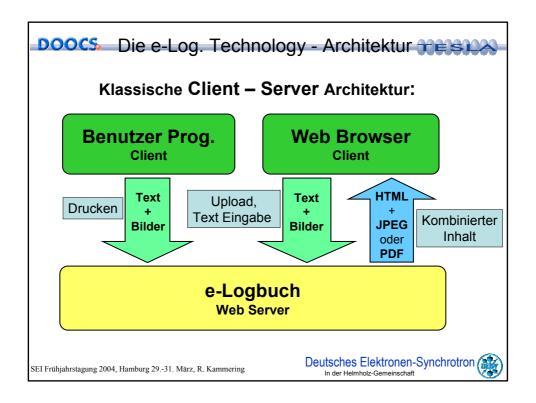
#### DOOCS

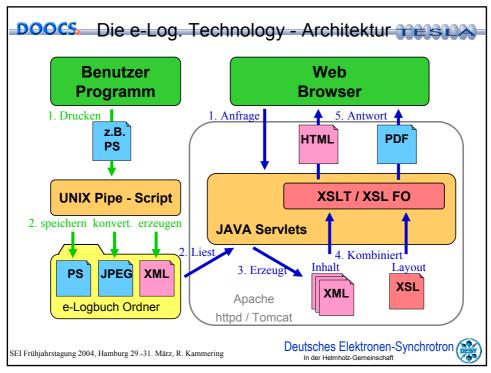
- Die TESLA Test Facility (TTF)
- Das TTF Logbuch
- Die e-Logbuch Technology
  - Architektur
  - XML, XSL etc.
  - Die Benutzeroberfläche (GUI)
- Einige Statistik
- Ausblick und Zusammenfassung











#### DOOCS XML: eXtensible Markup Language TESIAN

#### Ein typischer Logbuch Eintrag

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
t>
 <entrv>
   <text>This is the text field of the logbook!</text>
   <title>This is a new logbook</title>
   <isodate>2003-02-07</isodate>
   <time>19:24</time>
   <severity>NONE</severity>
   <category>USERLOG</category>
   <keywords>Linac Status
   <author>Kay Rehlich</author>
   <file>new file.jpeg</file>
   <link>new file.ps</link>
   . .
  </entry>
</list>
```



```
DOOCS XSL: eXtensible Stylesheet Language
 <?xml version="1.0"?>
 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="list">
                                                         Template 'list':
   <html>
     <body BGCOLOR="#cccccc">

    erzeugt HTML Seite

       <TABLE>

    erzeugt Tabelle

         <xsl:apply-templates select="entry">

    ruft 'entry' Template für

           <xsl:sort order="descending,"</pre>
                                                           jeden 'entry' in 'list'
                      select="time"/>
         </xsl:apply-templates>
                                                         · sortiert 'entries' absteigend
       </TABLE>
                                                           nach 'time'
     </body>
   </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template name="entry">
                                                         Template 'entry':
   <TR>
     <TD BGCOLOR="#99fffff">

    erzeugt Tabellenzeile

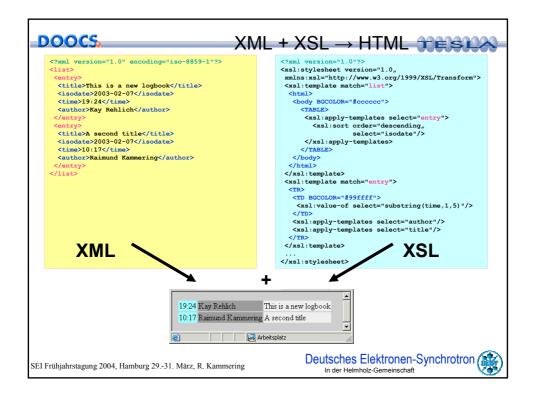
       <xsl:value-of select="substring(time,1,5)"/>

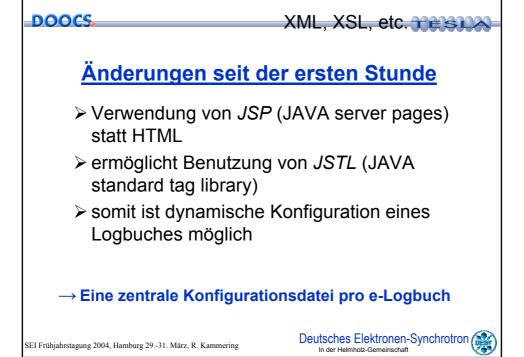
    erzeugt Tabellenzelle

     </TD>
                                                         · fügt Zeit ein
     <xsl:apply-templates select="author"/>

    ruft weitere Templates

     <xsl:apply-templates select="title"/>
   </TR>
  </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>
                                                    Deutsches Elektronen-Synchrotron
SEI Frühjahrstagung 2004, Hamburg 29.-31. März, R. Kammering
                                                        In der Helmholz-Gemeinschaft
```





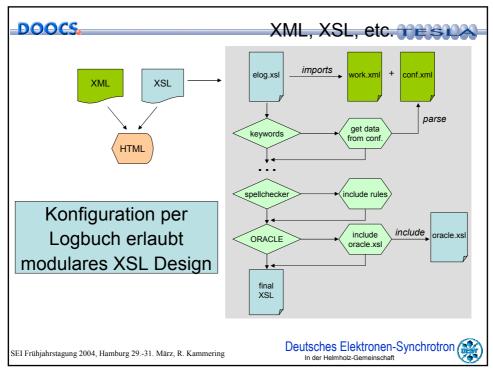
```
DOOCS
                                                  XML, XSL, etc.
    <!-- define the name of the logbook, displayed on each page -->
    <name>TTF eLogBook</name> -

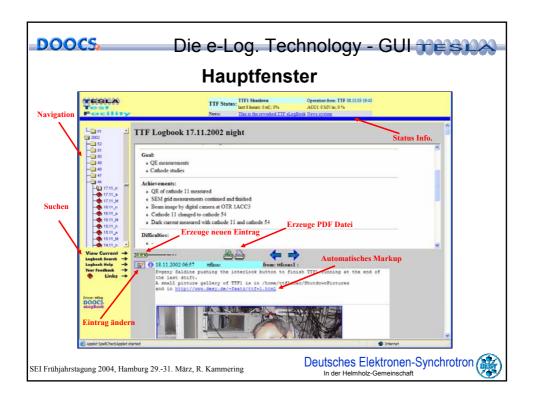
    Logbuch name

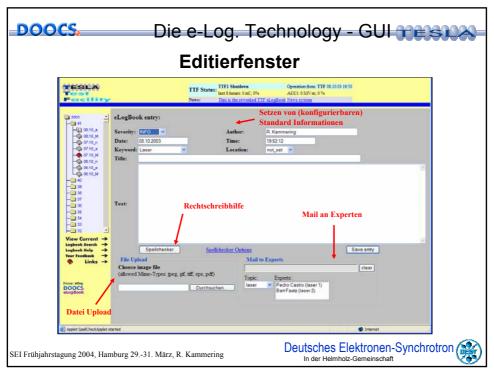
    <!-- period to create a new shift -->
    <!-- formats are: Y = year, M = month, W = week, D = day, 3 = 3 shifts a day -->
    <new_shift>M</new_shift> -
                                                    Schichtrhythmus
    <!-- language code, possible values: en, de -->
    <lang_code>en</lang_code>

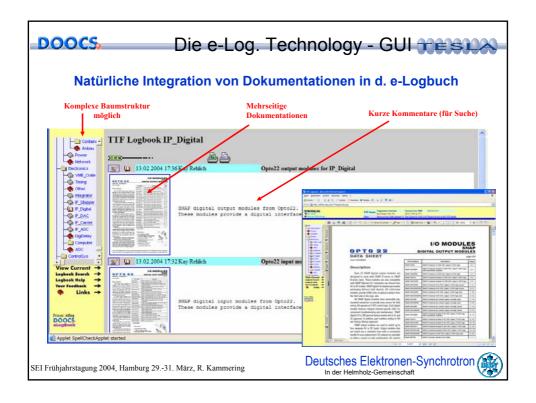
    Darstellungssprache

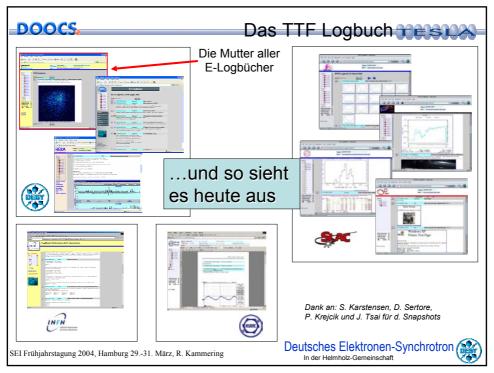
    <!-- date formatting, posssible formats are: -->
    <!-- date_fmt>MM/dd/yyyy</date_fmt -->
                                                  Datumsformat
    <!-- date_fmt>yyyy-MM-dd</date_fmt -->
    <date_fmt>dd.MM.yyyy</date_fmt>
    <!-- title string for each shift in strftime(3C) format --> Datumsformat (Titel)
    <title date>%B %Y</title date> *
    <!-- Shall text be 'above' or 'beside' the images --> ____ Text layout
    <!-- text_pos>above</text_pos -->
    <text pos>beside</text pos>
                                                             Hintergrundfarbe
    <!-- Background color for overall style of the HTML pages (standard rgb notation)-->
    <bgcolor>fffffff</bgcolor>
                                                     Deutsches Elektronen-Synchrotron
SEI Frühjahrstagung 2004, Hamburg 29.-31. März, R. Kammering
                                                         In der Helmholz-Gemeinschaft
```











#### 

#### Statistik für das TTF e-Lobuch:

- In Betrieb seit: 15. Okt. 2001 bis ??
- ~ 20000 Einträge insgesamt
- ~ 8Gb Graphische Daten / ~14Mb ASCII Text

## Bis heute laufen **27** e-Logbücher auf **12** verschiedenen Servern









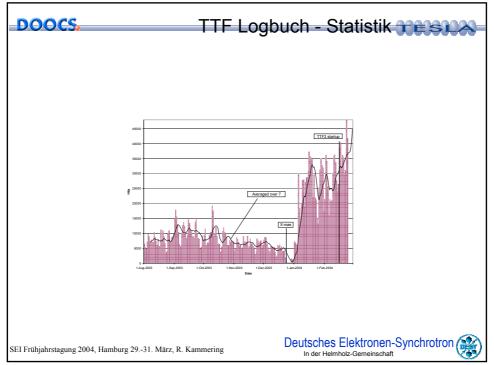












#### DOOCS

#### Zusammenfassung TESIA

#### Das elektronische Logbuch:

- ermöglicht vielen Programmen direkte Eingabe
- ist besser lesbar als handschriftliche Aufzeichnungen
- · involviert mehr Menschen in d. Maschinenoperation
- ermöglicht Experten (schnell), Kommentare, Tipps, etc. zu geben
- bietet Suchfunktion
- · ist der Platz für alle Messergebnisse
- ist ein muss für remote operation
- · bringt Erfahrung mit den Web Technologien
  - → Das e-Logbuch ist ein wichtiges GAN Werkzeug

SEI Frühjahrstagung 2004, Hamburg 29.-31. März, R. Kammering



#### DOOCS

#### Ausblick

#### Mögliche Erweiterungen

- Erweiterung d. Authentifizierung und Autorisierung (LDAP, NIS, ...)
- Weiteres Markup zur Textformatierung (Wiki Style z.B.: \_\_bold\_\_ wird als: bold gedruckt)
- Ausbau des e-Logbuch zu vollwertigem web service (SOAP, WSDL, UDDI - um z.B. über nicht lokale e-Logbücher zu suchen)
- •



DOOCS TESUA

## Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

- Online Quellen:
- e-logbook @ TTF: http://tesla.desy.de/doocs/elogbook
- e-logbook zum testen: http://gan.desy.de/guestelog
- Das TTF e-logbook (DESY intern): http://ttfinfo.desy.de/TTFelog



#### TTF2/XFEL Interlock Architecture

## Holger Leich DESY Zeuthen

- ⇒Joint project: DESY Hamburg and DESY Zeuthen
- ⇒People involved:

#### **DESY Hamburg:**

S. Choroba, H.J. Eckoldt, T. Grevsmuehl, O. Hensler, J. Kahl, F.R. Kaiser,

K. Rehlich, S. Simrock

#### **DESY Zeuthen:**

A. Kretzschmann, H. Leich, U. Schwendicke, R. Wenndorff

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### **Main Task of the Interlock Sytem**

- --> Guarantee operator /other persons safety
- --> to prevent any damage from the cost expensive components of the RF station
- --> also to prevent any damage from other environment

#### **Sources of Interlock Error Signals**

- hard component failures (non-reversible hardware malfunction)
  - --> broken cable or damaged contact, dead sensor, ...
- soft errors (e.g. sparks in the klystron or wave guide system, temperature above a threshold, ...)
- error conditions caused by transient noise from the RF station itself

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### Components of a TTF2/XFEL RF Station

#### **HV Power Supply**

Provide the input voltage of 0-12 KV to the capacitor bank of the Modulator

#### Modulator

Discharges a fraction of the energy stored in the capacitor bank into the pulse transformer. A bouncer circuit
will ensure that the 120 kV high voltage output pulse will be flat i.e. voltage drop will not exceed some
predefined level.

#### **HV Transmission Line**

• Connects the Modulator with the pulse transformer.

#### **Pulse Transformer**

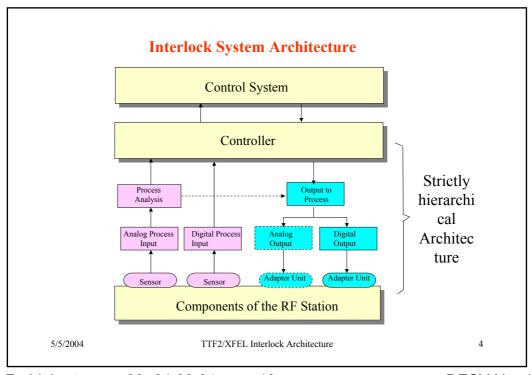
 Transforms the 12 kV, 1200 A pulse generated by the Modulator into a 120 kV, 120 A pulse driving the Klystron cathode voltage.

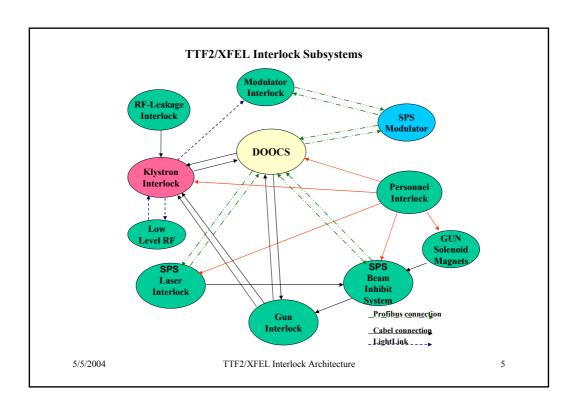
#### Persons and machine safety systems

 Several personnel and machine safety systems are interacting together to provide a safe operation of the whole system

#### Low Level RF System (LLRF)

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture





#### **Interlock Inputs**

- Digital Inputs
  - Oil levels
  - Cooling water flow
  - -Vacuum pump current
- Analog Inputs
  - Oil temperature
  - Cooling water temperature
  - Klystron Filament voltage & current
  - Solenoid voltage & current
  - SF6 gas pressure

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### **Interlock Inputs / Outputs**

- Inputs from other Subsystems
  - Persons interlock
  - RF leakage detector
  - Modulator ready
  - Gun interlock
  - RF system ready
- Interlock Outputs
  - Modulator on
  - Heater power supply on
  - Klystron solenoid power supply on
  - RF enable

5/5/2004

TTF2/XFEL Interlock Architecture

\_

#### **Response Times**

- Ultra Fast (UF):  $R_t < 1 \mu s$
- Fast (F):  $R_t = 1 ... 5 \mu s$
- Normal (N):  $R_t > 5 \mu s$
- --> Actual implementation only N and F
- --> ca. 70 signals to process, number increasing

5/5/2004

TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### The Implementation

→ 19" 4U System with dedicated backplane optimized to the application

→ 3U-Eurocard board format with 2 5-Row connectors (CPCI like ): → 125 + 110 = 235 pins

⇒ enough pin resources per slot and to backplane to build a compact interlock/control

⇒ Front-to-rear connections:

40 Pins • Control Bus: 50 Pins 16 Pins

• Service Request lines: 20 Pins (one per slave slot)

24 Pins · Direct Digital Out: 20 Pins • Service Request Lines:

#### Data throughput:

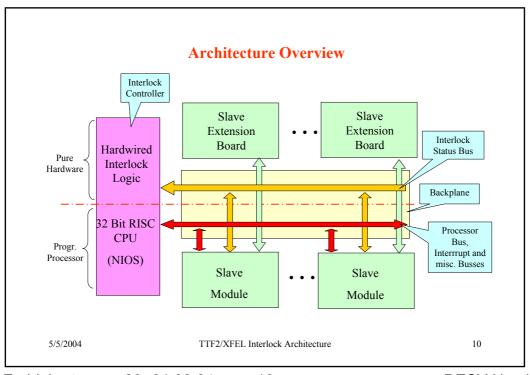
• Time Multiplex Bus:

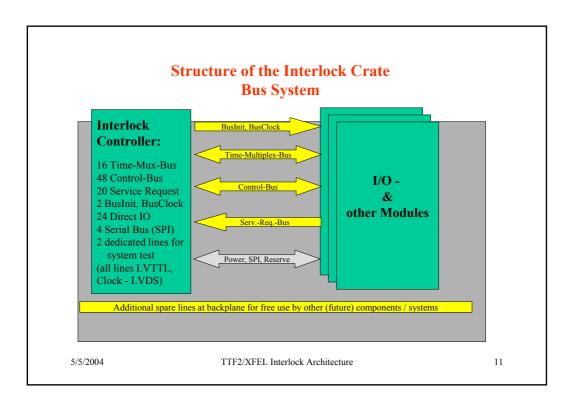
• Control Bus: 15 MBytes/s

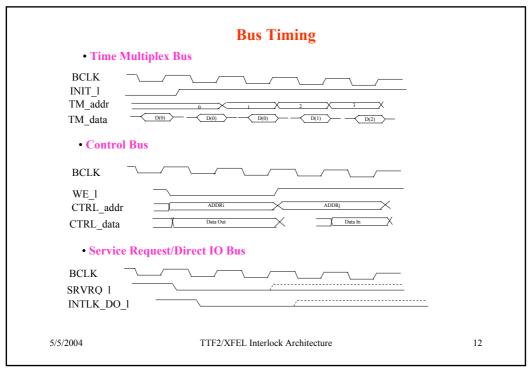
• Time Mux Bus: updates 125 Status signals

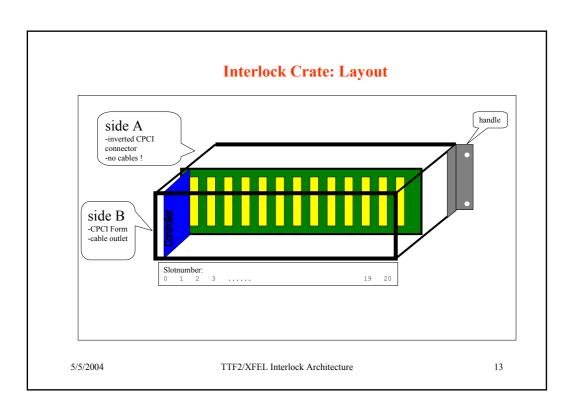
within 1µs

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture









#### **Interlock Selftest**

#### Zu testende Komponenten:

- Controller
- Backplane
- Slaves (alle vorhandenen)
- Netzteil- und Lüfterlogik

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### Prämissen

- Test der Komponenten in einem speziellen Mode (Systemtest) nach RESET
- Übergang in Interlock-Mode nach fehlerfreiem Test
- Im Interlock-Mode nur noch Test der Komponenten, die der Controller-CPU zugänglich sind (zeitzyklisch, Plausibilität, Watchdog zum Interlock)
- Einfache Logik möglichst viel von der Controller-CPU erledigen lassen

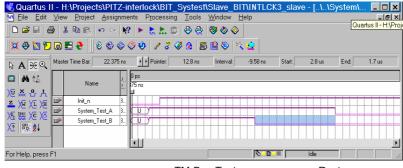
5/5/2004

TTF2/XFEL Interlock Architecture

15

#### Realisierung (I)

- Controller steuert System Test A und System Test B
- Slaves erkennen, daß getestet wird, sperren die Freigaben des Interlock



TM-Bus-Test

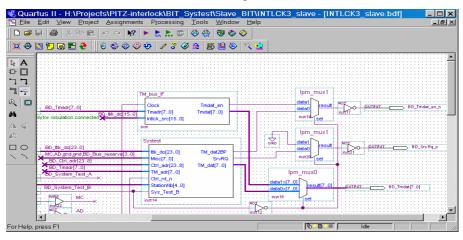
Rest

5/5/2004

TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### Realisierung (II)

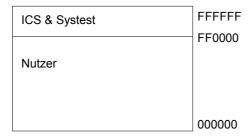
 System\_Test\_A schaltet per MUX TMdat und TMadr in den Control-Adressraum so daß sie vom Controller getestet werden können.



TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### Randbedingungen (I)

- Memory-Map der Slaves muß einheitlichen Regeln folgen, damit sie getestet werden können:
- Adressraum 0-FFFFFF wird aufgeteilt in Nutzer- und ICS (Identification Control and Status) & Systest-Adressraum



5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

18

17

5/5/2004

#### Randbedingungen (II)

- Jeder Modul erhält eine feste Stationsnummer (im FPGA-Design oder per Drehschalter) und darf <u>nur</u> auf der Station (Slot) im Crate stecken, für die er programmiert ist.
- A[23..19] == Stationsnummer im Nutzerbereich
- A[23..13] == 1111 1111 110, A[12..8] == Stationsnummer im ICS-Bereich

System Test space of Module @ Station 20	FFF400-FFF4FF
System Test space of Module @ Station 2	FFE200-FFE2FF
System Test space of Module @ Station 1	FFE100-FFE1FF
reserved for future use	FFE000-FFE0FF
free	
ICS space of Module @ Station 20	FFD400-FFD4FF
ICS space of Module @ Station 2	FFC200-FFC2FF
ICS space of Module @ Station 1	FFC100-FFC1FF
reserved for future use	FF0000-FFC0FF
reserved for special applications	B00000-FEFFFF
address space for Slaves	080000-AFFFFF
reserved for future use	000000-7FFFFF

5/5/2004

TTF2/XFEL Interlock Architecture

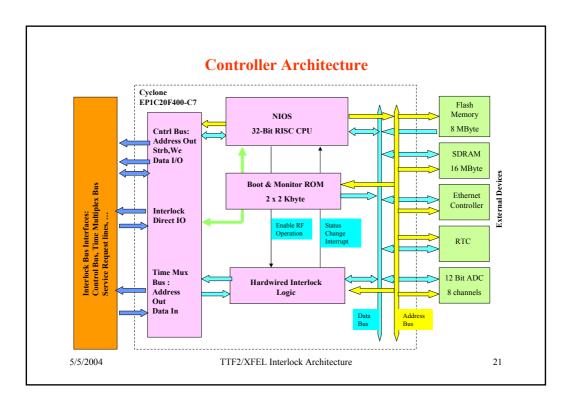
19

#### **Modul ID Structure**

Field type	Field name	Field length	example
		(byte)	
Binary	Station number	1	18
Binary	A/B-side flag	1	1 (B-side)
ASCII	module name	24	controller
ASCII	Version #	8	1.2
ASCII	Prog. File name	24	Controller1.pof
ASCII	Prog. File date	8	051103

5/5/2004

TTF2/XFEL Interlock Architecture



#### **Interface to the Control System**

The 32-bit RISC processor of the Controller performs all necessary control functions to all slave modules in the interlock crate. The interface to the DOOCS Control System is implemented via Ethernet. A TINE server runs on the NIOS processor and provides an interface to a DOOCS client.

- All status information and all mask data will be implemented as properties in the context of TINE
- All actual values of analog input channels are implemented as properties
- All commands to the interlock crate (to the controller) are implemented as DOOCS properties and may be issued by a DOOCS server
- The actual values of the data mentioned above are stored in the DOOCS History Format

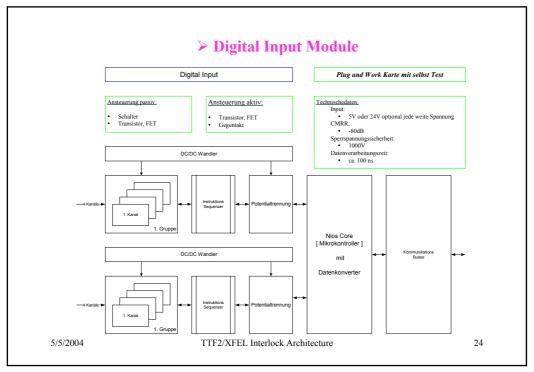
5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

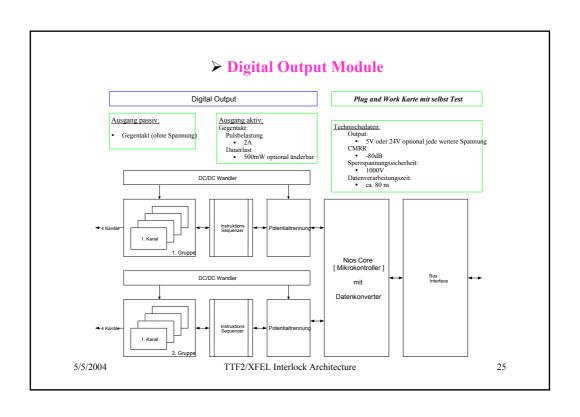
#### **Slave Module Overview**

#### **➤** Digital IO LightLink

- Versatile Link (VL)- or ST- Connectors
- Basic card: 4x Input + 4x Output + max. 2 piggyback's
- piggyback: either 8x Output (VL)
- or 8x Input (VL)
- or 4x Input & 4x Output (VL)
- or 3x Input & 3x Output (ST)

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture 23





	Spezifikation	t Module (Te	Einheiten / Zusatzdaten	_	9 /
L	Spezifikation	Teelinisene Daten	Linkien Zusteruten	_	
Kar	te allgemein				
		Kanäle pro Gruppe	Anzahl	4	
		Gruppen	Anzahl	2	
		Gruppen	Potentialfrei	2	
		Selbstkalibrierung	alle Kanäle	8	
		Selbst-Test	alle Kanäle	8	
		Sensoren	Pt-100		
			Pt-1000		
			Pt-1000 Ultra Low		
		Abtastrate	Sampels/s	100	
		Direkte spannungsmessung	Wahlweise	8	
Kan	nal				
		UMan	Umas = Uinp * PGA1128	1128	
		Uimp	V	+/- 1.25	
		Genauigkeit Ump	μV	+/- 2	
		CMRR	dB	-70	
		max. Kabellänge	m	bis 200	
		Sperrspannung	V	1000	
Ten	nperatur Messung				
		Pt-100			
		Meßbereich min	°C	- 200	
		Meßbereich max	°C	+ 800	
		Genauigkeit	°C	+/- 0.01	
		Meßstrom	mA	1	
		Pt-1000			
		Meßbereich min	°C	- 200	
		Meßbereich max	°C	+ 800	
		Genauigkeit	°C	+/- 0.01	
		Meßstrom	mA	1	
		Pt-1000 Ultra-Low*			
		Meßbereich min	°C	- 273	
		Meßbereich max	°C	+ 800	
		Genauigkeit	°C	+/- 0.01	
		Meßstrom	mA	1	

#### **➤** Analog Input Fast

Spezifikation	Technische Daten	Einheiten / Zusatzdaten	
	•		
Karte allgemein	1	1	
	Kanäle pro Gruppe	Anzahl	2
	Gruppen	Anzahl	4
	Gruppen	Potentialfrei	4
	Selbstkalibrierung	alle Kanäle	8
	Selbst-Test	alle Kanäle	8
	Abtastrate max	Sampels/s	1 Meg
Kanal	•		
	UMas	U <sub>Mass</sub> = U <sub>inp</sub> * PGA <sub>1128</sub>	18
	U <sub>inp</sub>	V	+/- 10
	Genauigkeit Uimp	μV	+/- 152
	CMRR	dB bei 1 MHz	-80
	Eingangsimpedanz	Ω	50 oder 10 Meg
	Kabellänge 10 MΩ	m	20
	Kabellänge 10 MΩ	m	ca. 7
	Abtastrate normal	Sampels/s	800k
	Abtastrate low	Sampels/s	200k
	Eigangssignal	•	DC to 1 MHz
	Sperrspannung	V	1000
	Datentransfer	Bit Parallel	8
	ADC → Signalkonditioner		

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### **➤** Analog Output

Spezifikation	Technische Daten	Einheiten / Zusatzdaten	
	•	•	
Karte allgemein			
	Kanäle pro Gruppe	Anzahl	4
	Gruppen	Anzahl	2
	Gruppen	Potentialfrei	2
	Selbstkalibrierung	alle Kanäle	8
	Selbst-Test	alle Kanäle	8
	Output	Strom	50
Kanal		-	
	Genauigkeit	μV	+/- 152
	CMRR	dB bei 1 MHz	-80
	Ausgangssimpedanz	Ω	200
	Kabellänge	m	20
	Updaterate	update/s	100
	Ausgangssignal	V	05V
	Ausgangssignal	V	010V

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

28

#### Task Matrix

	Task	Resposibility	Status
Hardware	Crate design (mechanics)	Z	done
	Backplane design (Schematics, Layout)	Z	done
	Modul design:		
	- Schematics	Z/HH	done
	– Layout	Z/HH	Partly done
	– FPGA design	Z/HH	Partly done
	– Emb. Processor design	Z/HH	Partly done
Firmware	Power up & periodic system check	Z	done
	Programs for emb. 8051 processors	НН	Partly done
	Subroutines for modul-specific tasks:		
	–SPI routines	Z	done
	-Interlock status readout	Z	done
	-ADC / DAC routines	НН	
Software	RTOS (μCOS-II)	Z	done
	TCP/IP and UDP Stack	Z/HH	Ongoing tests
	DOOCS interface (TINE server)	Z/HH	tbd

5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

#### **New Interlock Crate with Backplane**

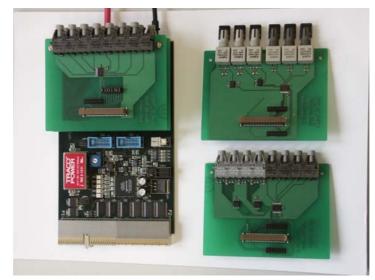


5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture 30

#### **New Interlock Controller Board (Prototype)**



#### **Light Link IO Board (Prototype)**



5/5/2004 TTF2/XFEL Interlock Architecture

32

## Digitale Hochfrequenzregelung für den UV-FEL

# Stefan Simrock DESY

SEI Tagung 2004

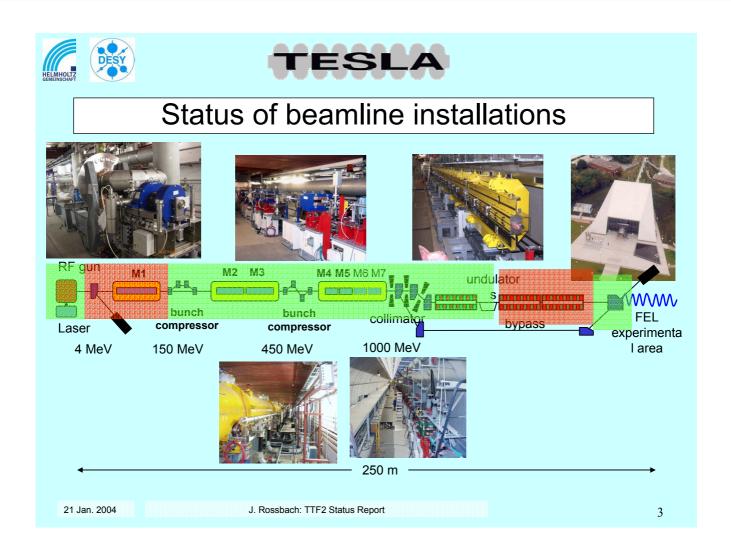
Stefan Simrock

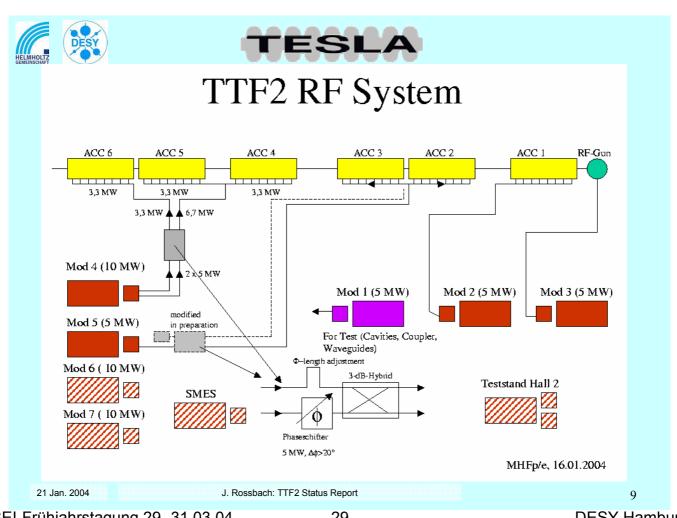


#### **Outline**

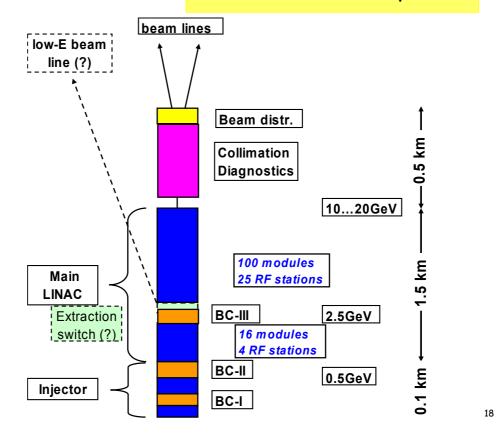
- UV-FEL and European X-FEL
- RF Requirements and Control Issues
- RF Control Design Choices
- UV-FEL RF Control
- Conclusion



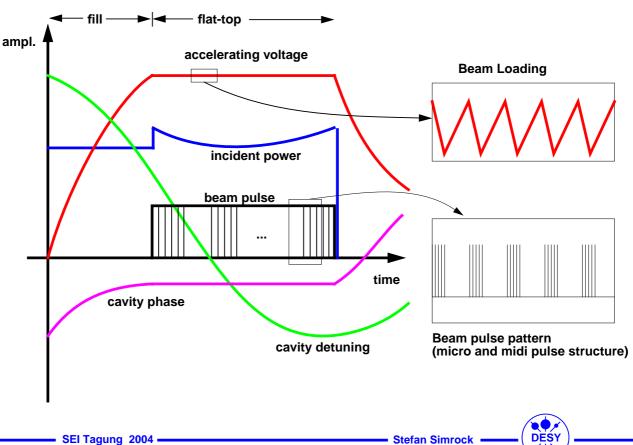




#### Possible XFEL Layout



#### **Typical Parameters in a Pulsed Linac**



Stefan Simrock

#### **Requirements for LLRF Controls**

- Maintain Phase and Amplitude of the accelerating field within given tolerances to accelerate a charged particle beam
- Minimimize Power needed for control
- RF system must be reproducible, reliable, operable, and well understood.
- Other performance goals
  - build-in diagnostics for calibration of gradient and phase, cavity detuning, etc.
  - provide exception handling capabilities
  - meet performance goals over wide range of operating parameters

SEI Tagung 2004

Stefan Simrock



#### **Amplitude and Phase Stability**

- Typically requirements for  $\sigma_E/E < 10^{-4}$  are
  - correlated fast amplitude error :  $\sigma_A/A < 10^{-4}$
  - correlated fast phase error (@-3 deg.):  $\sigma_{\phi} < 0.1$  deg.

Note: Must distinguish correlated and uncorrelated errors, intra-pulse, inter-pulse, and long-term (thermal > minutes). Long term stability of better than 1 deg. is difficult to achieve.

#### **Sources of Perturbations**

#### o Beam loading

- Beam current fluctuations
- Pulsed beam transients
- Multipacting and field emission
- Excitation of HOMs
- Excitation of other passband modes
- Wake fields

#### o Cavity drive signal

- HV- Pulse flatness
- HV PS ripple
- Phase noise from master oscillator
- Timing signal jitter
- Mismatch in power distribution

#### o Cavity dynamics

- cavity filling
- settling time of field

#### o Cavity resonance frequency change

- thermal effects (power dependent)
- Microphonics
- Lorentz force detuning

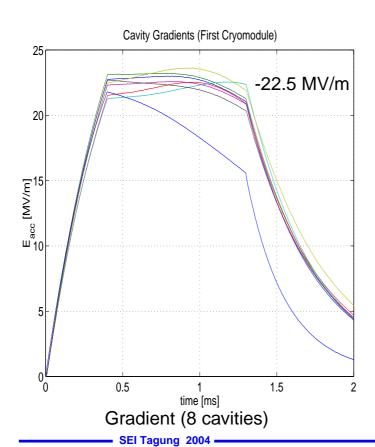
#### o Other

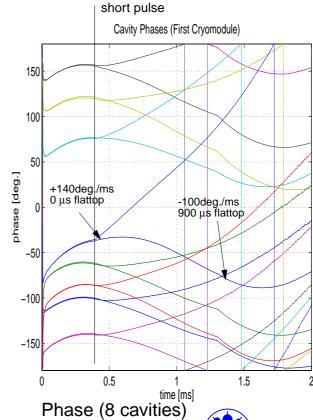
- Response of feedback system
- Interlock trips
- Thermal drifts (electronics, power amplifiers, cables, power transmission system)

SEI Tagung 2004



#### **Pulsed Operation at High Gradients**

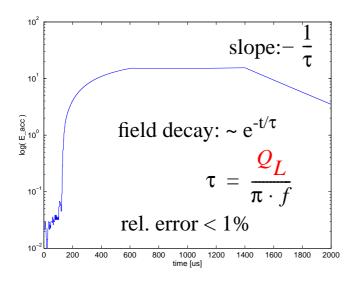


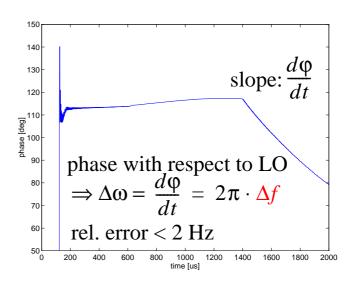


Stefan Simrock

DESY Hamburg

#### Measurement of Cavity Q<sub>L</sub> and Detuning





Loaded Q

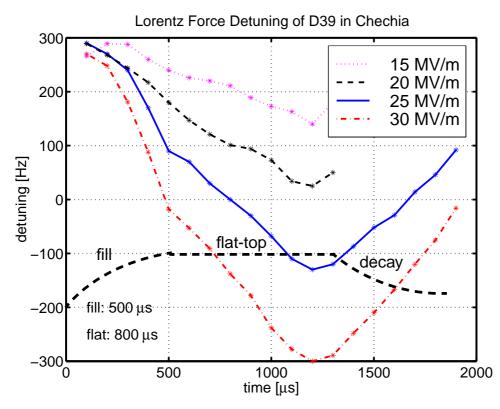
**Detuning** 

**SEI Tagung 2004** 

Stefan Simrock



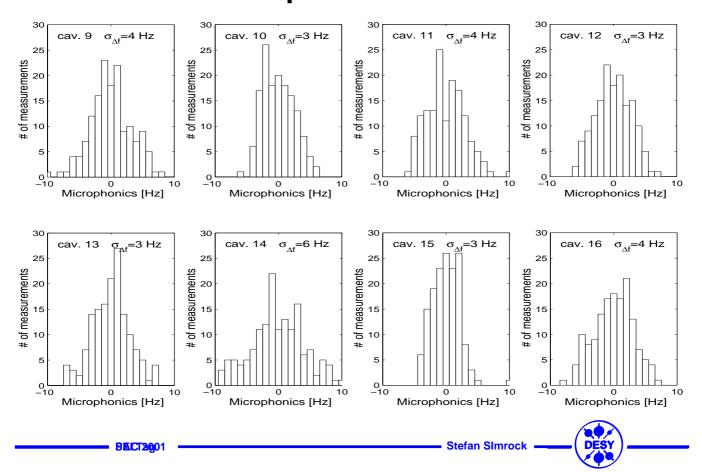
#### **Lorentz Force Detuning**



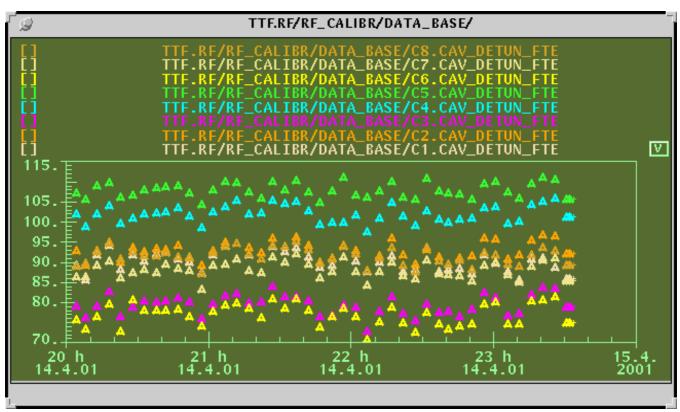
SEI Tagung 2004

Stefan Simrock

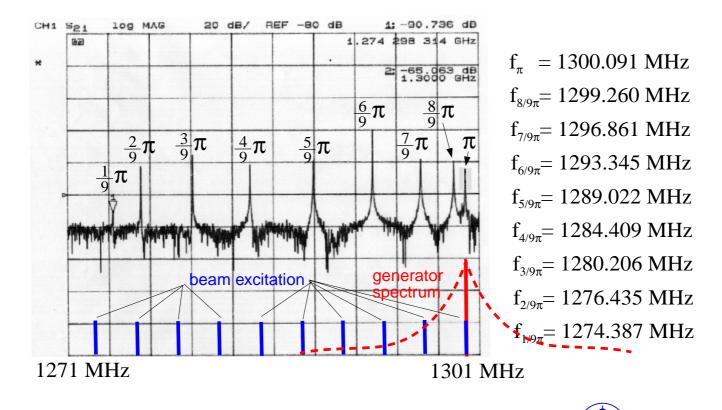
#### **Microphonics at TTF**



#### **Long Term Drift of Resonance Frequency**



#### **Excitation of other Passband Modes**



#### **Control Choices (1)**

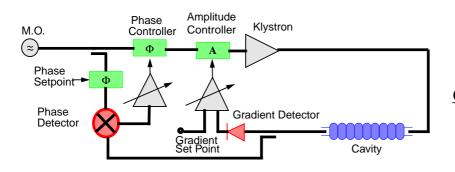
Self-excited Loop (SEL) vs
 Generator Driven System (GDR)

SEI Tagung 2004

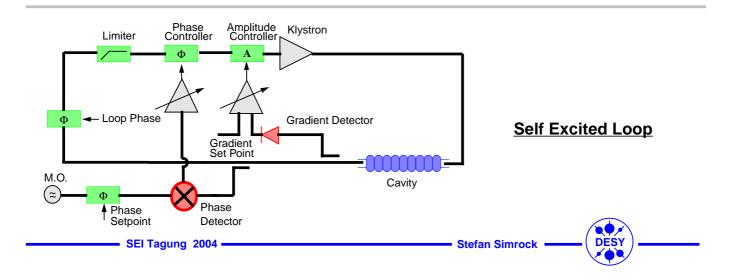
- Vector-sum (VS) vs individual cavity control
- Analog vs Digital Control Design
- Amplitude and Phase (A&P) vs
   In-phase and Quadrature (I/Q) detector and controller



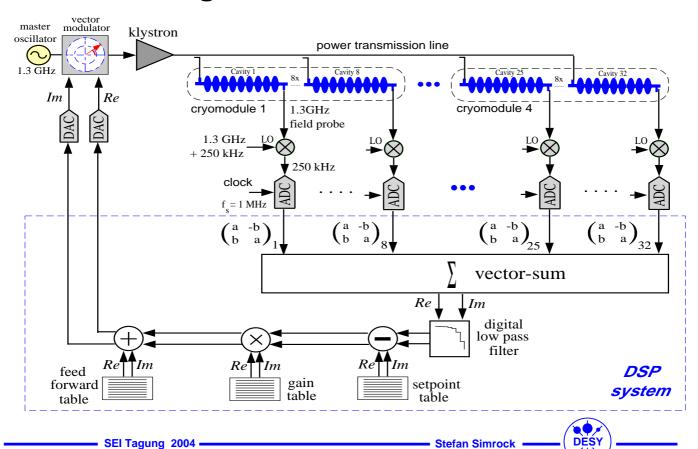
#### **Control Choices (2)**



#### **Generator Driven Resonator**



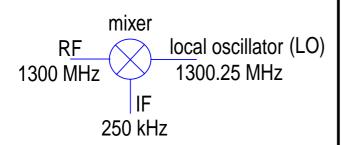
#### **Digital Control at the TTF**



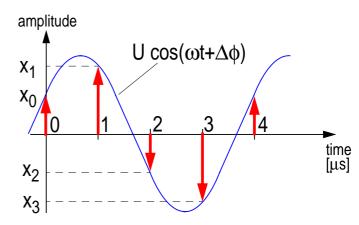
Stefan Simrock

DESY Hamburg

#### **Digital I/Q Detection**



- downconversion of cavity field to IF frequency at 250 kHz
- complete phase and amplitude information of the accelerating field is preserved.



- sample IF signal at 1MHz rate
- subsequent samples describe real and imaginary component of the cavity field.

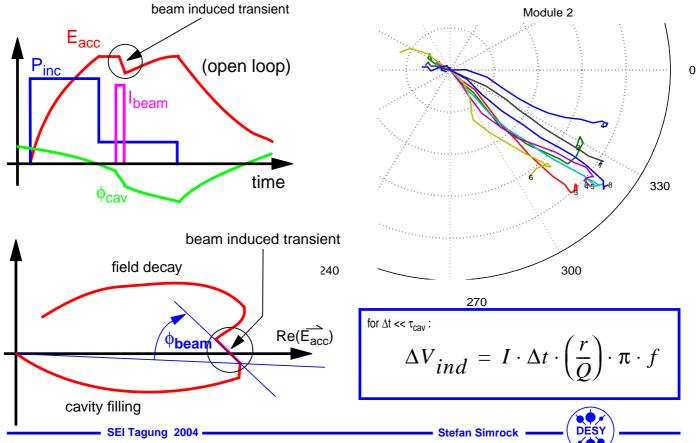
SEI Tagung 2004

Stefan Simrock

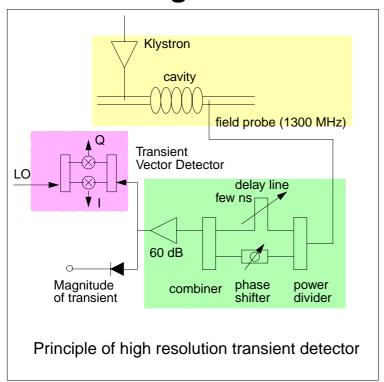


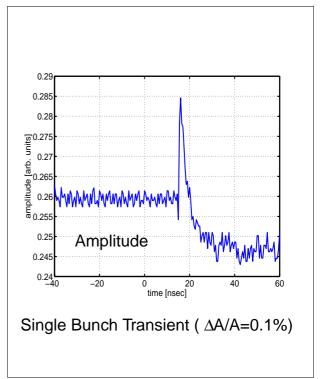
DESY Hamburg

#### **Beam Transient based Phase and Gradient Calibration**



#### **Single Bunch transient Detection**



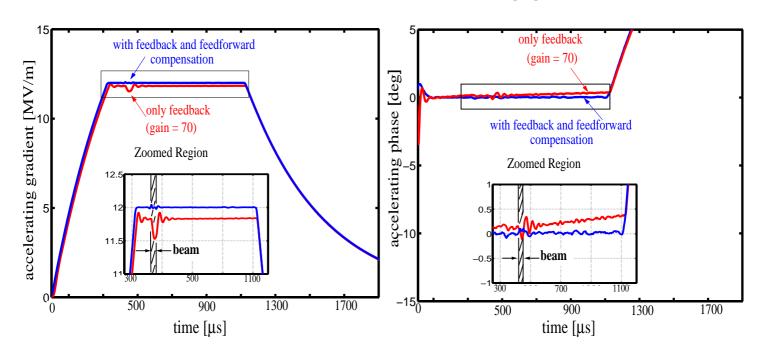


SEI Tagung 2004

Stefan Simrock



#### Performance at TTF (1)

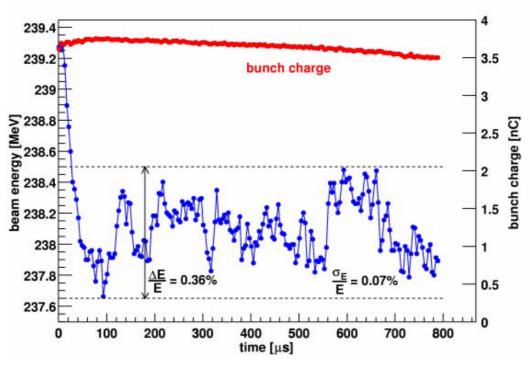


**Amplitude** 

**Phase** 



#### Performance at TTF (2)



Operation with long beam pulses

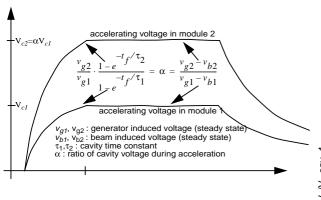
SEI Tagung 2004

Stefan Simrock

 $\tau_2 / \tau_1$ 



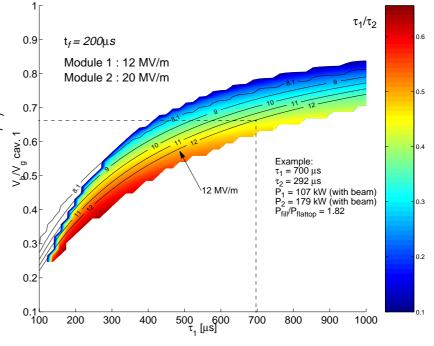
#### **Operation at Different Gradients**



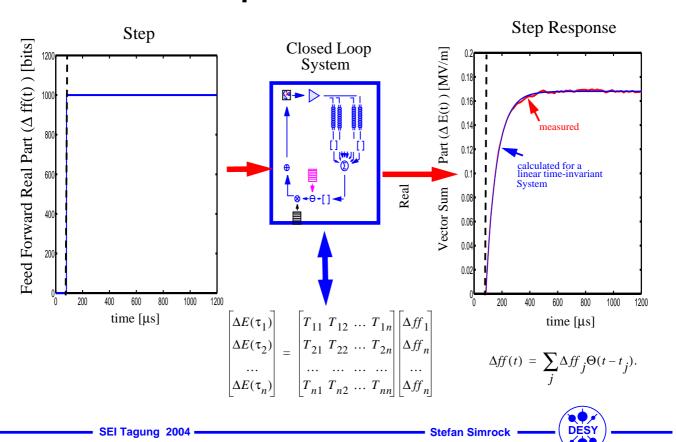
Operation at different gradients is only possible in narrow parameters range:

- gradient
- beam current

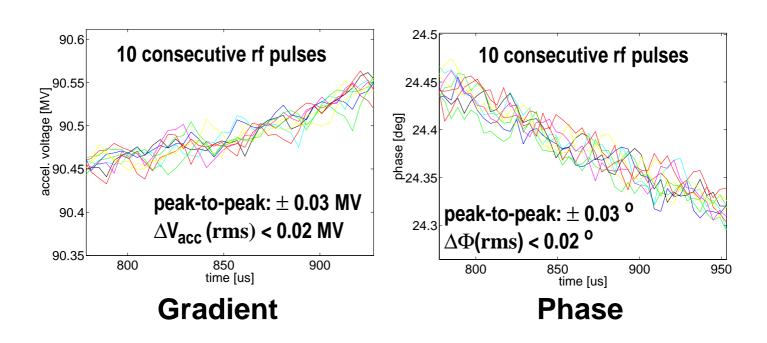
Deviation from this conditions leads to slopes on individual gradients.



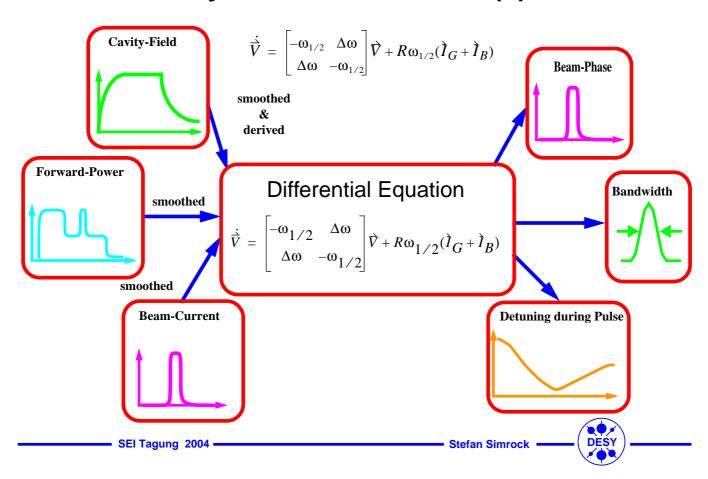
#### **Adaptive Feedforward**



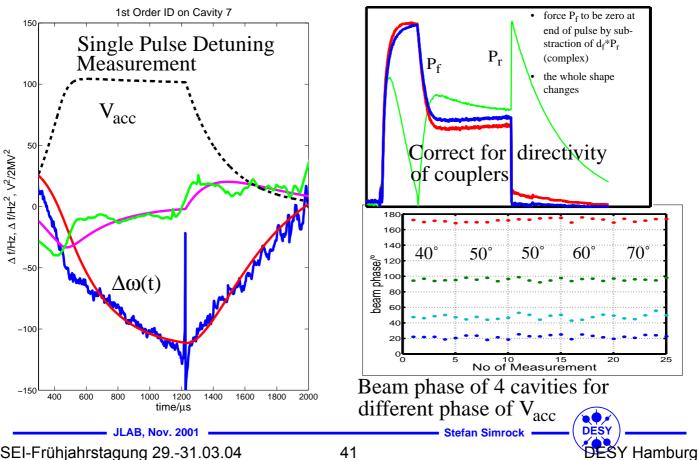
#### Reproducibility of Subsequent Pulses of Vector-Sum



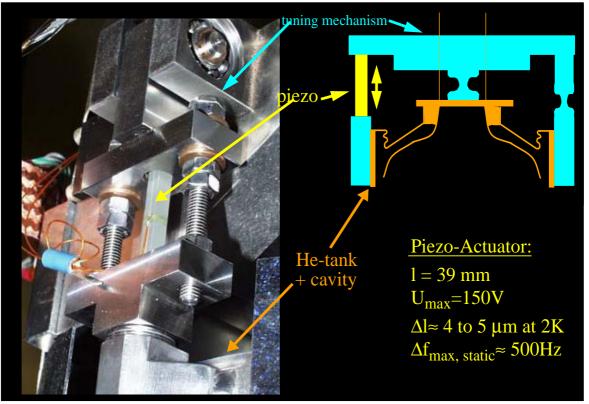
#### **System Identification (1)**



#### **System Identification (2)**



#### **Active Compensation of Lorentz Force Detuning (1)**

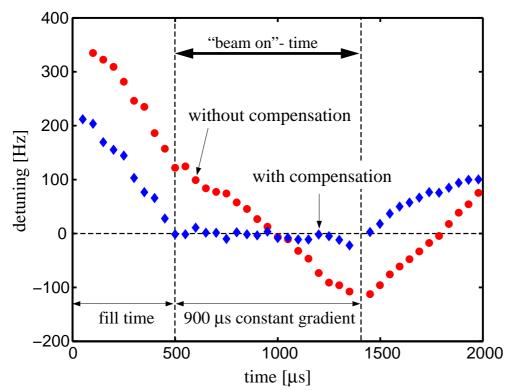


SEI Tagung 2004

Stefan Simrock



#### **Active Compensation of Lorentz Force Detuning (2)**



9-cell cavity operated at 23.5 MV/m

Lorentz force compensated with fast piezoelectric tuner

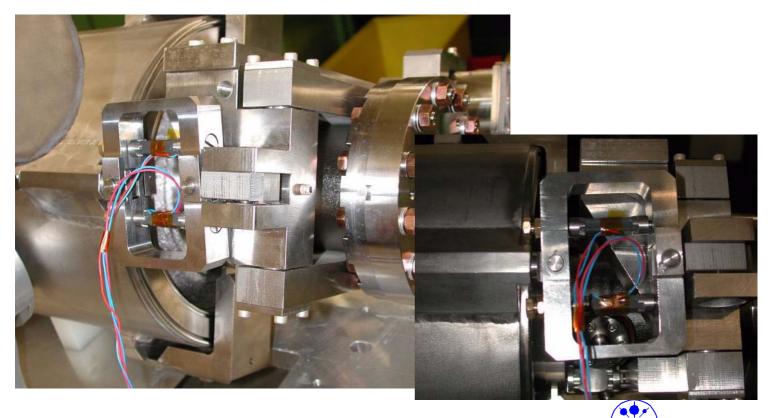
DESY Hamburg

SEI Tagung 2004 Stefan Simrock

#### **Actuators for Detuning Control Actuators**

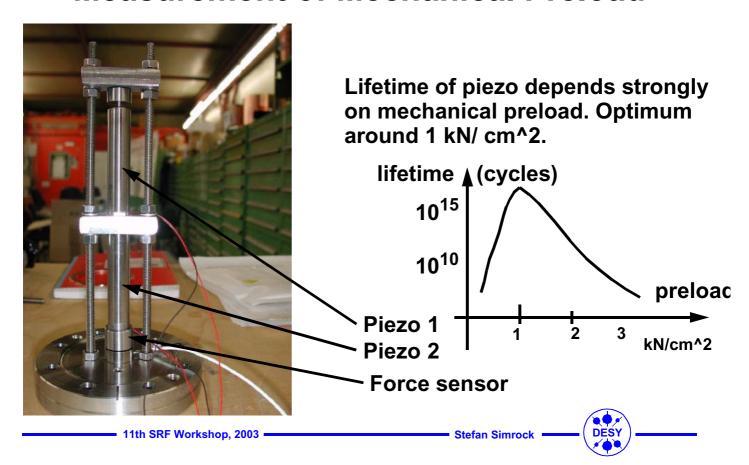


#### **Integration of Piezo Tuner for TTF**

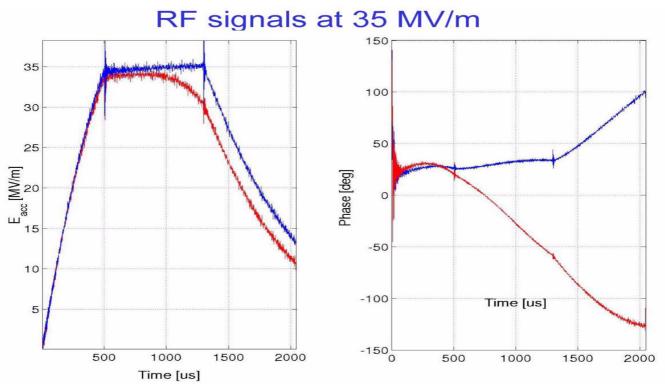


DESY Hamburg

#### **Measurement of Mechanical Preload**



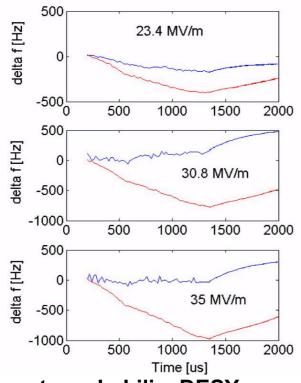
#### **Control of Lorentz Force Detuning Control**



DESY Hamburg

courtesy: L. Lilje, DESY

#### **Control of Lorentz Force Detuning (TTF)**



### Frequency stabilization at 35 MV/m

Blue: With piezo

Red: Without piezo

Frequency detuning of ~1000 Hz compensated with resonant excitation of a mechanical cavity resonance at 230 Hz.

NOTE: This is rather an demonstration of the capability of active tuning. Application in a real machine is probably difficult/impossible.

courtesy: L. Lilje, DESY

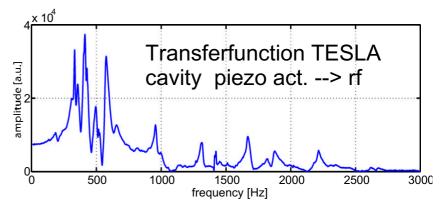
11th SRF Workshop, 2003

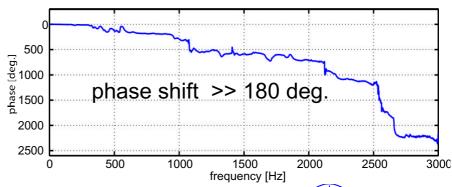
Stefan Simrock



#### **Microphonics Control Problem**

- Feedback is required due to stochastic nature of microphonics
- Transfer function
   piezo actuator -->
   cavity detuning shows
   many mechanical resonances from cavity
- Stability of Feedback loop?

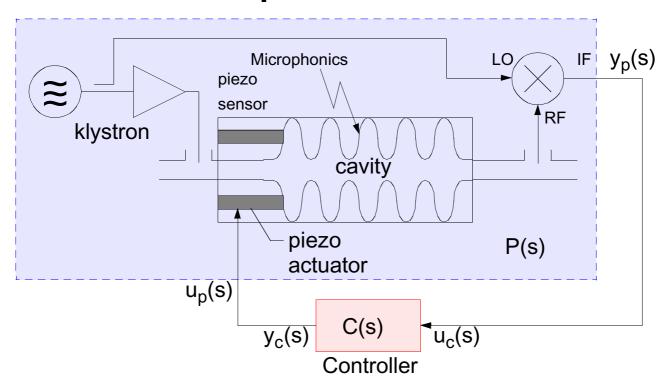




11th SRF Workshop, 2003

Stefan Simrock

#### **Microphonics Control**

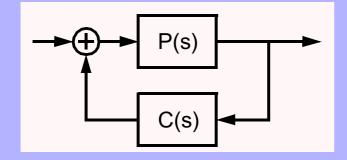


11th SRF Workshop, 2003

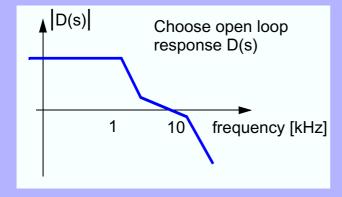
Stefan Simrock



#### **Controller Design**



$$\Rightarrow$$
  $C(s) = \frac{D(s)}{P(s)}$ 



D(s): stability criteria fulfilled high gain at low freq. fast roll-off at high freq.

DESY Hamburg

#### LLRF Subsystems/Components susceptible to failure

- o RF phase reference
  - from main driveline
  - LO for downconverter
- o Timing System
- o Vector modulator
- o Downconverter
- o Digital Control (Fdbck + FF)
  - ADC, DSP, DAC
  - includes exception handling
- o Redundant simple feedforward
- o Redundant monitoring system
- o Transient detection
- o Interfaces to other subsystems
  - includes interlocks

- o Waveguide tuner and controls
- o Cavity resonance control
  - slow (motor) tuner
  - fast (piezo) tuner
- o CPU in VME crate
- o Network to local controls
- o Cabels and connectors
- o Power supply for electronics
- o Airconditioning in racks
- o Software
  - DSP (FPGA) code
  - Server programs
  - Client programs
  - LLRF Parameters
  - Finite State Machine

SEI Tagung 2004

Stefan Simrock



#### DSP and ADC board LLRF for TTF I







#### C67 DSP board

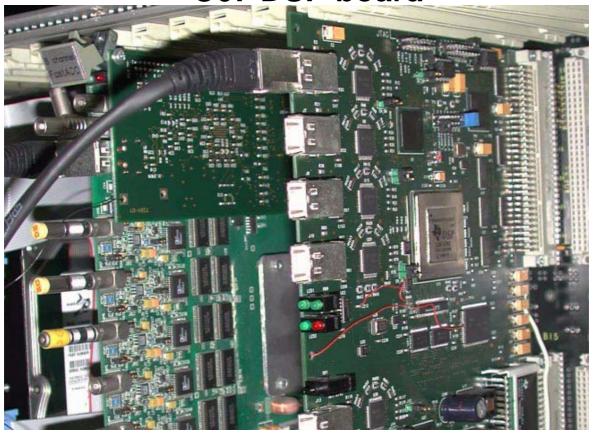


SEI Tagung 2004

Stefan Simrock



#### C67 DSP board



#### **C67 DSP board**

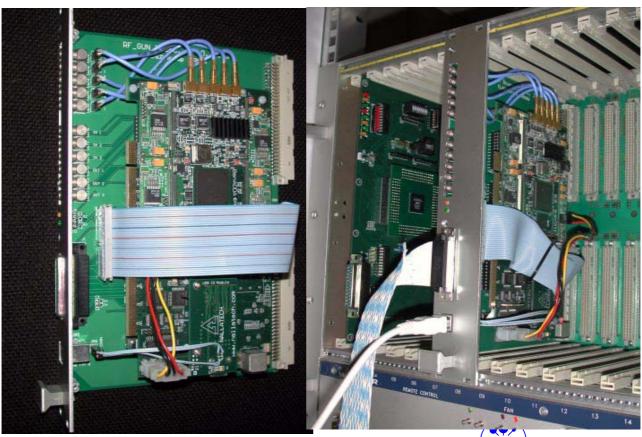


**SEI Tagung 2004** 

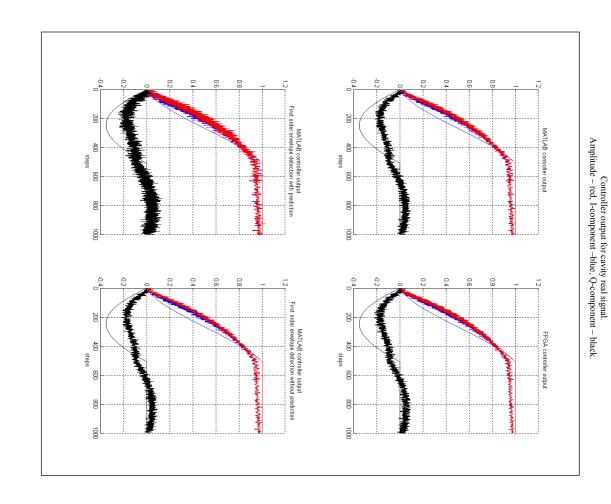
Stefan Simrock



#### **FPGA** based RF Gun Controller FPGA



Stefan Simrock



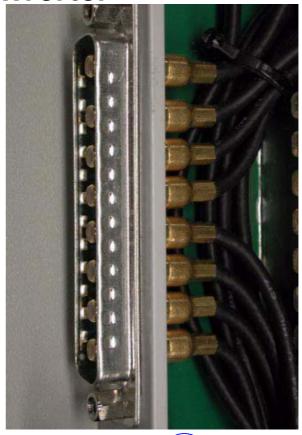
#### **Cavity Simulator**





#### **Downconverter**



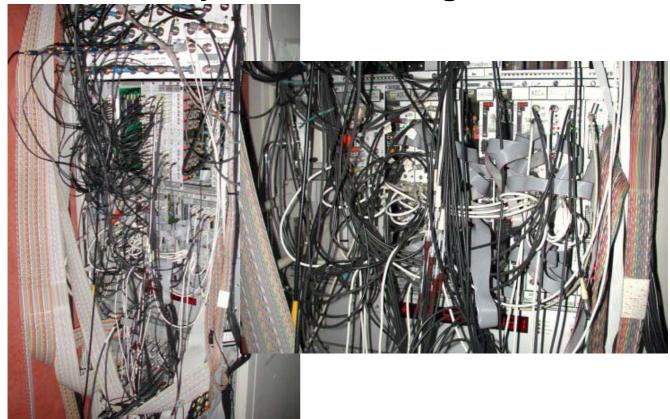


**SEI Tagung 2004** 

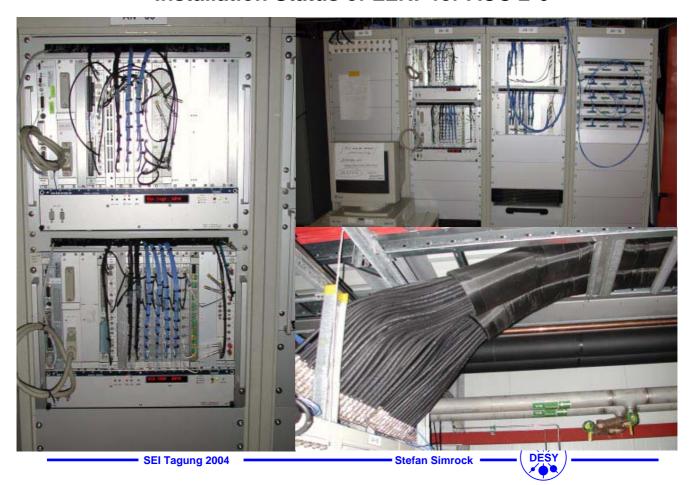
Stefan Simrock



#### Rack Layout and Cabling for TTF I



#### Installation Status of LLRF for ACC 2-6



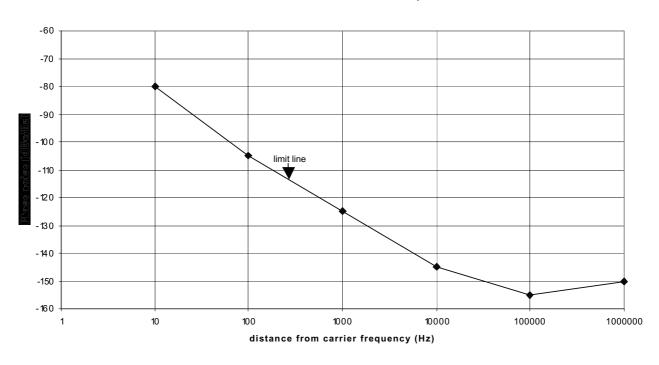
# Requirements for the M.O. for TTF2

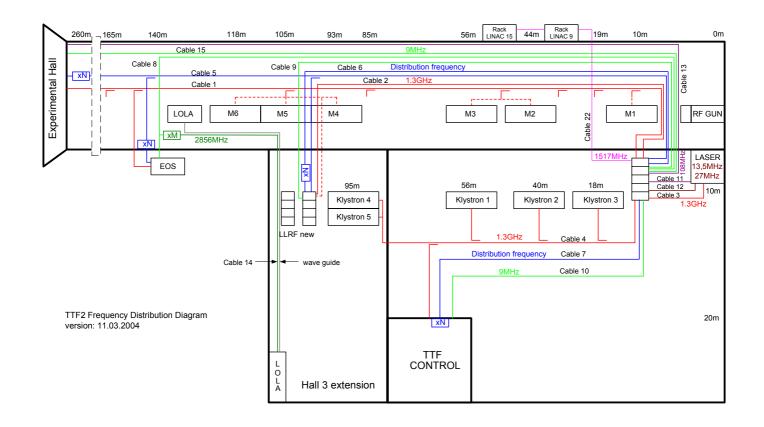
- Required frequencies: 50Hz, 50Hz(TTL), 1MHz, 9MHz, 13.5MHz, 27MHz, 81MHz, 108MHz, 1.3GHz, 1.517GHz, 2.856GHz
- · Required stability:

K.Czuba, B.Lorbeer, S.Simrock, H.Weddig

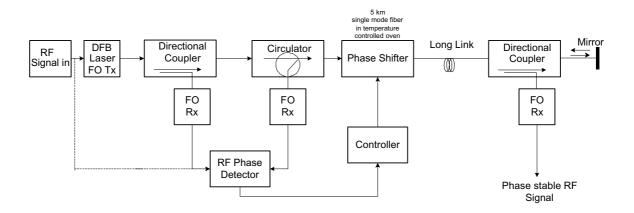
#### Required Phase Noise Spectrum:

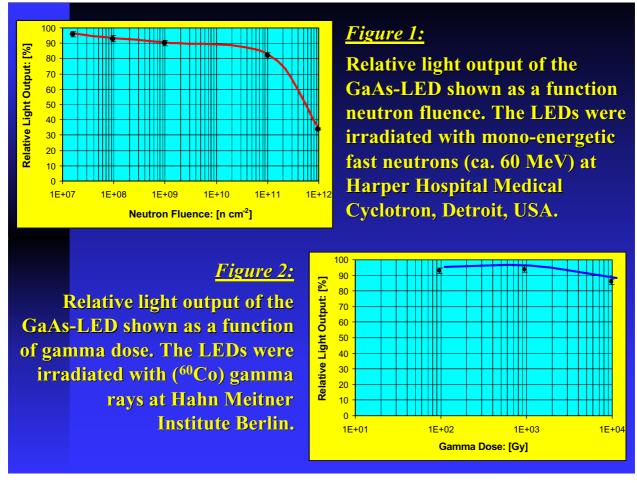
#### Phase noise limit line 1.3 GHz multiplier





#### Fiber-optic Distribution System

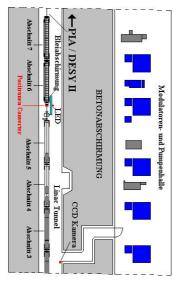




# ON DISPLACEMENT DAMAGE OF LED ONDER BASED

Bhaskar Mukherjee, Dominik Rybka and Stefan Simrock

We have successfully tested the prototype of a Fast Neutron Dosimeter using the parasitic neutron field produced by the e+ Converter (450 MeV electrons hitting a thick Tungsten plate) situated in the LINAC II Tunnel.



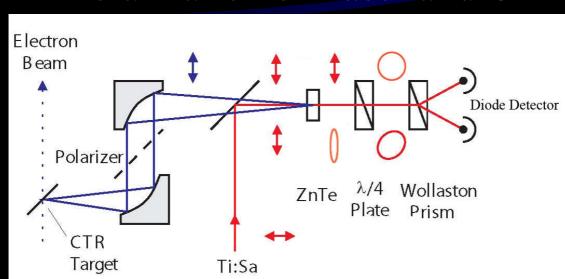
Results are summarized as follows:

Light Output: [Lux]

200.0

250.0

#### Polarization of Laser and CTR



- •Laser and CTR are horizontally polarized
- •laser polarisation is slightly elliptical after crystal
- •elliptical part of laser polarisation is converted to an elliptical polarisation by quarter wave plate

# Immediate Action Plan:

Linac radiation environment

A reliable device for monitoring Neutron Equivalent Dose Assessment of Neutron / Charged particle induced damage in the

20

40

60

80

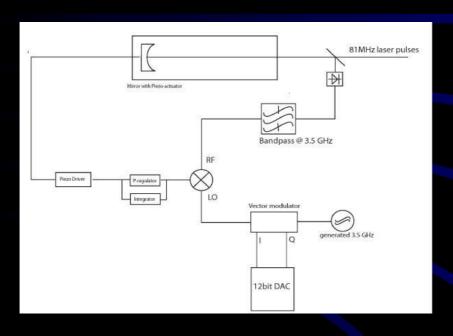
100

LED Current: [mA]

electronic components of future High Energy Linacs (i.e. TTF2) Prediction of catastrophic failure of electronic devices located in the

Calibration of the LEDs at CERN-EU Reference Field using HE Neutrons

#### Synchronisation Scheme



phase-locked loop (PLL)

$$f_{laser} = 81 \text{ MHz}$$

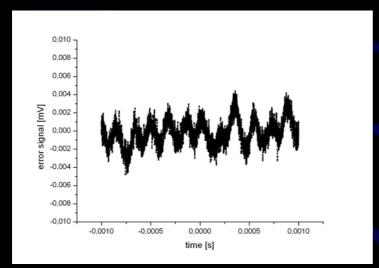
$$f_{RE} = 500 \text{ MHz}$$

$$f_{dm} = 3.5 \text{ GHz}$$

scanning done by phase shift of the 3.5GHz local oscillator (LO) with a vector modulator

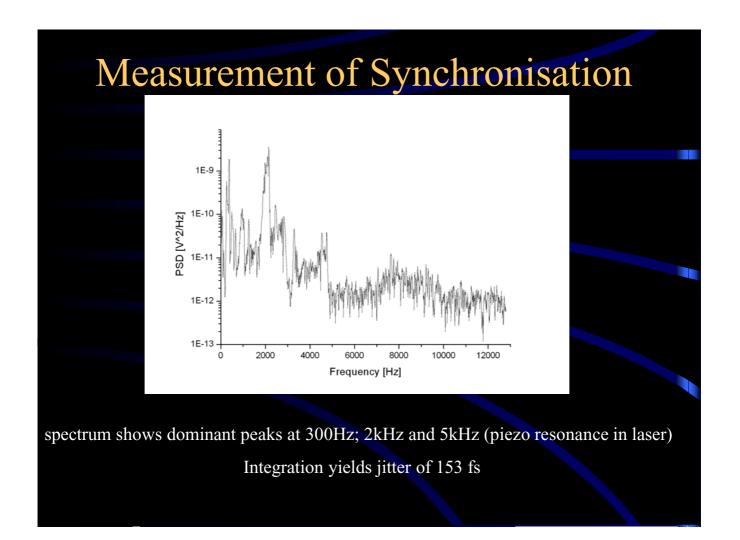
#### Synchronisation Accuracy

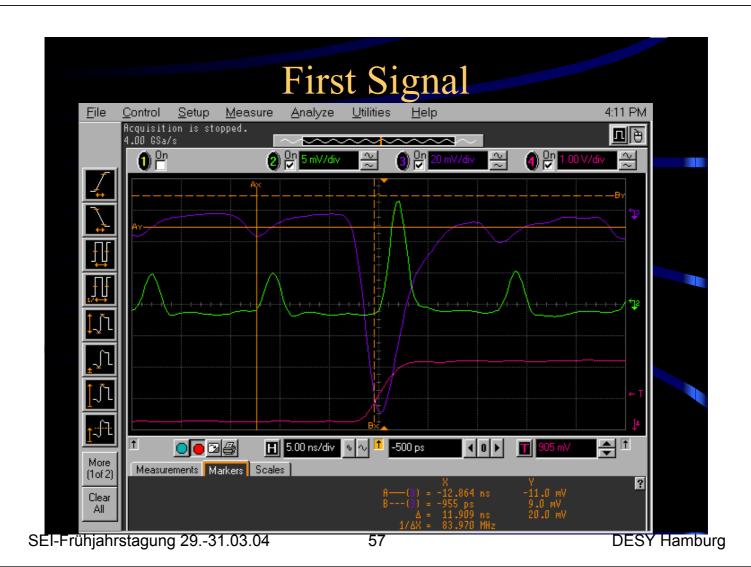
• open loop: 250mV rms for 45° phase shift that is 5.6mV per degree phase shift at 3.5 GHz 1°=793fs, so 1mV per 143fs jitter



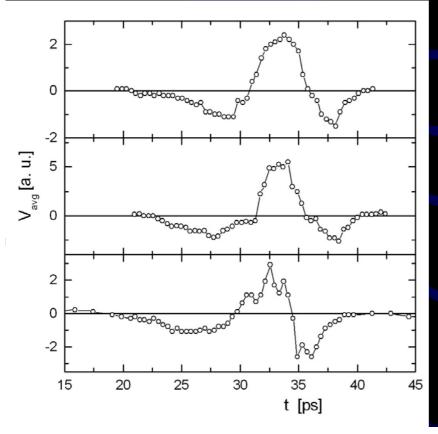
measured rms value: 1.4 mV

accuracy of 200fs reached





# EOS scans for different linac settings

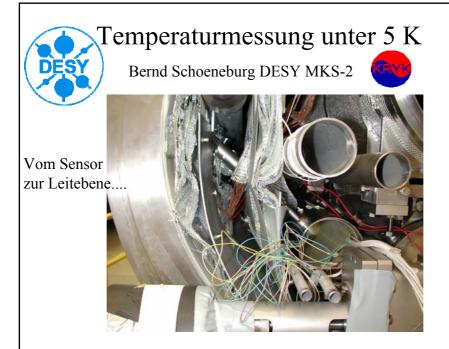


- •preliminary data!
- •scanning resolution: 396fs
- •jitter through gun: 1ps
- •improvements will be made during next shutdown
- •measurements in good agreement with expected bunch length of ~6ps FWHM

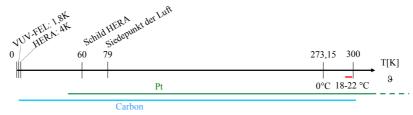
### Conclusion

- Superconducting linacs are the state-of-the-art technology to generate high quality charged particle beams for a variety of applications such as X-Ray FELs and Linear Colliders
- The performance of the rf system is critical to produce high quality beam. Control Issues are beam loading, microphonics and Lorentz force detuning
- RF Control can be accomplished with high speed digital signal processing including DSPs and FPGAs
- Large scale accelerator benefit from a high level of automation and implementation of sophisticated procedures, and algorithms.
- Much more future work needs to be done to explore all of the potential of this technology to fulfill the requirements with respect to operability, reliability, maintainability, and technical performance





# Messung tiefer Temperaturen mit hoher Genauigkeit



Welche Sensoren können verwendet werden?

- •Thermocouple → Referenz nötig, Genauigkeit sinkt mit fallender Temperatur
- •Resonatoren → Magnetfeldabhängigkeit? Kabelkapazität?
- $\bullet$ Platinsensoren  $\rightarrow$  Sättigungseffekt bei kleinen Temperaturen
- $\bullet \text{Dioden} \rightarrow \text{Hohe Auflösung, Unipolare Messung, HF-Gleichrichtung}$
- •Carbonsensoren → Hohe Auflösung bei kleinem T, geringe Auflösung bei hohem T



### Temperatur-Mess-Elektronik

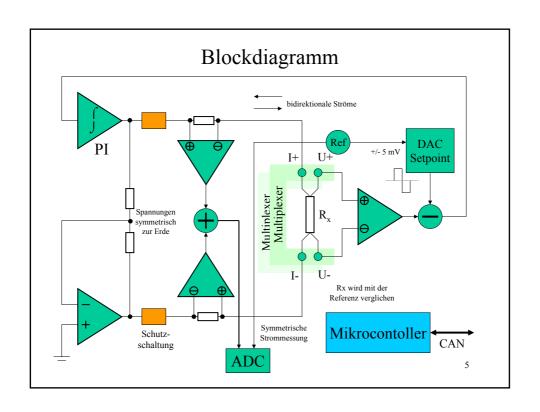
#### Anforderungen

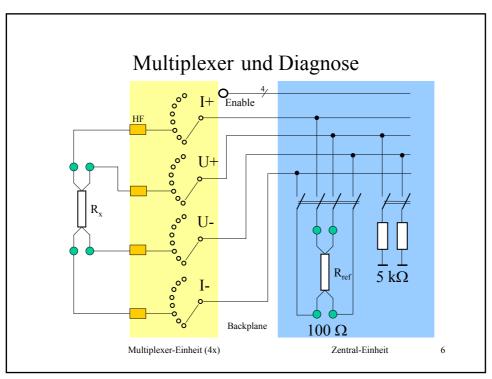
- ·Hohe Genauigkeit
- •Hohe Stabilität im Umgebuogstemperaturbereich
- ·Auflösung angepasst an Carbonsensoren
- •Sehr geringe Sensoraufheizung
- •Immunität gegenüber HF-Störungen
- •CAN-Bus Auslese
- •Konfigurierbare Parameter
- •Geringe Kosten je Kanal
- •Lange Kabel zum Sensor (>100 m) möglich
- •Eingebaute Diagnosemöglichkeiten
- •Absicherung gegen Sensorzerstörung bei Fehlfunktion

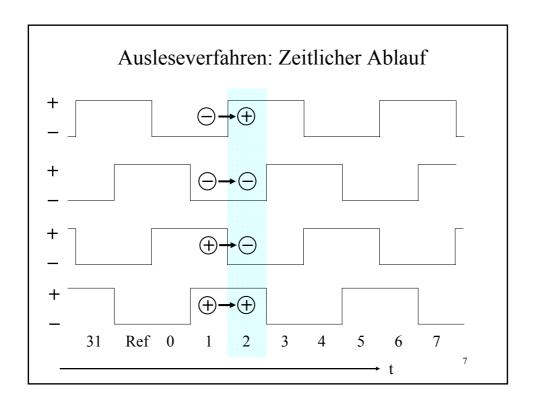
#### Lösung

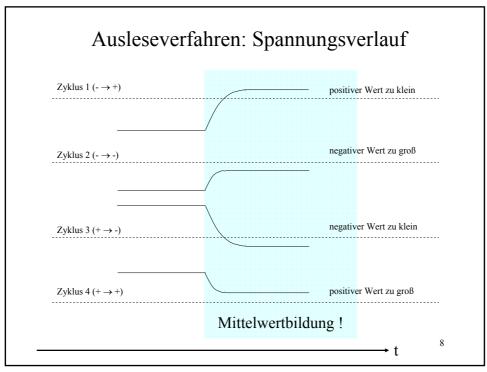
- •Rauscharme Verstärker und Präzisions-Referenz-
- Widerstand (→ ratiometrische Messung)
- •Erdsymmetrischer Aufbau
- •Strommessung bei konstanter Sensorspannung
- •Kurze Messzeiten um ein Aufheizen zu verhindern
- •Wechselnde Polaritäten um unipolare Offsets zu eliminieren
- •Algorithmus um Ladungsinjektion zu kompensieren
- •HF-Filter
- •Mikroprozessor mit eingebautem CAN-Controller
- •32 Eingangskanäle multiplexed in 4-Draht
- •Extra Hardware für Sensor-Diagnose
- •Sicherheits-Schaltung um den Sensor zu schützen falls der PI-Regler ausfällt

"fertig"

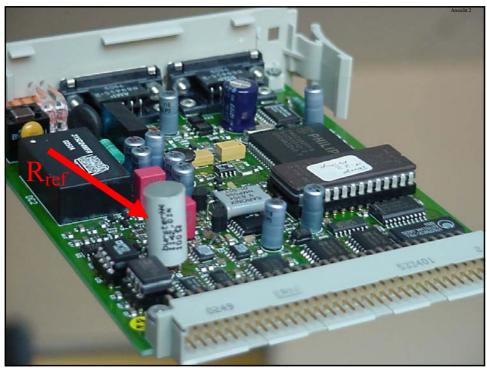


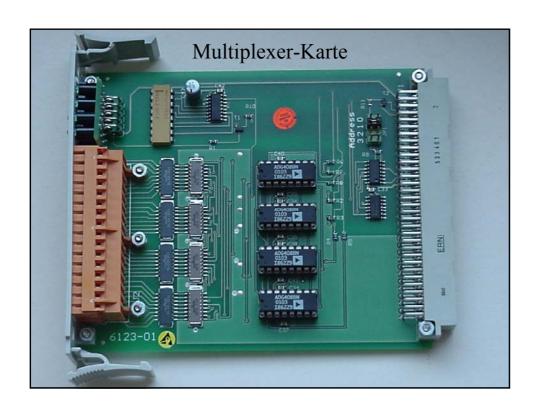






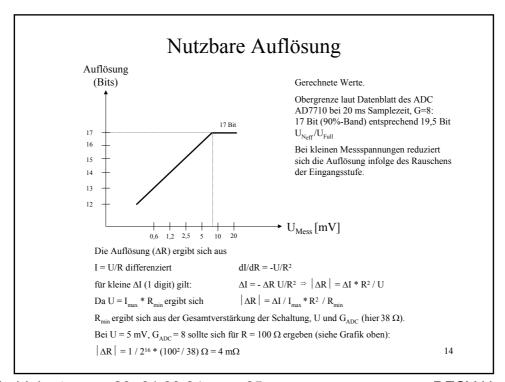


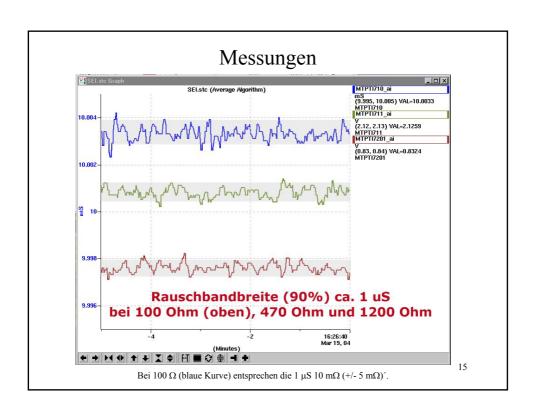


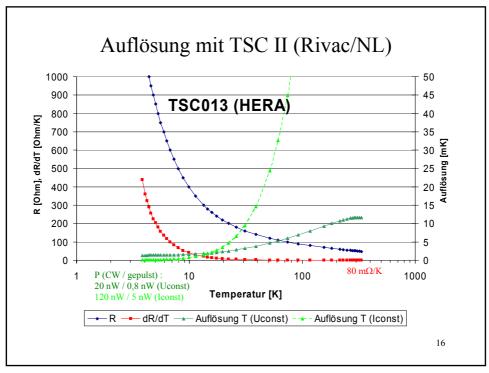


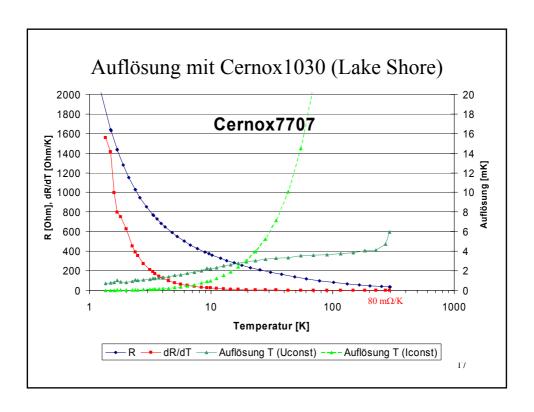












#### Technische Daten

Anzahl der Kanäle pro Einheit 32 (8 minimum, erweiterbar auf 16, 24, 32)

Messmethode 4-Draht, wechselnde Gleichspannung

ADC AD7710 Sigma-Delta 24 Bit, digitaler FIR-Filter

Messspannung 0 .. 25 mV Sensor OVP 1 V

Brauchbare Auflösung  $4 * 10^{-7} \text{ S } @ 5 \text{ mV }^*$ Temperaturdrift < 1 ppm/K (Referenz)

Messzeit 80 ms Pulse Zykluszeit 0,8 ... 3,1 Sekunden

\*) z.B.: 0.0004 Ohm bei 30 Ohm

In Verbindung mit einem kalibrierten Carbon-Sensor kann bei Temperaturen von 4,2 bzw.

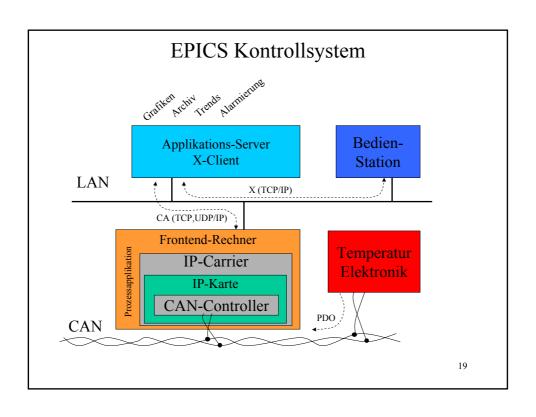
1,8 K erreicht werden:

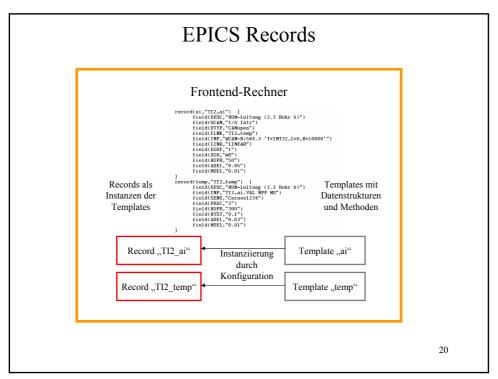
Absolute Genauigkeit 0,005 K

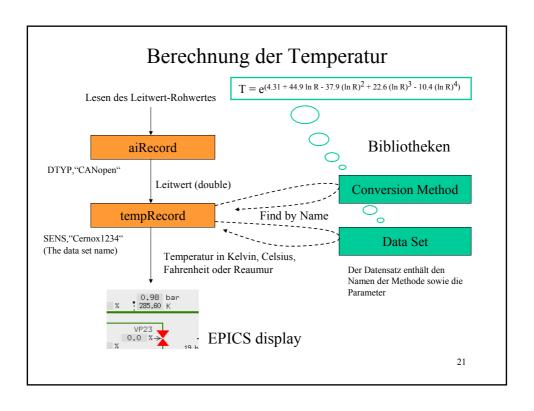
Auflösung < 0,001 K (1 mK)

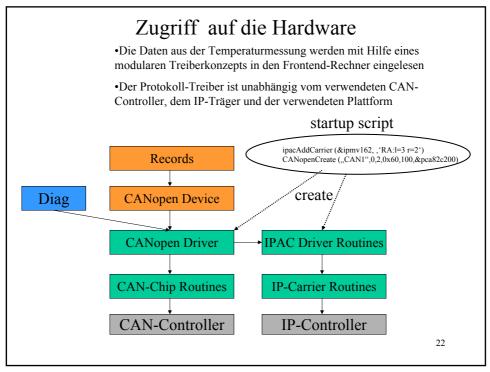
Bus CAN 2.0A ISO 11898, isoliert, 10..1000 kBaud

Datenformat CMS 32-Bit Integer multiplexed (5 Bytes)









#### Pläne

- 1. Temperature Modul-Firmware
  - Noch flexiblere Messmöglichkeiten, Spannungsmessung (alle Parameter programmierbar)
  - Automatische Bereichswahl für große Widerstandsbereiche
  - CANopen Objekt-Verzeichnis
  - SDO (service data object)
  - CANopen "predefined connection set"
  - Node guarding
- 2. EPICS record / device support
  - Diagnose in EPICS

23

# Ende



### Historie der SEI-Tagungen

#### Bernd-August Brandt\*

Immer wieder wird die Frage nach der Entstehung bzw. nach dem Entstehungsdatum der Studiengruppe gestellt. In den Akten gibt es nur spärliche Informationen über die ersten Sitzungen der Studiengruppe. Aber ich habe in meinen persönlichen Papieren Unterlagen, die ich 1994 für ein kurzes Anschreiben zur Einladung zur Frühjahrssitzung in Berlin bereits verwendete: Demnach fand im Physikalischen Institut der Universität Hamburg in der Jungius-Straße vom 25. bis 26. März 1960 eine Diskussionstagung statt, in der unter Punkt 12 der Tagesordnung "Gedanken über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Institute bei der Vorbereitung der Experimente und Diskussion über die Bildung der Studiengruppen" zur Debatte standen. Durch Zuruf der Namen von potentiellen Teilnehmern bzw. Instituten wurden die Studiengruppen gebildet. Neben anderen entstand so die Studiengruppe Hochenergiephysik –Elektronik–. Danach tat sich –nach außen sichtbar– nichts, aber es wurde ein Fördervorhaben beim BMAt FN 5.058 (für 1961?) beantragt: "Studiengruppen für Hopchenergiephysik im Rahmen des Fachausschusses Kernphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft".

Wohl erst angeregt durch eine private Initiative einer Gruppe (von 11) Personen<sup>1,2</sup> im Januar 1961 erfolgten Einladungen zu einer ersten Sitzung in Heidelberg. Zu dieser Sitzung bei Dr. B. Stadler im Tandem-Labor des MPI in Heidelberg gibt es keine Belege in unseren Akten. Einen konkreten Hinweis habe ich durch ein Schreiben von Prof. P. Stähelin vom 20.4.1961 in meinen persönlichen Unterlagen<sup>3</sup>.

Studiengruppen Hochenergiephysik im Rahmen des Fachausschusses Kernphysik des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften

Herrn Hamburg, 20.4.61

Dipl.-Phys. B. A. Brandt Physikal. Inst. d. Univ. Marburg

Marburg / Lahn Renthof 5

Betr.: Diskussionstagung über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Elektronik für die experimentelle Kernphysik am 25. April 1961 in Heidelberg

Sehr geehrter Herr Brandt!
Unter Bezugnahme auf Ihren Brief ...

SEI Frühjahrssitzung 2004 Hamburg

<sup>\*</sup> Bis Februar 1995 Fachbereich Physik der Philipps-Universität Marburg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe H.-J. Stuckenberg Transistorsabendblatt Nr. 5, 2.64, S.6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe atomwirtschaft atomtechnik, Jhrg. X, Nr. 6, Juni 1965, S. 298-302: W. Becker, Ispra, H.-J. Stuckenberg, Hamburg, K. Zander, Berlin. ESONE – ein System für die nukleare Elektronik.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> R. Thielmann hat die Tagesordnung in seiner Unterlagensammlung, die ich erst am 24.3.2004 erhielt.

... die tatsächlichen Reisekosten bis maximal zu den Fahrtkosten der Bundesbahn I. Klasse einschließlich Zuschlägen sowie ein Tagegeld erstattet werden.

...um telefonische Mitteilung an das

II. Inst. F. Experimentalphysik Hamburg-Barenfeld, Luruper Chaussee 149 Tel. 89 69 81, App. 270

Mit freundlichem Gruß

gez. Prof. P. Stähelin

Wolf

(Sekretärin)

Hier wird Bezug genommen auf einen Brief, der sich auf eine vorangegangene Einladung zu einem ersten Treffen der (benannten Mitglieder) der Gruppe bezieht.

Am 25. April 1961 in Heidelberg hat also die erste Sitzung stattgefunden.

Dieses Datum ist offenbar auch zugrunde gelegt worden, als das 20-jährige Bestehen der Studiengruppe im März 1981 feierlich begangen wurde, (zu der Zeit bereits unter dem Namen "Studiengruppe Nukleare Elektronik"). Der oben angegebene Briefkopf zeigt jedoch, dass die Studiengruppe zum Zeitpunkt dieser Einladungen mindestens formal existiert haben muss. Deshalb können wir mit voller Berechtigung die Veranstaltung vom **26.3.1960** als **Gründungsakt** ansehen.

Auch die anderen am 26. März 1960 gegründeten "Studiengruppen Hochenergiephysik": -Zählerexperimente-, -Visuelle Methoden-, -Auswerteverfahren- und -Theorie- haben erst ab Januar 1961 ihre Arbeit aufgenommen. Die Beschäftigung mit Szintillations-Detektoren hat wohl einige Jahre überdauert. Dr. Stanek, München, hat nach vielen Jahren (1968 oder 1970) einen neuen Anlauf versucht (mit mir unbekanntem Ergebnis).

Von allen Gruppen hat nur unsere bis heute überlebt.

Soweit einstweilen zum Beginn der Studiengruppe.

Über die Ziele unserer Gruppe brauche ich an dieser Stelle nichts zu sagen, das steht in unzähligen Zusammenfassungen (und Variationen), Tagungsberichten, Anträgen und nun auch im Internet<sup>4</sup>. Sehr treffend ist die Situation in dem o.g. Artikel<sup>2</sup> von W. Becker, H.-J. Stuckenberg und K. Zander formuliert.

#### Wie sah die Arbeit der Gruppe aus?

Zunächst waren die Diskussionen konzentriert auf die Experimente und Anwendungen am DESY. Dabei zeigte sich sehr schnell, dass grundlegende Fragen zu klären waren, um mehrheitsfähige Empfehlungen geben zu können. Es musste erst eine gemeinsame Sprechweise gefunden werden, genormte Begriffe und Größen bekannt gemacht werden, angefangen bei Schaltzeichen, Flussschaltbildern und bestehenden DIN-Vorschriften. Es diskutierten ja nicht nur Ingenieure, sondern auch Physiker<sup>5</sup>. Oft wurde formuliert, wir müssten etwas "normen", was zu Recht den FNA auf den Plan rief. Wir konnten nur Richtlinien und Standards erarbeiten.

In Hausaufgaben wurden Entwürfe erarbeitet, die dann in den Gruppen diskutiert wurden,

SEI Frühjahrssitzung 2004 Hamburg

<sup>4</sup> www.hmi.de/bereiche/I/DS/sei/index.html

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wie im Tagungsbericht 30.6./2.7.1965 so schön formuliert ist: "Einen guten Ingenieur stört Normung nur wenig, einem echten Physiker ist sie ein Greuel."

bis einvernehmliche Lösungen auf dem Tisch lagen. Sehr starke Impulse kamen von den beiden DESY-Elektronik-Abteilungen (Krolzig / Stuckenberg), die unter dem größten Druck standen, fertige Geräte vorzuweisen.

Damals wurde harte Arbeit in den Studiengruppentreffen und in kleinen Untergruppen geleistet, die um die Spezifikationen für Mechanik, Stecker, Versorgungsspannungen, elektrischen Pegel für Analog-Elektronik und Digital-Elektronik, sowie um entsprechende Prüfvorschriften rangen – und zum Teil geradezu kämpften.

Unsere ersten Treffen waren Diskussionssitzungen. Ich erinnere mich noch genau, wie Dr. Zander zu Beginn eines Treffens in Hamburg sagte, "wir sitzen doch nicht im Hörsaal zu einer Vorlesung", und uns aufforderte unsere Stühle im Kreis aufzustellen, damit jeder sehen könne, wer gerade redet.

Die Untergruppen tagten oft im 14-tägigen Rhythmus. Zunächst fanden deren Treffen überwiegend in Hamburg statt, später dann an den Heimatinstituten der Gruppenleiter.

Die Studiengruppensitzungen fanden nach Bedarf auch mehrmals im Jahr statt. Erst später spielten sich Herbst- und Frühjahrstermine (vor Beginn der Semester) ein. Bis in die 70-iger Jahre hinein lagen Sitzungstermine übrigens "mittwochs bis freitags".

Sehr bald wurde beschlossen, die Plenarsitzungen an den Dienstorten der Teilnehmer im Wechsel zu organisieren, damit man nach und nach die Institute der Beteiligten kennen lernen könnte. Ein schöner Brauch, der sich bis heute erhalten hat (s. Abbildung 1).

Häufigke	it der	Tagu	ngen								
Ort	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hamburg	05.19621	11.1962	07.1963	10.1963	06.1965	09.1972**	05.1974	03.1981	03.1988	03.1998	03.2004
Berlin	10.1965	03.1970	04.1973	09.1974	03.1990	03.1994	09.1996*	09.2000			
Jülich	03.1965	09.1969	03.1977	10.1982	03.1985	04.1995	09.1998	03.2003			
Frankfurt	12.1964	12.1966	10.1977	10.1983	05.1987	09.19 <b>9</b> 7	09.2002				
Karlsruhe	01.19642	03.1978	09.1986	03.1996	04.2001						
Bochum	03.1980	09.1990	03.1999	09.2003							
Graz	09.1980	10.1987	10.1995	10.2001							
Heidelberg	04.1961	10.1964²	09.1993	03.2000							
Marburg	04.1964	03.1968	03.1982	09.1994							
Wixhausen	09.1975	09.1991	04.1997	03.2002							
Erlangen	10.1971	09.1985	03.1989								
Martinsried	03.1979	10.1981	03.1992								
Würzburg	09.1968	09.1970	10.1988								
Braunschweig	11.1978	03.1993									
Freiburg	03.1972	03.1983									
Garching	02.1966	03.1975									
Mainz	03.1969	03.1984									
Rossendorf	09.1992	09.1999	9.2004								
Basel	12.1961										
Geel	10.1989										
Göttingen	10.1979										
Grenoble	04.1986										
Ilmenau	03.1991										
Köln	10.1976								_		
Konstanz	10.1984						* Zeuthen				
Münster	09.1973						**Duhnen				
Stuttgart	03.1976						¹ Tagungs	sbericht v	on E.v.Go	eler	
Wien	05.1971						<sup>2</sup> Tagung	im Jahres	bericht 19	64 erwähr	nt

Abb. 1: Häufigkeit der Studiengruppensitzungen an den Tagungsorten mit Tagungsdaten

Entsprechend fand die zweite Sitzung der Studiengruppe in Basel, im Institut von Prof. E. Baldinger statt, die dritte allerdings wieder in Hamburg.

Die Teilnehmerzahl der ersten Sitzungen lag bei 20 bis 30, die der Untergruppen bei 6 bis 18 Personen. Teilnehmer waren Physiker und Elektroniker und Techniker aus Universitäts- und Forschungslabors aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, und sehr früh auch Vertreter der Industrie. Die Teilnehmerlisten der ersten Sitzungen sind in unseren Akten leider nicht erhalten.

Berücksichtigt man die 81 (Plenar-) Sitzungen, von denen Teilnehmerlisten erhalten sind, ergibt sich eine mittlere Teilnehmerzahl von 59.

In späteren Jahren wurden zunehmend Ergebnisse und (s.u.) Statusberichte vorgetragen, oder Teilnehmer (besonders der einladenden Institute) berichteten über Arbeiten in und aus ihrem Hause. Daraus ergab sich dann die frontale Vortragsform (wohl auch weil in den meisten Instituten für die Sitzungen nur Hörsäle zur Verfügung standen). Eine aktuelle Liste der Sitzungen unserer Studiengruppe gibt die Abbildung 2 wieder.

1964 wurden 4 "ständige" Arbeitsgruppen zu 5 Themenbereichen gebildet (indem die Anwesenden einfach in 4 Gruppen aufgeteilt wurden):

- 1. Strahlungsdetektoren und deren Ausrüstung ( 6 Pers.) Gruppe I
- 2. Analog arbeitende Geräte

Gruppe II

- 3. Analog-Digital-Wandler4. Digitale Information verarbeitende Geräte ( 7 Pers.)
- Gruppe III
- 5. Energieversorgungsgeräte (4 Pers.)

Gruppe IV

Inzwischen hatte sich gezeigt, dass die Probleme und Fragen der Austauschbarkeit von Mess-. und Experimentgeräten nicht nur in der Hochenergiephysik, sondern allgemein in der Kernphysik relevant waren. Das führte 1962 / 1963 zur Umbenennung der Gruppe in Studiengruppe Nukleare Elektronik, für die sich die Abkürzung SGNE durchsetzte<sup>6</sup>.

Alle diese Diskussionen und Aktivitäten fanden nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern überall auf der Welt statt. In ganz Europa standen nach Überwindung der ersten Kriegsfolgen die Physiker und Elektroniker vor dem gleichen Problemen: Wie kann man die Möglichkeiten der entstehenden Großforschungseinrichtungen nutzen? Wie macht man das am besten? Alle wünschten sich ein einheitliches System. Das führte bereits 1961<sup>7</sup> zu einer europaweiten Verabredung, das **ESONE-System**<sup>8</sup> zu entwickeln.

Die Vertreter deutscher Institutionen in diesem europäischen Vorhaben waren alle Mitglieder der Studiengruppe. Die Vorarbeiten der Studiengruppe konnten direkt in die Arbeit der ESONE Working groups eingebracht werden.

Mit diesen Entwicklungen bekam die Arbeit der Studiengruppe eine neue Bedeutung und eine enorme Erweiterung: Das ESONE-System wurde vom ESONE-Committee betreut, das aus einigen Einzelmitgliedern und den interessierten Forschungseinrichtungen gebildet wurde. Dort fanden sich die Mitglieder der Studiengruppe als persönliche Mitglieder oder als Repräsentanten ihrer Heimat-Mitglieds-Institute wieder. Das Committee setzte eine (kleinere) ESONE-Executive-Group ein, die schnell auf Veränderungen oder Neuerungen reagieren und notwendige Entscheidungen treffen konnte. Auch hier wurden Studiengruppenmitglieder delegiert. Umgekehrt lernten ESONE-Leute die Studiengruppe kennen und wurden dort ihrerseits aktiv (Dres. W. Becker, H. Meyer, E. Sattler u.a.).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Auf Vorschlag unserer österreichischen Freunde, jedenfalls habe ich die Abkürzung erstmals von Herrn Dr. Attwenger gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> EURATOM-Zentrum Ispra, Juli 1961.; 16 Teilnehmer, davon 7 Deutsche (2 <u>noch</u> nicht als Studiengruppen-Mitglieder)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> European Standart of Nuclear Electronics System

	Sitzungen der S	tudienaruppe	Te	il-				Teil	
Lfn.		Datum	nehm	-	Lfn.	Ort	Datum	nehm	. —
	Gründung:					Marburg	22. März 1982	53	
	Hamburg	26. März 1960			45	Jülich	11. Oktober 1982	56	
1	Heidelberg	25. April 1961				Freiburg	21. März 1983	46	
	Basel	1. Dezember 1961			47	Frankfurt	3. Oktober 1983	50	
	Hamburg <sup>1</sup>	29. Mai 1962				Mainz	19. März 1984	62	
	Hamburg	30. November 1962				Konstanz	8. Oktober 1984	41	
	Hamburg SGNE	11. Juli 1963	23		50	Jülich	18. März 1985	72	
	Hamburg	15. Oktober 1963	44		51	Erlangen	23. September 1985	44	
	Karlsruhe <sup>2</sup>	23. Januar 1964	50 <sup>3</sup>		52	Grenoble SEI	14. April 1986	40	
	Marburg	27. April 1964	32		53	Karlsruhe	29. September 1986	47	
	Heidelberg <sup>2</sup>	21. Oktober 1964				Frankfurt	11. Mai 1987	40	
	Frankfurt	10. Dezember 1964	50		55	Graz	5. Oktober 1987	37	
	Jülich	31. März 1965				Hamburg	21. März 1988	56	
	Hamburg	30. Juni 1965	54		57	Würzburg	3. Oktober 1988	44	
	Berlin	27. Oktober 1965	58		58	Erlangen	13. März 1989	52	
	Garching	28. Februar 1966	85		59	Geel	2. Oktober 1989	34	
	Frankfurt	1. Dezember 1966	87			Berlin	19. März 1990	96	
_	Marburg	4. März 1968	68		61	Bochum	24. September 1990	40	
	Würzburg	23. September 1968	78			Ilmenau	18. März 1991	63	
	Mainz	17. März 1969	76			Wixhausen	30. September 1991	42	
	Jülich	22. September 1969	141			Martinsried	23. März 1992	48	
	Berlin	16. März 1970	132			Rossendorf	28. September 1992	66	
	Würzburg	21. September 1970	75		66		22. März 1993	55	
	Wien	12. Mai 1971	104		67	Heidelberg	27. September 1993	43	
	Erlangen	13. Oktober 1971	110		68	Berlin	21. März 1994	66	
	Freiburg	15. März 1972	123		69	Marburg	26. September 1994	46	
	Duhnen	20. September 1972	54		70	Jülich	3. April 1995	47	
	Berlin	4. April 1973	100		71	Graz	2. Oktober 1995	25	
	Münster	26. September 1973	74			Karlsruhe	25. März 1996	37	
	Hamburg	15. Mai 1974	111		73	Zeuthen	30. September 1996	45	
	Berlin	9. September 1974	83		74	Wixhausen	7. April 1997	42	
	Garching	19. März 1975	58		75	Frankfurt	29. September 1997	37	
	Wixhausen	24. September 1975	106			Hamburg	30. März 1998	40	
	Stuttgart	22. März 1976	117			Jülich	28. September 1998	38	
	Köln	4. Oktober 1976	94			Bochum	22. März 1999	27	
	Jülich	28. März 1977	140			Rossendorf	27. September 1999	40	
	Frankfurt	3. Oktober 1977	48			Heidelberg	27. März 2000	36	
	Karlsruhe	6. März 1978	70			Berlin	25. September 2000	30	
	Braunschweig	6. November 1978	55			Karlsruhe	2. April 2001	36	<del>                                     </del>
	Martinsried	19. März 1979	72			Graz	1. Oktober 2001	27	<del>                                     </del>
	Göttingen	1. Oktober 1979	68			Wixhausen	4. März 2002	46	
	Bochum	24. März 1980	62			Frankfurt	23. September 2002	38	
	Graz	29. September 1980	28			Jülich	24. März 2003	35	<del>                                     </del>
	Hamburg	23. März 1981	67			Bochum	22. September 2003	44	
	Martinsried	19. Oktober 1981	53			Hamburg	29. März 2004	53	
75	<sup>1</sup> Tagungsberich		Übtr.	Ø	- 55	<sup>3</sup> 18 Teilnehme		Sum:	Ø
			2800			.0 10		4809	
	g g can			. •	L	1			

Abb. 2: Chronologische Auflistung der Studiengruppensitzungen (mit Teilnehmerzahlen)

Die **Studiengruppe** entwickelte sich zu einem **Pool von Experten** für die Beschickung von allen möglichen Gremien, bzw. zum unabhängigen Treffpunkt für Vertreter dieser

Gremien; denn überall auf der Welt schossen geradezu nationale und internationale Gruppen aus dem Boden, die sich mit den messtechnischen Fragen der rasanten Entwicklung im gesamten Feld der (Kern-) Physik, Chemie und weiteren Disziplinen (z.B. Biologie und Medizin) befassten. Die Sitzungen der Studiengruppen wurden zu einem **Forum für Statusberichte** über alle möglichen nationalen und internationalen (Gremien-) Aktivitäten.

#### Organisation der Studiengruppe

Das alles funktionierte ohne Statuten, Vereinsvorschriften und Satzungen. Es gab und gibt keine offizielle Mitgliedschaft! Es gibt nur eine Adressenliste, und wer will, kann darin aufgenommen werden<sup>9</sup>. Die Damen und Herren aus der Industrie nehmen eine gewisse Sonderstellung ein: Sie haben Gastrecht aber kein Mitwirkungsrecht in Bereichen, die die Studiengruppe selbst angehen. Die Adressenliste enthielt in den 70- und 80-er Jahren ca. 200 Einträge: Anschriften von Einzelpersonen, Institutionen und Firmen aus Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien, England und Dänemark!

Auch die Leitung der Studiengruppe unterliegt keinen fixierten Regeln. Zunächst wurde die Leitung der Gruppe vom DESY-Direktorium übernommen, dann an DESY-Mitarbeiter delegiert. Heute bestimmen die Mitglieder der Studiengruppe die Leiter selbst durch Wahl und auf Vorschlag aus den Reihen der Mitglieder. Bisher ging das "einvernehmlich" durch Akklamation. Die Bezeichnung der Gewählten war zunächst "wissenschaftlich-technischer Leiter". Heute gelten sie als "Sekretär" der Gruppe.

#### Wie sah die Leitung der Studiengruppe im Einzelnen aus?

Bei Gründung der Gruppe lag die Verantwortung bei <u>Prof. P. Stähelin</u>, einem Mitglied des DESY-Direktoriums. Wohl von Anfang an wurde er von <u>Dr. H.-J. Stuckenberg unterstützt</u>, der alsbald die Leitung übernahm und de facto bis 1966 innehatte. Ihm zur Seite stand zunächst <u>Dr. E. v.Goeler</u>, und ab 1964 <u>Dr. H. Nentwich</u>.

Im Jahr 1966 kündigte sich eine Krise an: Das BMWF, Ministerium für wissenschaftliche Forschung, konnte (mangels gültigem Haushalt) die Mittel für 1966 nur sehr verspätet und gekürzt bereitstellen. 1967 blieben –nach 15 erfolgreichen Sitzungen– die Mittel völlig aus. Es konnten keine Sitzungen stattfinden. Zusätzlich gab es beim DESY offenbar Personalengpässe, sodass ein erneuter Anlauf ausblieb.

Ende 1967 fragte mich mein damaliger Chef, Prof. W. Walcher<sup>10</sup>, der ebenfalls dem DESY-Direktorium angehörte, ob "wir uns von Marburg aus um die Studiengruppe kümmern könnten". Die nötigen Anträge beim Ministerium würde er dann gegenzeichnen. Was antwortet man, wenn man so von seinem Chef gefragt wird? Die Leitung der Gruppe wurde zu einem Teil meiner Dienstaufgaben, und Frau E. Völker wurde mir nach und nach mit 5% ihrer Dienstzeit für die Büro-Arbeiten zugeordnet.

Um unser Institut der Gruppe vorzustellen und uns den Einstieg zu erleichtern, luden wir die Studiengruppe zum 4. März 1968 nach Marburg ein.

Als sich 1994 das Ende meiner Dienstzeit anbahnte, stellte sich die Frage: Wie geht es weiter? Die Studiengruppe hatte sich soweit vom DESY-Bezug gelöst, dass dessen

SEI Frühjahrssitzung 2004 Hamburg

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Unausgesprochene Voraussetzung ist allerdings die "Bindung" an ein staatliches oder privates Institut mit entsprechenden elektronischen Einrichtungen oder Anwendungen.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Er lebt mit bald 94 Jahren noch rüstig in Marburg und hat mir Grüße an alle, die sich an ihn erinnern, aufgetragen.

Direktorium wohl nicht mehr zu bemühen war. Also beschloss die Studiengruppe, einen neuen "Sekretär" aus ihrer Mitte zu wählen.

Wer den Vorschlag machte, <u>Dr. Frank Gabriel</u> aus Rossendorf zu fragen, weiß ich nicht mehr. Aber ich finde, es war eine glückliche Idee, einen Kandidaten aus den neuen Bundesländern zu nehmen, und ein Glücksfall, dass Dr. Gabriel bereit war, sich (für eine Periode von max. 4 Jahren) der Wahl zu stellen. Auf der Frühjahrssitzung 1994 in Berlin wurde er mit Akklamation gewählt. Aber erst 5½ Jahre später bat er um Ablösung. 2000 wurde –wieder in Berlin und per Akklamation– <u>Dr. Friedrich Wulf</u> vom HMI zu seinem Nachfolger gewählt. Wie sich zeigt, ebenfalls kein schlechter Griff!

Nicht direkt zur Leitung der Gruppe gehörend aber vom 1. Tag an als steter Anreger, Förderer und Mahner hat Prof. K. Zander große Verdienste am Gelingen der Arbeit der Studiengruppe. Das sollte hier ausdrücklich und in Dankbarkeit genannt sein. Ihm bzw. der Einweihung seines "Elektronik" - Gebäudes zu Ehren fand übrigens am 6./7. Dezember 1965 ein hochkarätiges besetztes "Symposium" unter dem "Patronat" der Studiengruppe im HMI in Berlin statt.

#### Wie waren die Einbindungen der Gruppe?

Die eingangs erwähnte Einbindung der Studiengruppe in den "Fachausschuß Kernphysik des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften" bestand nur formal. Im Rahmen der Physikertagung unsere Treffen abzuhalten, erwies sich (Bad Nauheim 1964 oder 1965?), als nicht sinnvoll; denn im Tagungsgeschehen der Physikertagung ging unsere kleine Gruppe unter, da wir keine eigene "Sitzung" bekamen. Einfluss auf die Termine hatten wir natürlich auch nicht. Es gibt dazu übrigens keine Unterlagen in unseren Akten. Problematisch war hier auch der Begriff **Physiker-"Tagung"**; denn das bedeutete im Allgemeinen eine erhebliche Reduzierung der Reisekostenerstattungen. Darum haben wir stets von "**Sitzungen**" und **nicht** von "**Tagungen**" der Studiengruppe gesprochen haben.

Der erste Kontakt mit überregionalen Organisationen war für unsere Gruppe –wie oben gezeigt– das ESONE-Committee. Die deutschen Vertreter in den ESONE Working groups haben –wie ebenfalls schon gesagt– nahtlos die Ergebnisse unserer Arbeitsgruppen einbringen können. Die Studiengruppe wurde Mitglied im ESONE-Committee. Viele unserer Mitglieder wurden in den ESONE-Gruppen aktiv als member oder auch als chairman. Entsprechend fanden auch viele gemeinsame Veranstaltungen statt, bzw. trafen sich Mitglieder der Studiengruppe zu ihren Sitzungen im Zusammenhang mit ESONE-Veranstaltungen. Z.B. im Sommer 1964 in Karlsruhe, wie Bild 3 zeigt<sup>11</sup>.

Aber ESONE war nur ein erster gemeinsamer Schritt zur Lösung der Probleme in der Mess- und Experiment-Elektronik. In einem zweiten Schritt ging es um die Auswertung der in riesigen Mengen anfallenden Messdaten. Die Computerindustrie brachte gerade die ersten Prozess - Rechner auf den Markt. Also hieß es nun, die Experimentdaten in die Prozessrechner hineinzubekommen – und die Experimente vom Computer her zu beeinflussen, d.h. zu steuern.

Bereits 1965 wurde im Ministerium für wissenschaftliche Forschung auf Empfehlung der Studiengruppe ein **ad hoc Ausschuß Projekt Koppelelektronik** eingerichtet, dessen Mitglieder von verschiedenen deutschen Institutionen gestellt wurden. Als der Ausschuss sich konstituierte, waren wiederum 70% der Teilnehmer Studiengruppemitglieder, so auch der Vorsitzende Dr. H.-J. Stuckenberg.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Leider finden sich keine Unterlagen, weder bei den Studiengruppen- noch bei (unseren !) ESONE- Akten.



Abb. 3: Werksfoto GfK 1017/4021: "ESONE-Treffen", Karlsruhe 17.7.1964 (oder 16.6.1964)



Abb. 4: 22 Jahre später, auf derselben Treppe: SEI-Tagung, Karlsruhe 29.9.1986

Der Ausschuss erarbeitete ein detailliertes Konzept mit dem Arbeitsnamen **RESY** (Rechner-Experiment System). Gegen Ende der Beratungen einigte man sich mit geladenen Industrievertretern<sup>12</sup> auf eine schnelle Realisierungsmöglichkeit im D3K-System, das in den Prozessrechnern der Firma Siemens verwendet wurde. (Spötter sprachen deshalb vom *RESI*-System).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> AEG-Telefunken, Labor Dr. Berthold, Frieseke & Hoepfner GmbH und Siemens AG (7.Juni 1968); Quelle: Protokoll der 1.Sitzung der ESONE Executive Group, 17./18.Juni 1968 von H. Klessmann.

Dazu kam es aber nicht; denn über die ESONE-Beziehungen wurde bekannt, dass die Briten ein ganz ähnliches System in Arbeit hatten. Diese Parallelentwicklungen wollte man verhindern und beschloss zusammenzuarbeiten. Dabei zeigte sich, dass die Briten auf keinen Fall die Siemens-Mechanik akzeptieren würden. Im ESONE-Committee entstand der Kompromiss mit Namen *JANUS*: Ein System mit der <u>Mechanik der Briten</u> und der <u>Elektronik des ad hoc Ausschusses</u>. Als der Name des zweigesichtigen römischen Gottes sich als "geschützt" herausstellte, wurde das (in beiden Richtungen lesbare) Kunstwort **CAMAC** (Computer Aided Mesurement And Control) als Bezeichnung kreiert.

Das CAMAC-System prägte für einige Jahre die Arbeit der Studiengruppe. Die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene war wohl noch intensiver als bei der Entwicklung des ESONE- Systems. Einerseits wurde am System selbst weitergearbeitet, andererseits wurden Geräte entworfen, beschrieben und vorgestellt, die die Experimentseite abdeckten und als Einschübe in die CAMAC-Überrahmen eingesteckt werden sollten. In dem Zusammenhang tauchte eine ganz neue Qualität auf für die Studiengruppe: Man musste sich nun mit der **Programmierung** beschäftigen. Alles dies geschah jetzt in CAMAC-working-groups aber auch in Untergruppen der Studiengruppe. Besondere Bedeutung hatte die CAMAC Dataway working group, deren chairman Dipl.-Ing. Horst Klessmann vom HMI war.

Die Software-Gruppe der Studiengruppe beschäftigte sich insbesondere mit den Fragen der "Echtzeit-Programmierung". In sehr kurzer Zeit wurde ein Entwurf für **PEARL**, eine **P**rocess and **E**xperimenta **A**pplication **R**ealtime **L**anguage erarbeitet. Die Ideen dieser Gruppe flossen wiederum in die wenig später entstandene CAMAC- Software-workinggroup ein.

CAMAC bekam eine solche Bedeutung, dass eine "European CAMAC Association", **ECA**, gegründet wurde, die auf europäischer Ebene ein Diskussionsforum für alles, was mit CAMAC zusammenhängt, sein sollte, wie die Studiengruppe im deutschen Sprachbereich ein Forum für Elektronik-Fragen im weitesten Sinne geworden war.

Die obersten Gremien bildeten das "CAMAC Management Board" (3 Personen, chairman: Prof. K. Zander), und das "CAMAC Councel" mit Vertretern aller Mitgliedsinstitutionen, in denen natürlich wieder etliche Studiengruppenmitglieder vertreten waren.

ECA teilte sich in lokale Untergruppen auf, die Studiengruppe wurde die "Regionale CAMAC Vereinigung (Association)", RCA Deutschland. mit engen Verbindungen -in den 70-er Jahren eine politische Sensation- auch zu den osteuropäischen Regionalgruppen<sup>13</sup>.

Zwei besondere Aktivitäten von Studiengruppenmitgliedern sollten hier noch genannt werden:

- Das CAMAC Management Board hat einen Verbindungsmann bestellt, der sich für die Verbreitung und die Einhaltung der CAMAC-Standards einsetzten und vor allem die Verbindung zur Industrie pflegen sollte.
- Dieser "Mr. CAMAC" wurde unser Dr. J. Trebst aus Erlangen.
- Um den Wust von CAMAC-Geräten halbwegs überblicken zu können, vor allem um die Produkte der Firmen vergleichen zu können, wurden alle CAMAC - Geräte - Herstelle um Produkt-Listen und -Spezifikationen gefragt, die dann zu einem CAMAC Product Guide zusammengefasst in 5 Auflagen erschienen<sup>14</sup>.

Die europäischen Entwicklungen gingen natürlich nicht an den Wissenschaftlern in den USA vorbei. Die Amerikaner hatten ihr NIM-System (**N**uclear **I**nstruments for **M**esurements), das -dem ESONE-System vergleichbar- auch an vielen Stellen in Europa

SEI Frühjahrssitzung 2004 Hamburg

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mit Tagungen in der UDSSR, Ungarn u.a.; Slogan: CAMAC, "Can Arrage Meetings in Any Country".

Herausgegeben 1978 bis 1988, zusammengestellt und bearbeitet von B.-A. Brandt im Fachbereich Physik, Marburg, gedruckt von EURATOM im schönen grünen Umschlag als ECA-Report.

zum Einsatz gekommen war. Aber die Einschübe passten nicht in die CAMAC-Überrahmen. An dem CAMAC-System waren die Amerikaner zwar interessiert, aber eine Übernahme war nicht möglich. Sollten sie nun eine CAMAC-Parallele entwickeln? Nach zähen Verhandlungen gab es den Kompromiss, einen Übergangsstecker zu entwickeln, durch den NIM-Einschübe in einem CAMAC-Crate zum Einsatz kommen konnten.

Einen Eindruck von den Verflechtungen der Studiengruppe mit anderen Gremien und Instituten mag die Abbildung 5 vermitteln.

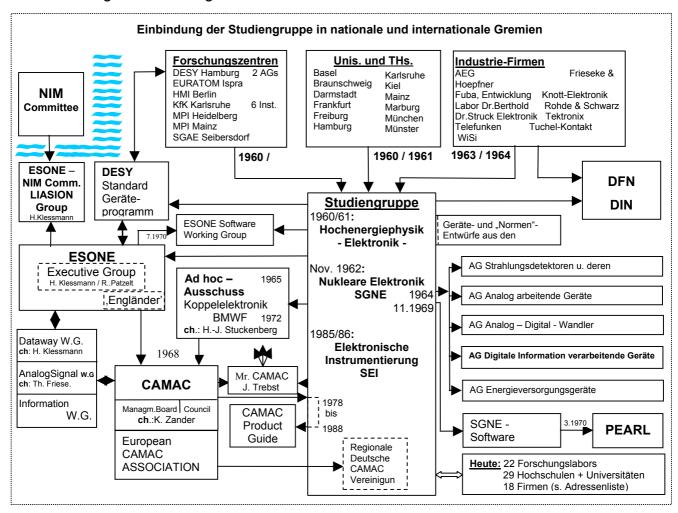


Abb. 5: Einbindungen der Studiengruppe

Aber es gab auch viel Kritik, dass die Studiengruppe sich so sehr auf ESONE und vor allem CAMAC geworfen hat; denn für grundsätzlich Fragen der Elektronik-Entwicklungen schien nicht genug Platz zu bleiben, und die Programmier-Probleme, die der Einsatz von CAMAC mit sich brachte, waren vielen Teilnehmern zu speziell. Deshalb wurden diese Fragen auch überwiegend in den Untergruppen behandelt. Deren Obmänner trugen dann aber ihre Statusberichte in den Studiengruppensitzungen vor - und entfachten dort nicht selten lebhafte (und tendenziell längliche) Diskussionen –wie in den Anfangsjahren der Studiengruppe die Diskussionen um die "Nukleare Elektronik" hochschlugen.

Es wurde aber auch immer wieder zurückgesteuert, insbesondere durch Vorträge aus den Gastgebenden Instituten, in denen verstärkt die Physik und die Hintergründe für die Entwicklungsaufgaben der Elektroniker und Ingenieure erläutert und damit neue inhaltliche Schwerpunkte gesetzt wurden.

In den 80-er Jahren schoben sich zunehmend Elektronik-Probleme aus nicht nuklearen Bereichen in den Vordergrund. Und wie bekannt, geriet das "Nukleare" in der Öffentlichkeit ziemlich heftig in Verruf. In der Suche nach einem neuen Namen fand der Vorschlag von Prof. H. Leopold aus Graz den meisten Beifall. In Erlangen wurde 1985 beschlossen, die "Studiengruppe für Nukleare Elektronik" in "Studiengruppe für elektronische Instrumentierung", SEI umzubenennen. Um die Abkürzung gab es noch einige Diskussionen. Schließlich wurde aber die ontologische Semantik geradezu als Programm akzeptiert.

An dieser Stelle wird es Zeit, etwas zu sagen über die

#### Finanzierung der Studiengruppe.

Mir ist nicht bekannt, welches Ministerium 1961 die Finanzierung der Studiengruppe übernommen hat. 1966 jedenfalls wurden die Finanzen vom BMWF (Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung) zurückgefahren, aufgrund unserer Anträge von Marburg aus aber erneut bewilligt. Die Gesamtkosten lagen bei ca. 30.000 DM pro Jahr.

Im Zusammenhang mit den starken internationalen Einbindungen der Studiengruppe, konnten die Beträge gesteigert werden. In den besten Jahren (ca. 1969 bis 1977) hatten wir über 75.000 DM pro Jahr zur Verfügung, um internationale Kontakte, z.B. auch USA-Aufenthalte, von Studiengruppenmitgliedern zu finanzieren. Seit 1984 war das BMFT für uns zuständig, und wir wurden von der Fachgruppe "Nuklearphysik" betreut. Die Finanzen wurden wieder knapper. Unsere Anträge wurden sehr restriktiv behandelt<sup>15</sup>. Neben unseren Verwaltungskosten (Papier, Druck und Porto) durften nur noch einer Person aus jeder Institution Reisekosten finanziert werden.

Als unser Name nicht mehr "nuklear" war, wurde die Studiengruppe sofort aus dem Förderprogramm "Nuklearphysik" herauskatapultiert. Für etwas so Exotisches, wie diese Gruppe, von dem man nicht einmal sagen konnte, "wie viel durch ihre Arbeit gespart würde", gab es keinen anderen Förderungstopf im Ministerium.

Auch der Fachbereich Physik der Uni Marburg ebenso die Philipps-Universität selber wollten oder konnten (nicht einmal für die Verwaltungskosten) einspringen.

#### Die Rolle der Industrie

Wie bereits erwähnt, hat die Studiengruppe fast von Beginn ihrer Arbeit an engen Kontakt zur Industrie gehabt. Das war für beide Teile nicht immer einfach. Insbesondere in den Bauteile- und Geräte-Informationen der ersten Jahre mussten sich die Herren<sup>16</sup> der Industrie oft sehr harsche Kritik anhören. Z.B., wenn die Geräte die Angaben in den Datenblättern nicht einhielten. Andererseits wollten Studiengruppenmitglieder sich nicht zu früh von der Industrie über die Schulter gucken lassen. Aber das hat sich alles im Laufe der Jahre gegeben. Jahrelang (mit kleinen Unterbrechungen bis heute) hat die Industrie mit der Ausstellung ihrer neuesten Produkte unsere Sitzungen bereichert. Umgekehrt haben die Industrievertreter immer wieder betont, wie wertvoll ihnen die Fachgespräche mit den Gruppenmitgliedern sind.

Oft bin ich von den Herren gefragt worden, ob sie ein Standgeld für ihre Ausstellung zu zahlen hätten. Wir haben verneint. Wie hätten wir es denn auch verbuchen sollen? In der Stunde der Geldnot aber kam die rettende Idee: Das Standgeld kann in Form von Spenden an die Philipps-Universität überwiesen und der Studiengruppe zur "freien" Verfügung gestellt werden. Damit haben sich alle Beteiligten einverstanden erklärt, und so

<sup>16</sup> In den ersten Jahren gab es keine Damen aus der Industrie als Sitzungsteilnehmerinnen, aus den Instituten nahm sehr früh Frau Barthel aus der GfK Karlsruhe regelmäßig teil.

SEI Frühjahrssitzung 2004 Hamburg

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> D.h. unsere Anträge mussten immer detaillierter und minutiös begründet, also immer umfangreicher sein.

war das Überleben der Studiengruppe 8 Jahre lang gesichert. Dafür gilt allen unseren Ausstellern ein ganz großer Dank.

Die Erstattung von Reisekosten der Teilnehmer war ab dem Zeitpunkt Sache der jeweiligen Institutionen. Letztendlich hat auch das geklappt. Aber bei einigen Teilnehmern stellte sich jedes Mal die Frage: "Fahre ich zu einer Sitzung, oder kaufe ich ein Gerät?"

Inzwischen hat sich die Frage der Verwatungskostenfinanzierung entschärft, es braucht niemand mehr Angst zu haben, die Studiengruppe sei von der Industrie abhängig.

#### Publikationen der Studiengruppe

Aus der Feder der beiden Herren v.Goeler und Nentwig fanden sich bisher unbeachtete Tagungsberichte für einige der ersten Studiengruppensitzungen und Jahresberichte für 1964 und 1965<sup>17</sup>, Aus diesen Berichten wissen wir von **drei Studiengruppensitzungen**, die **bisher unbekannt** waren und deshalb in unseren Listen bis zum heutigen Tage nicht enthalten sind<sup>18</sup>.

Herr Stuckenberg seinerseits war der Autor von "internen" Mitteilungsblättern, die er "Transistors Abendblatt" nannte. Sechs Ausgaben erschienen von Juli 1962 bis Mai 1965. In ihnen waren die neuesten Informationen aus der "Elektronik- und Studiengruppen-Welt" zusammengestellt und – in seiner unnachahmlichen und beliebten Art – humoristisch aufgelockert.

#### **Bauelemente-Information**

Die erste richtige "Publikation" unserer Gruppe war die Bauelemente Information von unserem Ehren-Doktor Th. Friese. Wie schon erwähnt, fanden bereits in den ersten Studiengruppensitzungen intensive Diskussionen über Geräte und Bauelemente statt. Treibende Kraft und Moderator war Th. Friese. Ab 1969 wurden Listen der behandelten Bauelemente, Ergebnisse der Diskussionen und Ergänzungen in schriftlicher Form festgehalten und an unsere Mitglieder verschickt. Herrn Friese gelang es obendrein, durch "passende" Randbemerkungen, die dröge Lektüre erfreulich aufzulockern. Diesen Stil übernahm dann auch Herr Götze, der Herrn Friese zunehmend unterstützte und ablöste. Später wurde auch der Tagesordnungspunkt "Bauelemente-Information" von Frieses Mitarbeitern bestritten. Aber seine Handschrift blieb unverkennbar. Wir können Herrn Friese gar nicht genug dafür danken. Aber auch Frau Völker sei Dank, die Verpacken, Adressieren, Frankieren und Versand zusätzlich zu besorgen hatte.

Die Bauelemente-Informationen bildeten den Anfang, überhaupt Informationen über die Sitzungen an die Mitglieder zu versenden (zur Erinnerung bzw. für die, die nicht teilnehmen konnten).

#### <u>Tagungsberichte</u>

Ab 1970 wurden Kurzfassungen der Vorträge zusammengestellt und -(aus Personal- und Infrastruktur-Gründen) nur einfach "geheftet"- verschickt. Ein besonderer Mangel war dabei, dass die "Veröffentlichungen" in dieser Form nicht zitierfähig waren.

Das änderte sich mit dem Übergang der Leitung an Dr. Gabriel. Das Forschungszentrum

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Offenbar als interne Papiere gedacht, z. B. für Finanzierungsanträge; denn ich kann mich nicht erinnern, einen dieser Berichte früher gesehen oder gar gelesen zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Wiederentdeckte Sitzungen: 3. Sitzung: DESY Hamburg, 29.5.1962, Tagungsbericht E.v.Goeler

<sup>7.</sup> Sitzung: KfK Karlsruhe, 23./24.1.1964, Jahresbericht 1964, H.Nentwich

<sup>9.</sup> Sitzung: MPI Heidelberg, 21./23.10.1964, Jahresbericht 1964, H.Nentwich

**Rossendorf** konnte die "gebundenen" Tagungsberichte mit einer FZR-Nummer versehen und damit **zitierfähig** machen. Ein wichtiger Punkt; denn so kann man auch neueste Forschungsergebnisse oder entsprechende Pläne –und die möchten wir ja gerade hörenbekannt machen, ohne den Urheberschutz zu verlieren.

Seit der Leitung durch Dr. Wulf ist entsprechend die Vergabe von ISSN-Nummern möglich – und die Berichte sind nun im Internet, auf CD oder als Hochglanzbroschüre verfügbar.

#### Die **D**-Programme

Ein wesentliches Anliegen der Studiengruppe war stets das gegenseitige Kennen lernen. Das betraf nicht nur die Personen, sondern auch ihre Heimat-Institutionen. So war mit jeder Sitzung auch der Tagesordnungspunkt "Besichtigung" des ausrichtenden Instituts bzw. der Labors. Die Rundgänge waren stets informativ –und oft hochinteressant–, aber wenn mehrfach an einem Institut getagt wurde, war es schwer, etwas Neues zu zeigen. Deshalb entstand die Idee, über den Rand der Institute hinaus zu sehen. Das Eis war ja gebrochen, als wir das erste, und bisher einzige Mal, nicht in einem Institut getagt haben: 1972 in Dunen. Einziges "technisches" Besichtigungsobjekt war dort ein "Dampfer" – und mit dem sind wir dann nach Helgoland gefahren.

Nach und nach entwickelte sich der **D**ienstagnachmittag zum Besichtigungstermin, immer wieder in unseren Instituten, aber gelegentlich mehr oder weniger weit entfernt vom Institut und (auch) "elektronischen" Fragen: Ein breites und hoch interessantes Spektrum von der Technik bis zur Kultur<sup>19</sup>:

```
9 1972 Helgoland, Duhnen
 3 1975 Flugerprobungsstelle Manching: MRCA-Tornado, Garching
 3 1981 Elektronikzentrum der Post im Fernsehturm München, Martinsried
 3 1982 Leiterplattenfertigung, Marburg
 3 1983 Sonnenobservatorium Schauinsland, Freiburg
10 1983 Deutsches Wetteramt Offenbach, Frankfurt
 3 1984 Gutenberg Druckerei, Mainz
 3 1985 Tagebau Hambach, Jülich
 4 1986 Sternwarte GAP, Pic de Bure, Grenoble
9 1986 Kernkraftwerk Philippsburg, Karlsruhe
10 1987 AMI Halbleiterfertigung, Graz
 3 1989 Umwelt-Waldschäden, Erlangen
10 1989 Plantin-Moretus: MA Druckerei (Antwerpen), Geel
 3 1991 Gickelhahn, Ilmenau
 3 1994 Einsteinturm (Babelsberg), Berlin
 3 1994 MA Kornmühle (Brückermühle) / Friedensstein /
        Sprengstoffgelände (Stadtallendorf), Marburg
 9 1997 Flugsimulator, Frankfurt
 9 1998 AVAX -Stützpunkt (Geilenkirchen), Jülich
 3 1999 Opelwerke, Bochum
 9 1999 Sächsische Schweiz: Burg Breitenstein, Rossendorf
 3 2000 ESA / Heidelberger Druckmaschinen, Heidelberg
 9 2000 Ernst-Reuter-Kraftwerk, Berlin
 4 2001 Ägypten-Ausstellung, Karlsruhe
```

9 2003 Planetarium / Bergbaumuseum, Bochum

Hier ist eine gute beste Stelle, auch unsere Damen zu erwähnen. Ehefrauen, Verwandte und Bekannte, nahmen die Gelegenheit wahr, an den Tagungen teilzunehmen, bzw. die jeweiligen Städte zu besichtigen. Zunächst waren die örtlichen Veranstalter bemüht, ein "Damenprogramm" zu organisieren, später haben das unsere (inzwischen befreundeten)

SEI Frühjahrssitzung 2004 Hamburg

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Die Liste ist leider nicht vollständig; da keine Dokumentation darüber existiert; denn die Tagesordnungen sind fast nie in den Sitzungsberichten enthalten.

Damen selbst in die Hand genommen. Meist haben sie auch an unseren Instituts-Besichtigungen teilgenommen, und erst recht bei den externen Besichtigungen mitgemacht.

#### Zum Schluss:

Ich habe immer wieder Namen genannt. Das bringt mich am Ende in eine schwierige Situation: Viele Namen von weiteren Damen und Herren wären zu nennen, die sich um die Studiengruppe verdient – zum Teil sehr verdient – gemacht haben. Jede Aufzählung wäre aber unvollständig; denn letztlich haben alle "Mitglieder" der Gruppe und auch die Vertreter aus der Industrie ihren Teil zum Gelingen und Leben der Gruppe beigetragen. Um alle zu nennen, wären über 400 Namen mit Bemerkung und Erklärung aufzuzählen. Das würde den Rahmen meiner Ausführungen sprengen und ich würde auch dann nicht allen gerecht werden können. Deshalb bitte ich, alle Genannten jeweils als pars pro toto zu sehen. Allen Nichtgenannten gilt unser vielfältiger Dank und unser aller Anerkennung in gleicher Weise.

Mit besonderem Dank möchte ich an unsere verstorbenen Mitglieder denken, die fast alle zu den aktivsten der frühen Jahre gehört haben. Auch hier kann ich nur die nennen, von deren Tod ich gehört habe. In ehrendem Gedenken nenne ich hier ihre Namen:

Dipl.-Phys. Akolk, TU Braunschweig / DESY Hamburg

Dr. Wolfgang Attwenger, RZ Seibersdorf

Prof. Dr. Ulrich Cappeller, Phys. Inst. Marburg

Dipl.-Ing. Gerhard Ebeling, PTB Braunschweig

Prof. Dr. Werner Kessel, IKF Frankfurt / TU Berlin

Dr. Gerd Klasmeier, Phys. Inst. Würzburg

Dipl.-Ing. Horst Klessmann, HMI Berlin

Dipl.-Ing. Alfred Krolzig, DESY Hamburg

Dr. Rainer Kurz, KfA Jülich

Dr. Horst Meyer, EURATOM Geel

Dipl.-Ing. Rainer Staudte, IKF Frankfurt

Dr. Hans-Joachim Stuckenberg, DESY Hamburg

#### Zusammenfassung und Ausblick:

Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermittelt, dass heute die 88. Sitzung der Studiengruppe SEI stattfindet.

Wenn ich in die Zukunft blicke, habe ich keine Zweifel, dass die Gruppe noch etliche Jahre erfolgreich weiterarbeiten kann. Wenn es dabei mit zwei Sitzungen pro Jahr weiter geht, wird im

### Frühjahr 2010

die

100. Sitzung

stattfinden. Das könnte ein großes Fest werden.

Folgt man meinen Überlegungen zum Gründungsdatum mit März 1960, ist gleichzeitig das

#### 50-jährige Bestehen

der Studiengruppe

SEI

zu feiern.

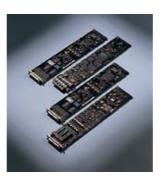
Dazu wünsche ich viel Glück und nachhaltigen Erfolg.

Aufhören möchte nicht, ohne einen herzlichen Dank an alle auszusprechen, die mich beim Zusammentragen des Materials für diesen Rückblick unterstützt haben:

Fr. Kriesten, Dr. Th. Friese, Dr. F. Wulf; Berlin Fr. E. Völker, Dr. R. Thielmann; Marburg Fr. H. Breitenstein, Dr. F. Gabriel; Rossendorf



# **ProDAQ**



Professional Data Acquisition
And Control



## Was habe ich vor?



- Einführung über Bustec
- Was ist der ideale Bus??
- Was spricht f
  ür oder gegen den VXIbus
- ProDAQ
  - Konzept
  - Mutterkarte
  - Funktionskarten
  - Slot0's
  - Software & System Integration
- Was ist der Bus der Zukunft?
- Zusammenfassung



## Einführung zu Bustec





- ISO 9001 im Oktober 2000
- ProDAQ Boards von Siemens in Deutschland gefertigt
- Kunden:
- ➤ Bosch
- ➤ VDO
- ➤ Eurofighter
- Airbus Industries
- ➤ Alcatel
- ➤ Alstholm
- ➤ Peugeot
- ➤ Daimler Chrysler
- ➤ EDF
- ➤ PSI
- ➤ LRBA

- ➤ Boeing Rocketdyne
- > Hughes Aircraft
- ➤ Los Alamos
- > Northrop Grumman
- > TRW
- ➤ Lockheed Martin
- ➤ Honeywell Space-Systems
- > NASA
- ➤ General Electric
- General Dynamics
- ➤ IBM



### Was ist der ideale Bus?



- Bussauswahl
  - Wofür?
  - Was sind Ihre Bedürfnisse?
  - Viel Rechenleistung
  - Schnelle Regelung
  - Hohe Messgenauigkeit
  - Viele Mess- und/oder Steuerkanäle
  - Wie sind diese verteilt ?

# Vergleich verschiedener Busse





	GPIB	USB 2.0	IEEE1394 "Firewire"	VME	VXI	PXI	CPCI	PCI		
Data throughput	Cal	ole connecti	ons	Backplane Busses						
- theoretical [MBytes/sec]	1	60	100	320	160	132	132, 264	132		
- achievable [MBytes/sec]	0.5	40	80	200	100	40	40, 80	40		
Real-time Capability	yes	yes	yes	yes	yes	limited	limited	no		
Synchronisation	no	yes	yes	no	yes	yes	no	no		
Analog Accuracy	high	high	high	middle	high	middle	middle	small		
Defined SW Drivers	no	yes	yes	no	yes	yes	no	no		
Open SW Platform	yes	yes	yes	yes	yes	no	yes	no		
Size	large	small	small	small-middle	middle	small-middle	small-middle	small		
Nb. of vendors	> 500	< 30	< 5	> 100	> 100	8	< 30	> 1.000		
IEEE Standard	yes	no	yes	yes	yes	no	no	no		
Price	high	low	low-middle	middle	middle	middle	middle	very low		

### Gründe für den VXIbus

als Mess- und Instrumentierungsbus



- Gut etablierter IEEE Standard
- Über 100 bekannte Hersteller
- Über 2000 verschiedene Module
- Standardisierte SW Treiber mit jedem Produkt
- Gute analoge Genauigkeit



# Gründe gegen den VXIbus



- Historisch zum Teil zu teuer
- Historisch zu wenig Daten-Bandbreite, weniger wie VME

# ProDAQ

# Was bringt Bustec/ProDAQ



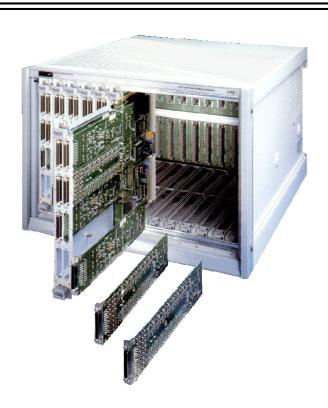
- Sehr hohe Datenbandbreite
- VXIbus 3.0 dank Bustec
- Erfüllt sehr harte Echtzeitanforderungen
- Sehr hohe analoge Genauigkeit
- Sehr hohe, skalierbare Kanalzahlen/Slot
- Bis zu 8 verschiedene Funktionen/Slot
- Dadurch kleine Systeme mit hoher Kanaldichte
- DSP's/Slot => sehr schnelle Steuerung
- Kostenersparnisse bis zu 50%



# **ProDAQ Konzept**



Mutterkarte -Funktionskarten Ansatz





# **ProDAQ Konzept**

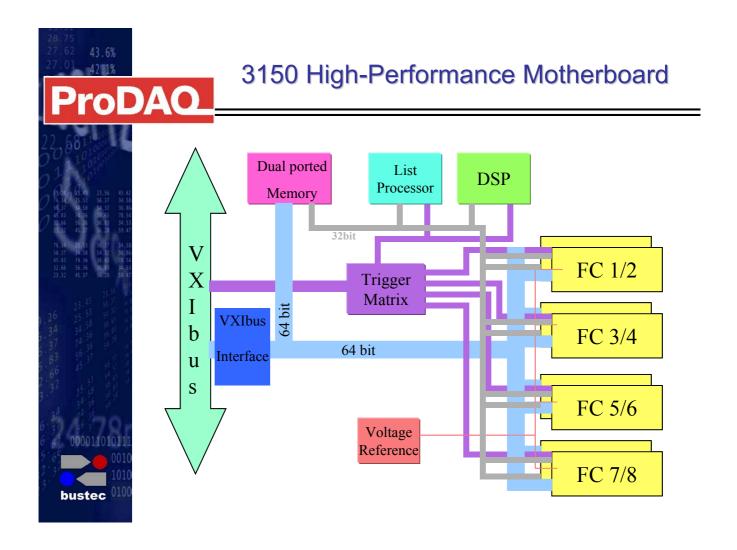


- Mutterkarte & Funktionskartenansatz
- Optionale onboard programierbare Spannungsquelle
- Optionales onboard Dual ported Memory (128 MB)
- Optionale onboard DSP's



- Bis zu 8 beliebig versch. Funktionskarten pro VXIbus Slot
- Bis zu 384 Kanäle pro Slot (192 differentielle Kanäle)
- 20 25 MB/sec kontinuierlicher Datendurchsatz
- Weniger wie 200 nsec "Interrupt Response Time"
- Kompletter PID-Loop in weniger wie 2 μsec
- Einfache Entwicklung spezieller Funktionskarten
- "On the Fly" Kalibrierung (mit bis zu 0.001% Genauigkeit)





### **ProDAQ Function Card Range** 3410 - 24 Ch. Input Protected ADC 3411 - 24 Ch. Enhanced ADC 3430 - 4 Ch. Σ-Δ ADC, 625KHz, 16bit 3431 - 4 Ch. Σ-Δ ADC, 102.4KHz, 16bit 3432 - 4 Ch. Σ-Δ ADC, 51.2KHz, 16bit 3450 - 2-ch. 3 MHz Transient Rec. 3451 - Transient Rec. Timer Card 3452 - Programmable Clock Card 3510 - 16-Ch Precission DAC 3511 - 8-Ch. Enhanced 200 KHzDAC 3550 - Fast DAC/AWG 1MHz 3610 - 48-Ch. Digital I/O 3630 - 4-Ch. Prog. 16MHz serial Card 3653 - 2-Ch. MIL-STD-1553 Interface 3806 - 40 MHz Counter/Timer 3911 - Pulsed Current Source 3940 - 32-Ch. Switching/Relay Function



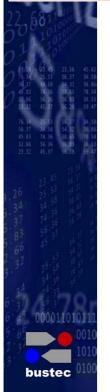
### **Treiber & Software Support**



- Treiber (als Sourcecode mitgeliefert)
  - \*Plug&Play Treiber für Windows
  - \*Plug&Play Treiber für Linux Environment
  - ★Plug&Play Treiber für VxWorks
- Software Support
  - \* HP-Vee
  - \* Visual Basic
  - \* Labview/Labwindows
  - \* Matlab/Simulink Crosscompiler für das HMB



### Slot-0 Kontroller

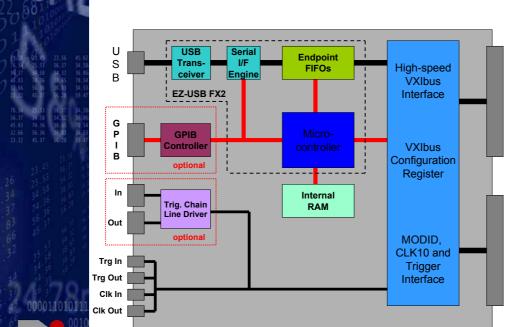






### ProDAQ 3020

**USB2.0 Slot-0 Controller** 



- · C-Size, single slot
- USB 2.0 Port
- · Trigger In/Out
- Clock In/Out
- Complete Trigger I/O for Trigger Chaining, in the 3020–BA version
- With optional GPIB port
- 32 MB/sec sustained incl. SW
- Configurable Slot-0/ non-Slot-0 operation

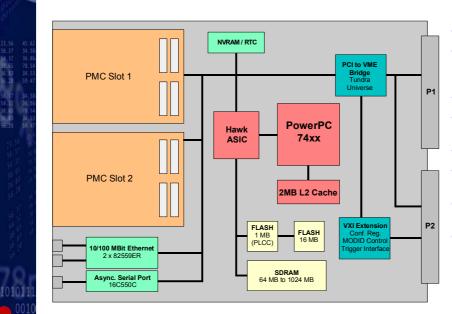
Besteht Bedarf für solch ein VME-board?



bustec

### ProDAQ 3042/3

PowerPC-based Embedded Slot-0 Controller

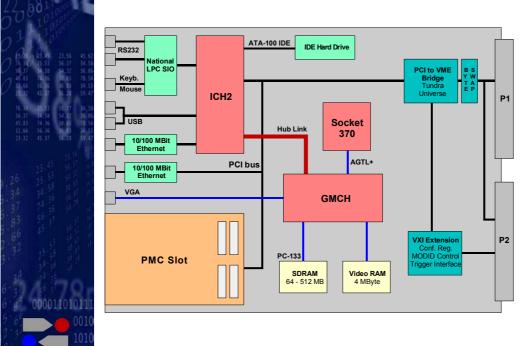


- · C-Size, single slot
- 500/1000 MHz G4
   PowerPC with up to 2MB cache
- 27MB/sec throughput
- 512 MB to 1GB on-board ECC-protected DRAM
- 16 + 1 MB FLASH
- Two 10/100/1000 Mbit Ethernet Interfaces
- Configurable Slot-0/ non-Slot-0 operation
- Two PMC slots for expansions

# ProDAQ\_

#### ProDAQ 3045/6

#### Pentium-based Embedded Slot-0 Controller



- · C-size, single slot
- 1.3/2.2 GHz
   Pentium III/IV
   processor with
   133/400 MHz
   system bus
- Up to 512 MB/1GB SDRAM
- 23MB/sec throughput
- Two 10/100/1000
   Mbit ethernet interfaces
- Keyboard, Mouse, USB, RS232 I/O via front panel
- IDE Hard Drive
- · PMC expansion slot
- Slot-0/non-Slot-0 operation (progr.)



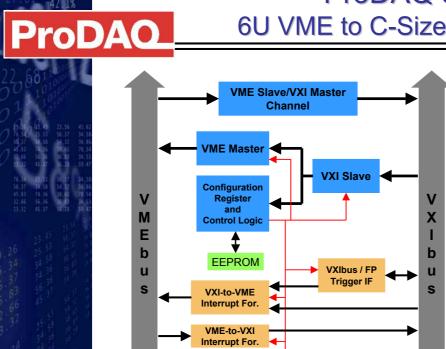
## Software Support

#### **Bustec Slot-0 Controller are shipped with:**

- Standard VXIplug&play compatible VISA-Library
- VXI Resource Manager

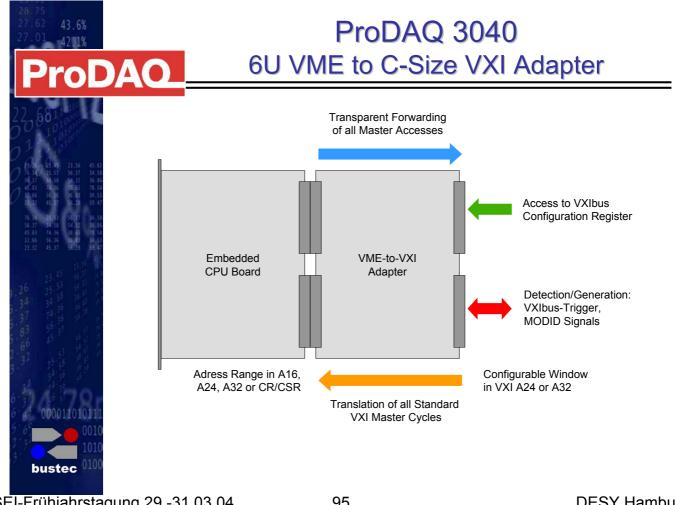
#### **Supported Operating Systems:**

- Linux all Slot0's
- Windows 2000/XP (ProDAQ 3045/6 and 3020)
- VxWorks (ProDAQ 3042/3 and 3045/6)



## ProDAQ 3040 6U VME to C-Size VXI Adapter

- VME64x compatible **VME-Interface**
- VXIbus Spec. Rev. 2.0 compatible VXI-Interface
- Transparent forwarding of all **VMEbus Master-Accesses to** the VXIbus
- Integration of the VME Slave Access into the VXIbus **Resource Management**
- VXI-to-VME and VME-to-VXI Interrupt Forwarding and **Vector-Translation**
- VXIbus-compatible **Configuration Register**
- VXIbus and Front-panel Trigger Interface, MODID Support, **CLK10 Generation**
- **Auto-SYSCON Detection and Forwarding**



MODID, CLK10

Slot-0 Detection

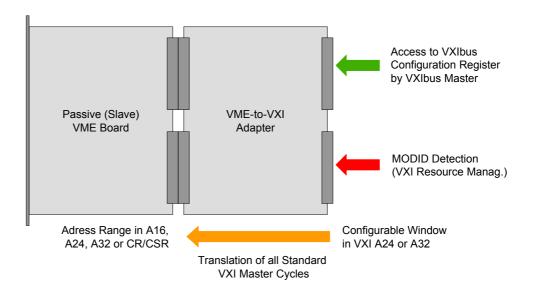
Auto-SYSCON

Detection



## ProDAQ 3040 6U VME to C-Size VXI Adapter







#### Was kommt dann bei Bustec?

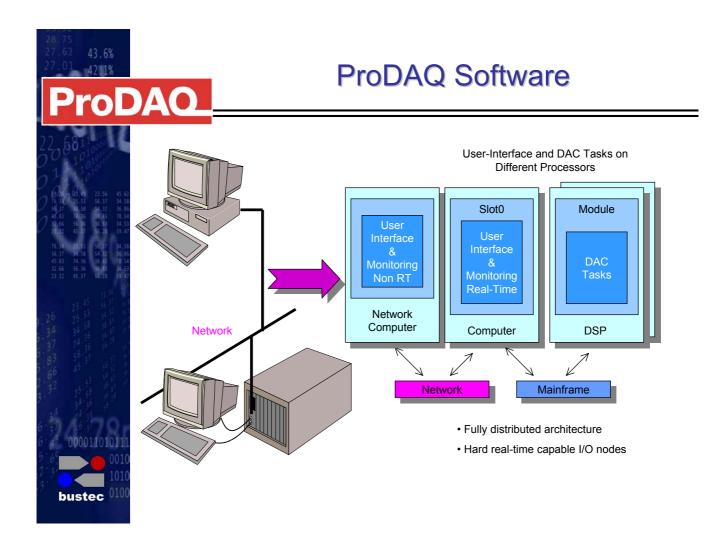


#### 🎉 3180 Nächste Genaration Mutterkarte

- Bis zu 4 DSP's, TigerSHARCS
  - 2eVME Protokoll mit 120MB/sec Datendurchsatz
  - Bis zu 1 Gbyte onboard Memory
  - Schnellerer interner Bus
  - Q4/04 Q1/05

## 3030 1Gbit Ethernet Kontroller

- 2eVME Protokoll mit70-80MB/sec Datendurchsatz
- Q4/04 Q1/05





## Was ist der Bus der Zukunft



- Die Ära der parallelen Backplanebusse ist vorbei
- VXIbus war der letzte gute Mess- und Instrumentierungsbus
- Es werden serielle Busse mit/ohne "Crossbar Switchen" kommen
- Wann?
- Weiss ich nicht !! Frühestens in 3-5 Jahren
- Welcher?
- Time will show !! (Rapid I/O, 3GIO)
- Glaube ich an PXI?
- Nein, denn das bringt dem Anwender keinen Vorteil!!
- Aber man sollte die Marketingmacht von NI nicht unterschätzen



## Zusammenfassung



- VXIbus ist in der Messtechnik die beste Lösung für Anwendungen die hohe Messgenauigkeiten bei gutem Datendurchsatz erfordern
- Die ProDAQ Produktpalette ist ständig am Wachsen
- ProDAQ Produkte werden von Siemens für Bustec produziert
- ProDAQ wurde für hohen Datendurchsatz, hohe Kanalzahlen and sehr hohe analoge Genauigkeit entwickelt
- ProDAQ ist ein idealer Fit für Echtzeitanwendungen
- ProDAQ ist 30 50% preiswerter wie Konkurenzprodukte
- Der Bus der Zukunft wird serieller Natur sein

#### Maximale Skalierbarkeit mit LabVIEW

Von der einfachen Datenerfassungsapplikation bis hin zur FPGA Lösung

Dipl.-Ing.(FH) Thomas Rönpage – National Instruments Germany

ni.com

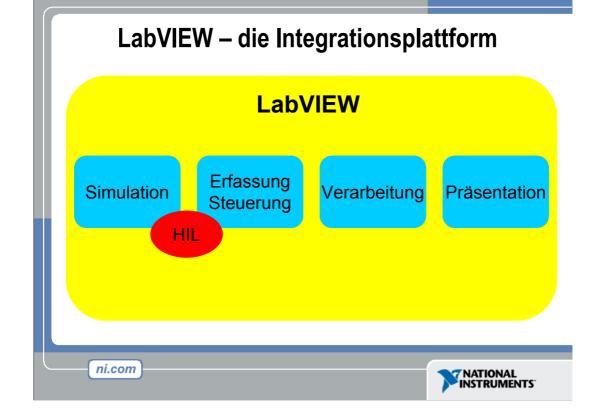


#### **Inhalt**

- LabVIEW die Integrationsplattform
- Simulation mit LabVIEW
- Erfassung und Steuerung mit LabVIEW
- Datenverarbeitung mit LabVIEW
- Präsentation mit LabVIEW und DIAdem

ni.com





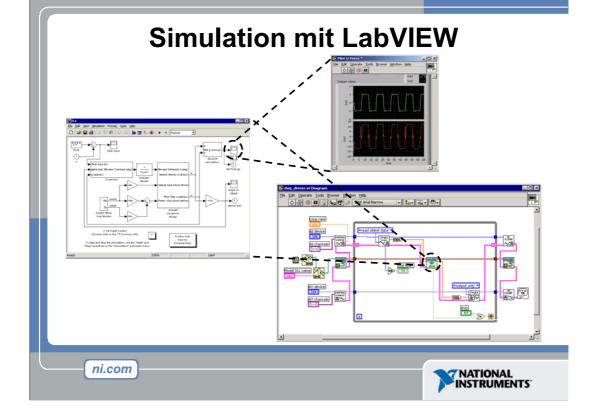
Die graphische Programmiersprache LabVIEW, die seit nunmehr 18 Jahren die Meß- Prüf- und Automatisierungstechnik revolutioniert hat, ist die Integrationsplattform für einen breiten Anwendungsbereich.

Im obigen Bild sind die Funktionseinheiten der Entwicklungsumgebung dargestellt. Neben den klassischen Aufgaben der Erfassung/Steuerung, Verarbeitung und Präsentation, ist in den letzten Jahren mit der Simulation ein neuer Aufgabenbereich herangereift.

Die Funktionseinheit der Simulation stellt dabei eine perfekte Ergänzung des klassischen Funktionsumfangs dar, die speziell von den vorhanden Funktionen profitiert.

Der Austausch von simulierten Größen gegen reale Meßwerte wird durch LabVIEW zum Kinderspiel. Speziell durch die breite Hardwareplattform, die von National Instruments angeboten wird, lassen sich sehr leistungsfähige HIL Prüfstände realisieren.

Auch den Bereich der Datenpräsentation konnte National Instruments durch die Akquisition der Fa. GfS mit ihrem DIAdem deutlich ausbauen. Skalierte Ausdrucke, Höhenliniendiagramme und Schriftfelder sind nur einige Beispiele der leistungsfähigen Reporterstellung von DIAdem.



Da die Simulation im heutigen Produktentstehungsprozeß eine zentrale Rolle spielt und der Übergang von der Simulation zum realen Objekt einfach möglich sein soll, war die Integration in LabVIEW die logische Konsequenz.

LabVIEW bietet derzeit verschiedene Integrationsmöglichkeiten:

Es gibt ein Simulation-Interface-Toolkit, das eine Integration mit dem Simulink® von The MathWorks erlaubt. Hierbei ist es zum Einen möglich die Ein- und Ausgänge des Simulink®- Modells auf einer LabVIEW Oberfläche darzustellen und somit eine geeignete Visualisierung zu erzielen, und zum Anderen läßt sich ein Simulink®- Modell direkt in ein LabVIEW-VI konvertieren. Die Möglichkeit ein Simulationsmodell als LabVIEW-VI zur Verfügung zu haben ist besonders attraktiv, da über die Parameter des LabVIEW-VI's auf alle Prozeßparameter und Ein- und Ausgänge des Modells zugegriffen werden kann und somit die gesamte Hardware von National Instruments für dieses Modell zur Verfügung steht. An dieser Stelle kann LabVIEW seine Stärke der Skalierbarkeit voll ausspielen und dieses Modell VI auch unter dem LabVIEW-RT unter Echtzeitbedingungen laufen lassen.

Weiterhin bietet LabVIEW mit dem Math Interface Toolkit auch den umgekehrten Weg. Mit diesem Toolkit lassen sich LabVIEW-VI's in MEX-Funktionen integrieren, so daß beliebige LabVIEW-VI's auch aus dem MATLAB® aufgerufen werden können.

Mit der nächsten LabVIEW-Version wird National Instruments einen weiteren großen Schritt zur Integration von Simulationsanwendungen anbieten.

### **Erfassung/Steuerung mit LabVIEW**

- Großes Spektrum an Schnittstellen
  - Seriell, GPIB, CAN, Profibus, LIN...
- Dezentrale Komponenten
- Riesige Bandbreite an Datenerfassungskarten
  - -DC ... 2,7 GHz
- Bilderfassung Machine Vision
- Motorensteuerung Motion
- Echtzeit / FPGA

ni.com



Die Erfassung und Ausgabe von Daten sowie die Kommunikation über Schnittstellen, stellt sicherlich die Kernfunktionalität einer Entwicklungsumgebung für die Meß- Prüf- und Automatisierungstechnik dar.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Entwicklungsumgebung flexibel und offen ist, damit alle notwendigen Daten eingelesen bzw. ausgegeben werden können. Dieser Punkt ist sei jeher eine der großen Stärken von LabVIEW, da National Instruments selbst mit über 1000 Produkten ein sehr breites Angebot bereithält und zusätzlich die Offenheit der Software eine Integration von 3rd Party Komponenten ermöglicht.

Die ständig wachsende Leistungsfähigkeit von PC's hat immer neue Applikationen ermöglicht. So sind heute Einsteckkarten im Bereich von 100 MHz oder sogar bis zu 2,7 GHz verfügbar, und es ist möglich geworden Bilddaten zu erfassen und mit einem Standard PC zu verarbeiten.

Da es im technischen Anwendungsbereich eine Vielzahl von Applikationen gibt, bei denen ein Echtzeitverhalten gefordert ist, was mit einem Windows basierten System nicht zu erreichen ist, hat National Instruments ein LabVIEW-Real Time im Angebot. Auch hier spielt die Skalierbarkeit wieder eine entscheidende Rolle. Der gleiche LabVIEW-Code der unter der Windows Entwicklungsumgebung läuft, kann auf ein Echtzeitsystem heruntergeladen werden.

Die aktuellste Ausprägung für die Realisierung von Echtzeitanwendungen stellt die LabVIEW FPGA Technologie dar, mit der es möglich ist direkt LabVIEW-Code in ein FPGA zu laden.



In der dezentralen Messtechnik kommen die Komponenten der Fieldpoint- oder Compact-Fieldpoint-Familie zum Einsatz. Diese Komponenten bieten Eingänge für übliche Sensoren, wie PT-100, DMS, Thermoelement, usw, sowie digitale Einund Ausgänge in der üblichen 24V-Technik.

Die Ankopplung dieser Fieldpoint-Bänke erfolgt über die Ethernet Schnittstelle, wobei es intelligente und passive Kommunikationsmodule gibt.

Bei diesen unterschiedlichen Konfigurationen kann LabVIEW seine Skalierbarkeit voll ausspielen. Das gleiche Programm, dass bei den rein passiven Kommunikationsmodulen auf dem PC läuft, kann in die intelligenten Kommunikationsmodule heruntergeladen werden und läuft dort autark unter einem Echtzeit-Betriebssystem.

Ein spezieller Real-Time-Kommunikationsassistent ermöglicht die Verteilung der Applikation auf Knopfdruck.

#### Klassische Instrumente mit LabVIEW

- NI 4070 6,5 digit DMM und 1,8MS/s Digitizer
- NI 5122 100MHz 14 Bit Digitizer
- NI 6552 100MHz Digital Waveform Analyser/Gener.
- NI 5404 100MHz Clock and Frequency Generator
- NI 5660 2,7 GHz RF Signal Analyser
- NI 5670 2,7 GHz RF Vector Signal Generator

ni.com



Selbst der Bereich der klassischen Box-Instrumente für den Hochfrequenzbereich bleibt LabVIEW nicht länger verschlossen. Auch wenn es schon immer möglich war existierende Geräte über die entsprechenden Bus-Anbindungen (RS-232 oder GPIB) zu integrieren, gibt es nun eine Reihe von PXI-Einsteckkarten, die deutlich höhere Messgeschwindigkeiten und spezielle Funktionen anbieten.

Ein gutes Beispiel für die Funktionsvielfalt ist die NI 4070. Diese Karte kann als hochgenaues DMM mit 6,5 Digits Genauigkeit bis zu 100Hz betrieben werden oder aber als High Speed Digitizer mit 1,8MS/s und 10Bit Auflösung.

Auch der 100MHz Messbereich ist mit drei neuen Karten gut besetzt. Es gibt einen zweikanaligen Digitizer mit einer Bandbreite von 100 MHz und einer Auflösung von 14Bit.

Für den Test von digitalen Bussen und Leitungen hält der 100MHz digitale Logikanalysator/Generator einige spezielle Funktionen bereit. Bei diesem Gerät läßt sich der Spannungspegel von -2V bis 5.5V in 10mV Schritten einstellen und die Zustände an den Ausgängen können zurückgelesen werden, um ein elektrisches Fehlverhalten des Busses zu erkennen.

Sogar der Gigahertz-Bereich ist mit zwei PXI-Einschüben besetzt und bietet sowohl einen Signal Analysator als auch einen Vektor Generator.

#### **Echtzeit mit LabVIEW**



Einsteckkarte



PXI-System



Fieldpoint



**Compact Vision System** 

ni.com



Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen das Betriebssystem Windows aufgrund seiner nicht-deterministischen Eigenschaften ungeeignet ist. Zwar gibt es auch spezielle Echtzeitbetriebssysteme sowie Echtzeiterweiterungen für Windows, jedoch stehen dafür meist nur sehr spezielle und komplizierte Entwicklungssysteme zur Verfügung und die Investitionssicherheit ist aufgrund fehlender Zukunftsperspektive nicht gegeben.

Bei National Instruments war von Beginn an klar, dass man einem Anwender den Komfort, den er von Windows gewohnt ist, auch auf dem Echzeitsystem bieten muss. Deshalb war das Ziel den ganz normalen LabVIEW-Code auf ein Echtzeit-Target herunterzuladen. Diese Lösung wurde Ende der neunziger Jahre erstmals angeboten.

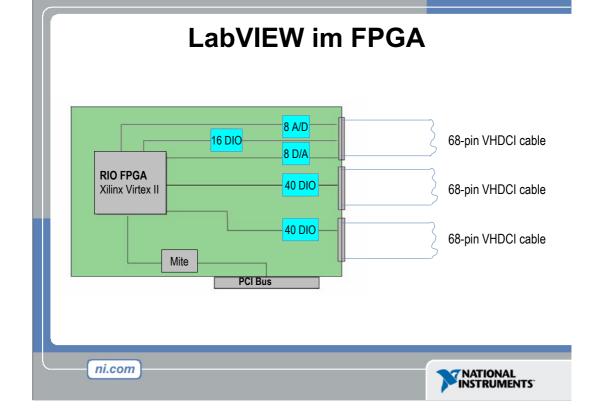
Mittlerweile sind vier Klassen von Echtzeit-Zielsystemen entstanden:

Die Einsteckkarte ist eine Datenerfassungskarte mit lokaler Intelligenz. Hier läuft das Echtzeitbetriebssystem auf dieser Einsteckkarte die zusätzlich über Analoge Ein- und Ausgänge, sowie digitale I/O's verfügt.

Für eine größere Skalierbarkeit bietet das PXI-System eine Lösung. Hier läuft LabVIEW-RT auf dem Controller, der über das Netzwerk an einen Windows-PC angeschlossen ist. Für das PXI-System gibt es neben den Datenerfassungskarten auch eine Echtzeitunterstützung für die Schnittstellen, CAN, IMAQ sowie 3rd Party-Komponenten.

Auch das dezentrale Fieldpoint System erlaubt den Download von LabVIEW-Programmen.

Die aktuellste Ausprägung der Realtime-Zielsysteme ist das Compact-Vision-System, welches den Betrieb von drei IEEE1394 Kameras erlaubt und als Machine-Vision-System autark arbeiten kann.



Mit der Möglichkeit LabVIEW-Code in ein FPGA zu laden wird die Skalierbarkeit von LabVIEW erst richtig deutlich.

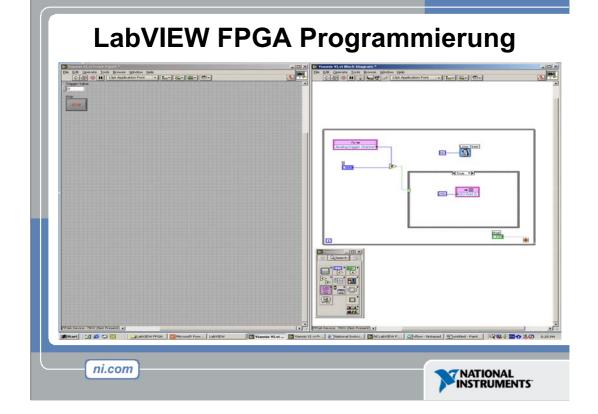
Die erste Karte dieser Technologie wird als Rekonfigurierbare-I/O-Karte bezeichnet und verfügt über 96 digital I/O-Leitungen sowie acht analoge Eingänge und acht analoge Ausgänge.

Die A/D- bzw. D/A-Wandler können bis zu einer Abtastrate von 200KS/s betrieben werden und erreichen eine Auflösung von 16-Bit. Die digitalen I/O's hingegen sind direkt mit dem FPGA verbunden und werden in Ihrer Verarbeitungsgeschwindigkeit nur durch die Gatterlaufzeiten des FPGA begrenzt, die fünf Nanosekunden bei einer Taktung mit 200MHz beträgt.

Dadurch das auf dem FPGA keinerlei Betriebssystem läuft braucht man sich auch keinerlei Gedanken um ein Sheduling zu machen. Die Schleifen, die in LabVIEW parallel laufen, werden auf dem FPGA wirklich parallel realisiert. Da die Funktionalität des FPGA frei programmiert wird, sind der Flexibilität keine Grenzen gesetzt. Es können Telegramme erzeugt werden, 80 Zähler parallel laufen oder 8 Regler mit 10KHz parallel implementiert werden.

Die einzige Einschränkung ist derzeit die ausschließliche Unterstützung der Integer-Arithmetik. Eine Fließkomma-Operation würde sehr viel Platz auf dem FPGA verbrauchen.

Mit dieser Technologie wurde beispielsweise ein HIL Prüfstand zur Kurbel-Nockenwellensimulation realisiert, wobei die benötigten PWM-Signale nicht nur vom FPGA erzeugt, sondern auch zur Laufzeit verändert werden können.



Auch für die FPGA-Programmierung gelten die gleichen Überlegungen wie für die Realtime-Programmierung. Während normalerweise die Kenntnis der VHDL-Sprache eine Voraussetzung für die Programmierung von FPGA-Bausteinen ist, sollte der LabVIEW-Anwender in die Lage versetzt werden direkt seinen LabVIEW-Code in ein FPGA herunterzuladen. Dieser Herausforderung stellten sich National Instruments und das National Propulsion Lab in Kalifornien. Im Jahr 2003 kam mit der Rekonfigurierbaren I/O-Karte das erste Produkt auf den Markt.

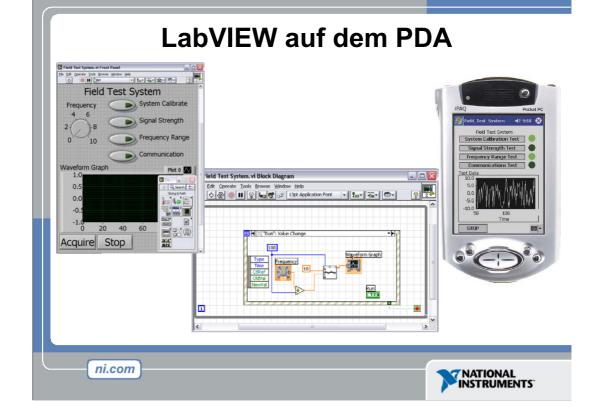
Der LabVIEW-Anwender installiert einfach das FPGA-Modul für LabVIEW und erhält damit die Möglichkeit seinen LabVIEW Code per Mausklick für das FPGA zu kompilieren und automatisch herunterzuladen.

Die Funktionspalette für die FPGA-Programmierung unter LabVIEW ist gegenüber der Windows-Palette eingeschränkt. Es fehlen die Bibliotheken wie Stringbearbeitung, Datei-I/O, Datenerfassung, ActiveX, usw, die auf dem FPGA keinen Sinn ergeben.

Die einzige reale Beschränkung ist die ausschließliche Verwendung von Integerarithmetik, d.h. eine Division ergibt stets ein Ergebnis und einen Rest aber keine Dezimalzahl.

Technisch betrachtet erzeugt LabVIEW automatisch den VHDL-Code, der dann vom Xilinx-Compiler in den Bitstream umgewandelt wird. Praktisch betrachtet freut sich der LabVIEW-Entwickler, dass er mit all diesen Schritten nichts zu tun hat.

Besonders spannend ist die Tatsache, dass parallele Schleifen aus dem LabVIEW-Diagramm auf dem FPGA tatsächlich auch parallel ablaufen und nicht, wie auf den üblichen Ein-Prozessorsystemen, in Scheiben zerlegt nacheinander.



Neben den Echtzeit- und FPGA-Lösungen laufen LabVIEW-Applikationen seit LabVIEW 7 Express auch auf PDA's.

Es gibt sowohl für den Pocket-PC als auch für Palm OS ein entsprechendes LabVIEW Modul. Mit diesen Geräten sind eine Vielzahl an mobilen Applikationen möglich. Es wird standardmäßig die Kommunikation über IR oder Bluetooth angeboten. Die Pocket PC's bieten teilweise noch ein Carrier-Modul an, womit sich ein oder zwei PCMCIA-Karten betreiben lassen. Hier können die Datenerfassungs- oder CAN-Karten von National Instruments eingesetzt werden.

Diese gezeigten Beispiele illustrieren sehr deutlich die oberste Maxime der LabVIEW Entwicklung, die Wiederverwendbarkeit von Code. Es ist stets die gleiche LabVIEW Entwicklungsumgebung und es sind die gleichen VI's.

#### **Datenverarbeitung mit LabVIEW**

- Online Verarbeitung der erfassten Daten
- Unzählige Analysefunktionen
  - Statistik
  - Bestimmung von messtechnischen Größen (RMS, THD...)
  - Frequenzanalysen
  - Digitale Filterfunktionen
  - Mathematische Funktionen (Differentialgleichungen...)

ni.com



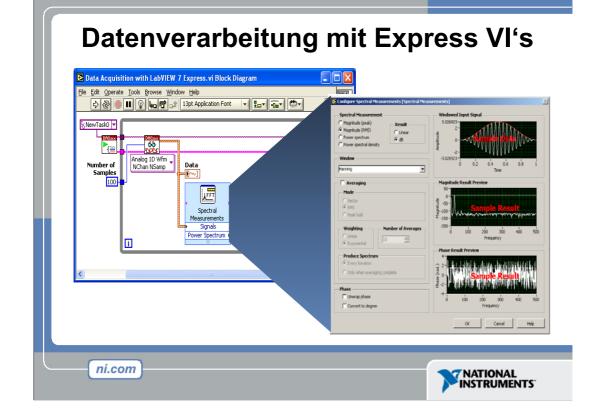
Gerade in der Datenanalyse kann LabVIEW seine Vorteile als Compiler ausspielen. Da der LabVIEW-Code kompiliert wird, können auch alle Analysefunktionen "online" betrieben werden. Im Bereich der Datenanalyse profitiert der Anwender von der ständig steigenden Leistungsfähigkeit der Prozessoren. War es vor zehn Jahren, auf einem 386er Prozessor, gerade mal möglich Daten mit 50KS/s kontinuierlich zu erfassen und gleichzeitig eine FFT über eine Blockgröße von 1024 Punkten zu berechnen, so kann man mit aktuellen Prozessoren die Daten mit 800 KS/s erfassen und über eine Blockgröße von 16.384 eine FFT kontinuierlich berechnen. Grundsätzlich kann die Blockgröße für die FFT beliebig groß werden, nur reicht dann die Zeit für die Berechnung nicht mehr bevor ein neuer Datenblock von der Datenerfassungskarte geliefert wird. Beim obigen Beispiel wird 49 mal pro Sekunde eine FFT über 16.384 Punkte gerechnet.

Das Spektrum der Analysefunktionen ist dabei nahezu unerschöpflich. Neben sehr einfachen Funktionen wie den statistischen Berechnungen wie Mittelwert, Standardabweichung und Histogrammfunktionen spielt die Bestimmung messtechnischer Größen eine zentrale Rolle. Es gibt hier Funktionen zur Bestimmung des Effektivwertes, Klirrfaktors oder es können beispielsweise die Pulsparameter wie Anstiegsgeschwindigkeit, Überschwingen, usw ermittelt werden.

Auch bei den Frequenzanalysen bleiben keine Wünsche offen. Neben der klassischen Fouriertransformation gibt es auch Hilbert- und Hartleytransformationen. Spezialitäten aus der Signalanalyse wie bspw. die Short-Time-FFT oder das Garborspektrogramm sind in zusätzlichen Toolkits enthalten.

Die digitalen Filterfunktionen beinhalten neben den Standard-Filtern wie Butterworth oder Chebyshev auch alle Möglichkeiten der FIR- und IIR-Filter. Auch hier gibt es über ein zusätzliches Toolkit die Möglichkeit der Filterauslegung.

Der Umfang der Mathematischen Funktionen reicht von der allgemeinen Algebra über spezielle Algorithmen zum Auffinden von Nullstellen bis hin zu Differentialgleichungen.

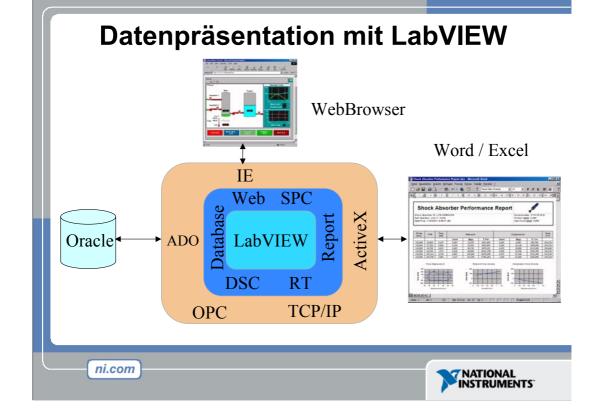


Die neuen Express-VI's die ab der LabVIEW Version 7.0 enthalten sind, erweitern die Skalierbarkeit um eine neue Dimension. Bislang war die Skalierbarkeit der Analysefunktionen auf die funktionale Ebene beschränkt, während nun mit der Skalierbarkeit der Anwenderfreundlichkeit eine neue Ebene eingeführt wurde.

Bei den neuen Express-VI's braucht nur noch das Eingangssignal verdrahtet zu werden, während die gesamten Parameter der Analyse im Express-VI selbst konfiguriert werden. Besonders hilfreich ist dabei, dass im Express-VI bereits das tatsächliche Messsignal zu sehen ist, und somit alle Einstellungen der Parameter sofort Einfluss auf das reale Messsignal haben.

Ein weiterer Vorteil der Express-VI's ist, dass häufig ein Express-VI viele unterschiedliche Analysen beinhaltet, die mit den herkömmlichen VI's durch viele unterschiedliche VI's abgebildet sind.

Letztendlich besteht jedes Express-VI aus ganz normalem LabVIEW-Code, der sich öffnen läßt und umgekehrt bietet das Express-VI-Development-Toolkit die Möglichkeit eigene Express-VI's zu erzeugen.



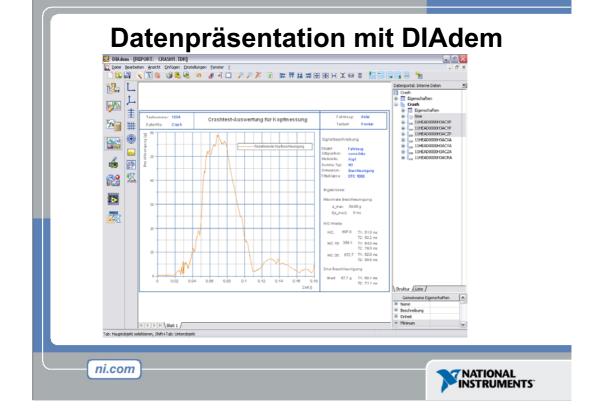
Zur Datenpräsentation gehört in LabVIEW neben der eigentlichen Darstellung der Benutzeroberfläche auf dem Monitor auch die Möglichkeit die Daten in einer Datenbank abzulegen, über ActiveX in ein Word- oder Excel-Dokument zu übertragen oder über einen Web-Server zur Verfügung zu stellen.

Dabei bedient sich LabVIEW stets den vom Betriebssystem bereitgestellten Standards. So nutzt das LabVIEW Database-Connectivty-Toolkit die standard ADO-Schnittstelle in Windows, um mit allen üblichen Datenbanken kommunizieren zu können.

Für den Datenaustausch mit Word oder Excel nutzt das Report-Generation-Toolkit von LabVIEW die ActiveX-Schnittstelle.

Da heutzutage immer mehr Anwendungen nach Web-Clients verlangen, hat LabVIEW hier mit der Remote-Panel-Funktion eine Möglichkeit geschaffen, um LabVIEW VI's in einem Webbrowser zu bedienen.

Weiterführende Datenpräsentationsfunktionen, wie bspw. skalierte Ausdrucke, werden mit dem Dokumentenbasierten System DIAdem realisiert.



Durch den Erwerb der Fa. GfS im Jahre 1999 konnte National Instruments sein Angebot im Bereich der Offline-Datenauswertung sowie Reportgenerierung mit dem DIAdem massiv erweitern.

DIAdem ist nicht nur ein sehr umfangreiches Offline-Datenanalyse-Werkzeug, sondern bietet auch sehr leistungsfähige Funktionen zur Reportgenerierung.

Gerade bei der Reportgenerierung kommt es neben einem Unterschriftenfeld häufig zu der Forderung nach skalierten Ausdrucken. Da DIAdem hier Papierseitenorientiert arbeitet ist diese Möglichkeit gegeben.

Die aktuelle Version 9.0 ist mit einem Datennavigator versehen, der das Auffinden der Daten in den unterschiedlichsten Quellen, wie Datenbank oder Filesystem, ermöglicht.

Der entscheidende Vorteil der DIAdem Datenverwaltung ist das Hinzufügen von Metainformationen, die eindeutige Aussagen über die Daten beinhalten.

Wer kennt nicht das Problem, dass kostspielig gewonnene Messdaten unbrauchbar herumliegen, da sich niemand mehr an die Versuchsbedingungen, Versuchsdurchführung, Datenformate, usw. erinnern kann.

Bei den Darstellungsformaten der Messdaten, läßt DIAdem keine Wünsche offen. Das schier unerschöpfliche Angebot reicht hier von zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen, horizontalen und vertikalen Balkendiagrammen, über Polardiagrammen bis hin zu Höhenliniendarstellungen.

Alle Funktionen aus DIAdem lassen sich mit VB-Script automtisieren.

Das DIAdem ist eine sinnvolle Ergänzung für jeden Messtechniker und sollte bei keinem Anwender fehlen.

Seit DIAdem zu National Instruments gehört, wurden viele Verknüpfungen zwischen LabVIEW und DIAdem geschaffen, so daß bspw. der Report aus einem LabVIEW Programm im Hintergrund mit DIAdem erstellt werden kann.

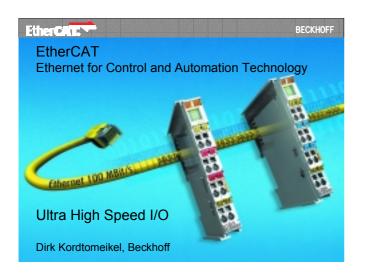
## Zusammenfassung

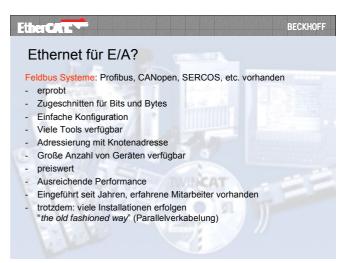
- LabVIEW bietet Möglichkeiten von der Simulation bis hin zur Datenpräsentation.
- Bei Datenerfassungsapplikationen gibt es Lösungen von Desktopanwendungen über RT bis hin zu FPGA und PDA
- Die Datenanalyse wird durch die neuen Express-VI's komfortabler
- Die Auswertung und Reporterstellung wird durch DIAdem sinnvoll ergänzt.

ni.com



## EtherCat Dirk Kordtomeikel Beckhoff

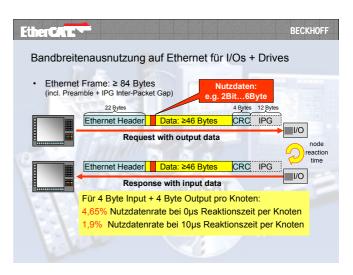








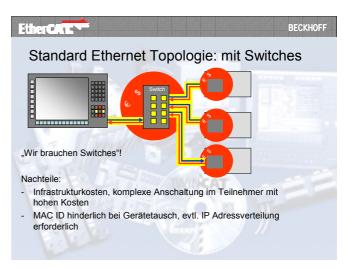




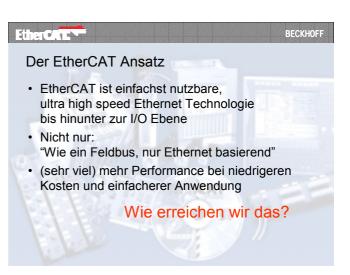


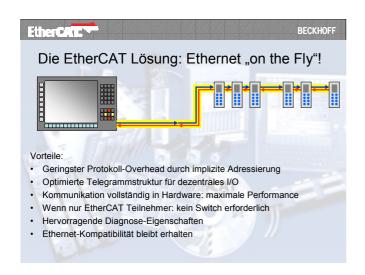


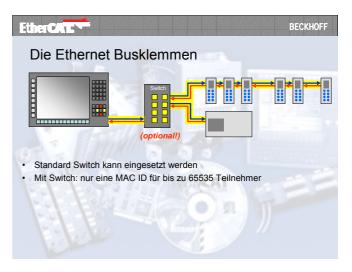


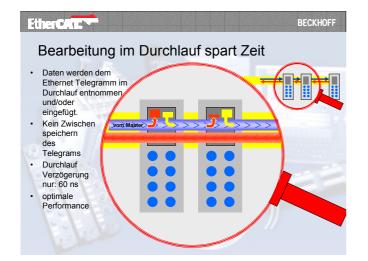




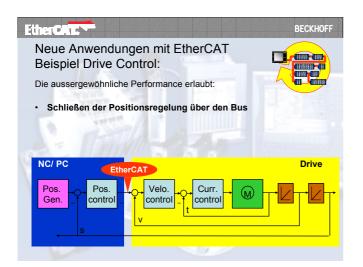


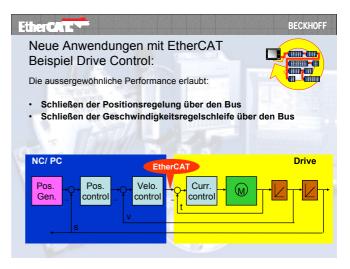


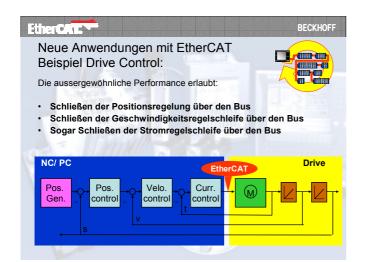


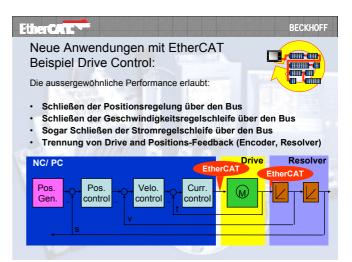


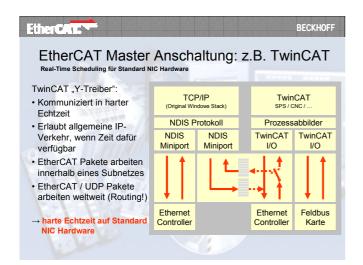


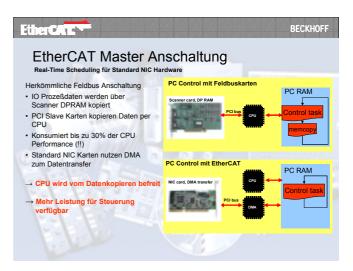


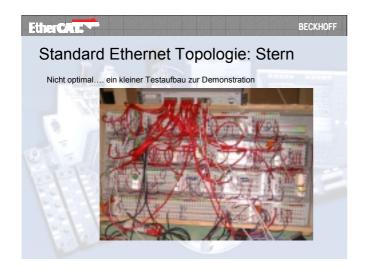


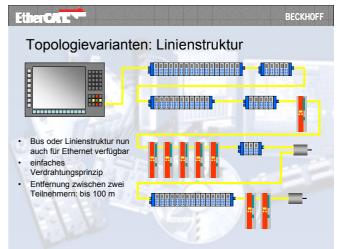


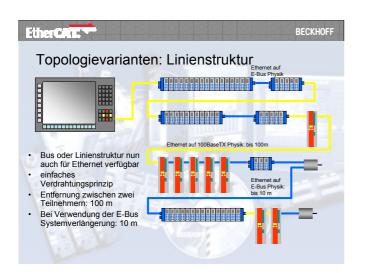


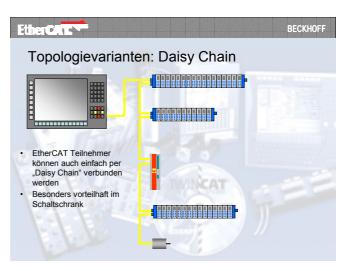


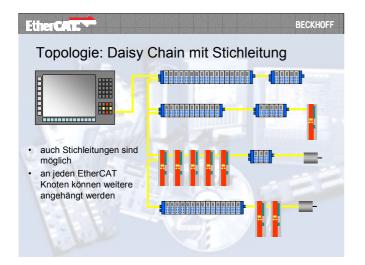


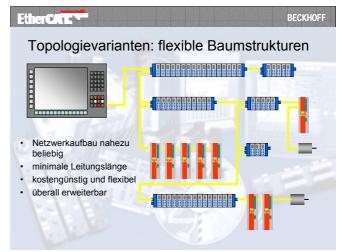


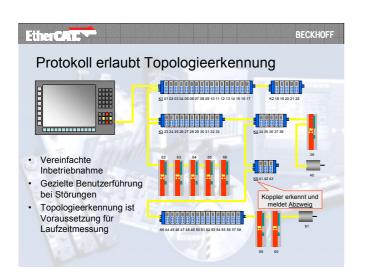




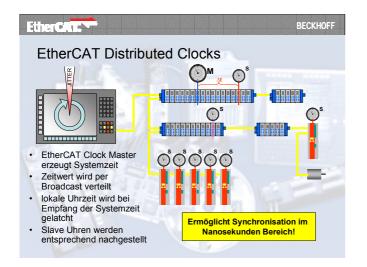


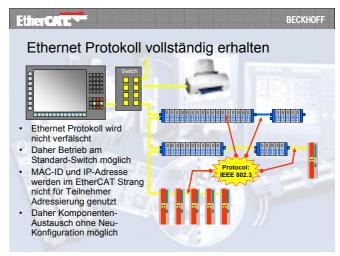


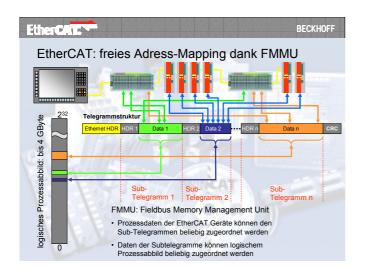


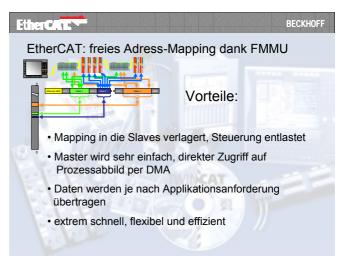


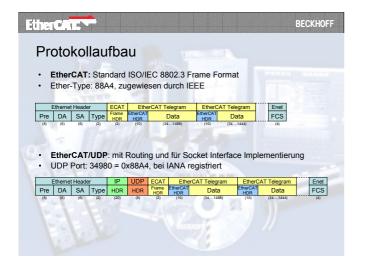


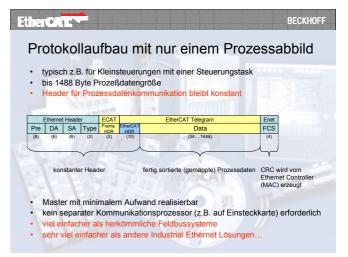


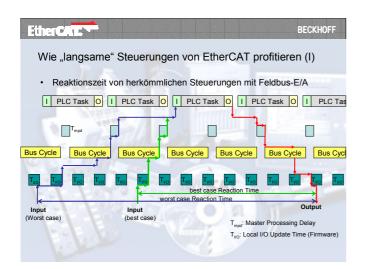


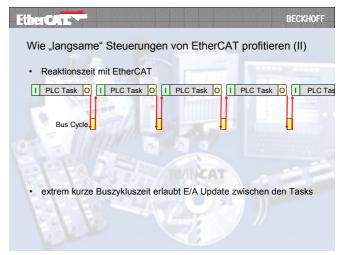


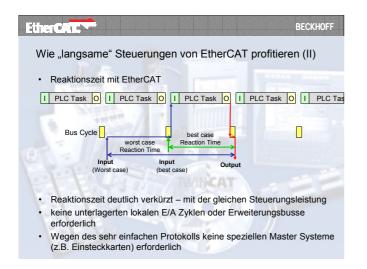




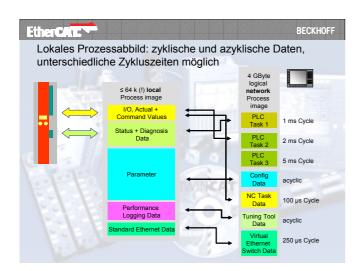


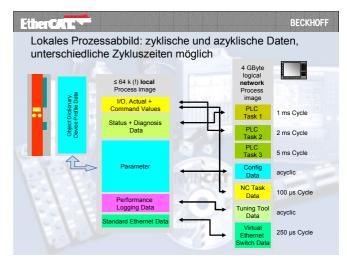


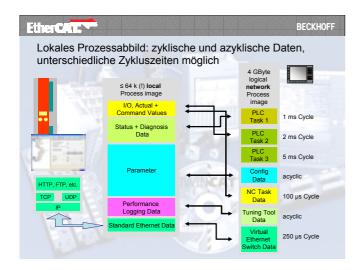


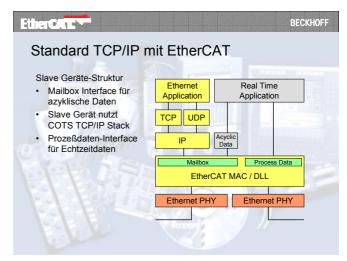


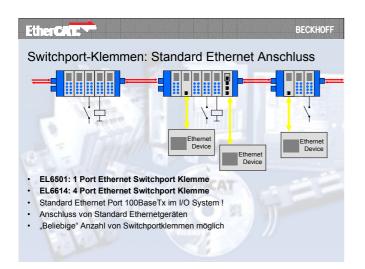


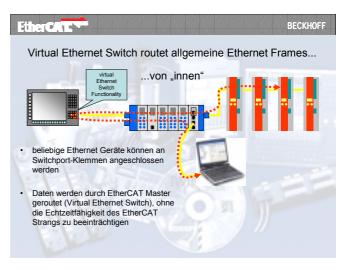


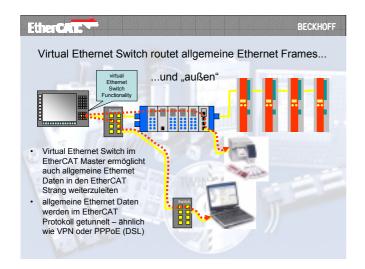


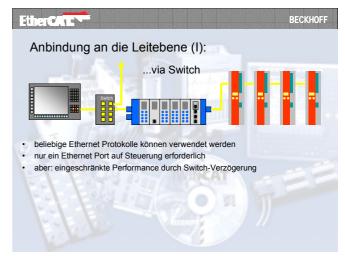


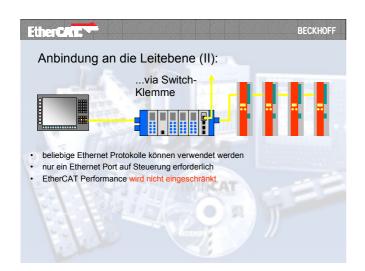


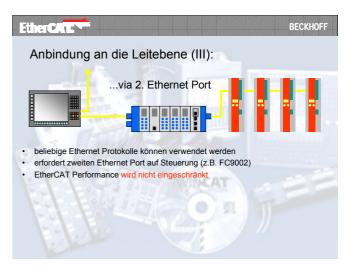


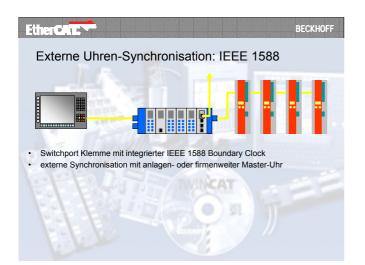


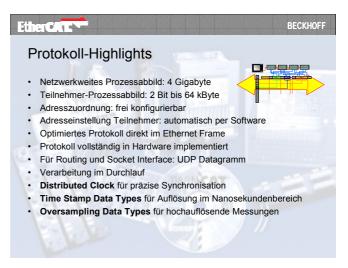


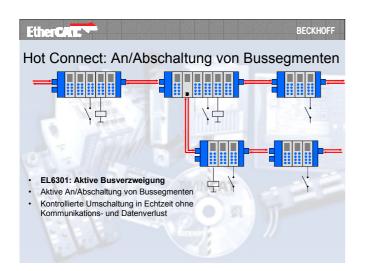


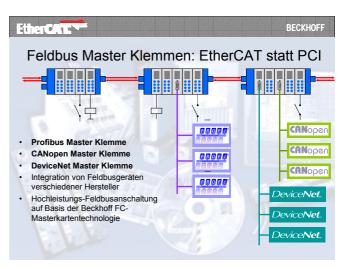


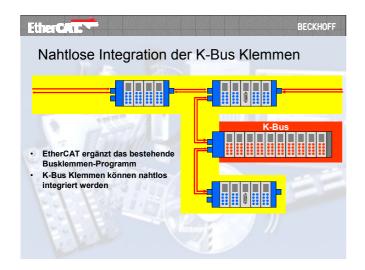


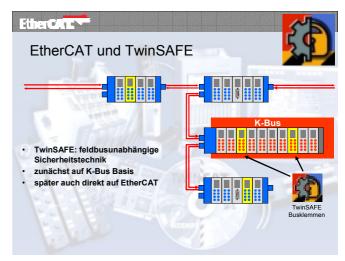


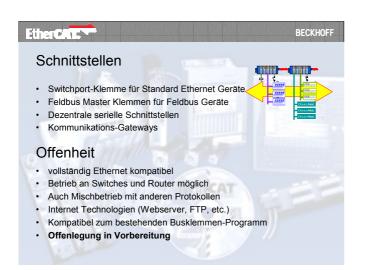






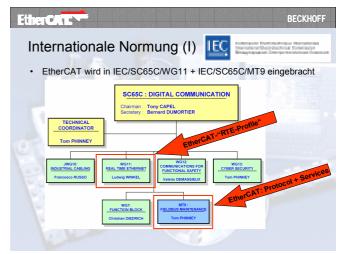








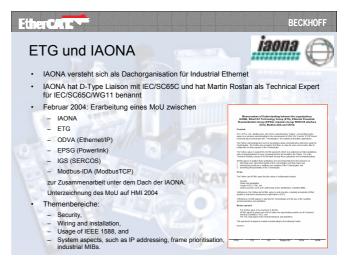


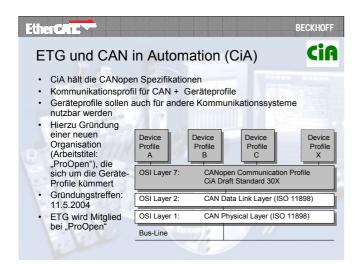


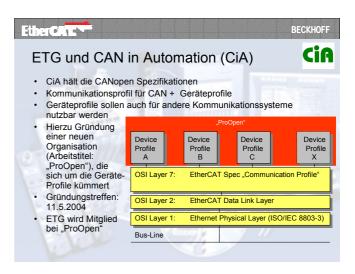


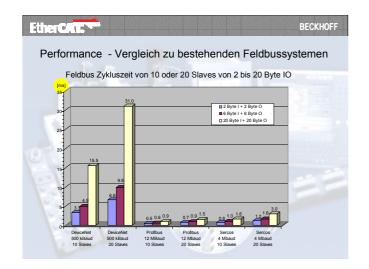


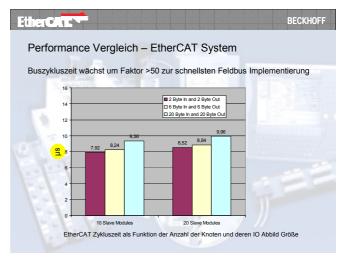


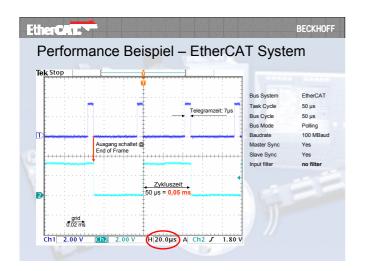


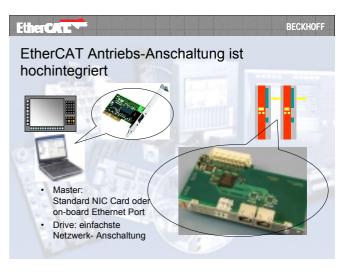


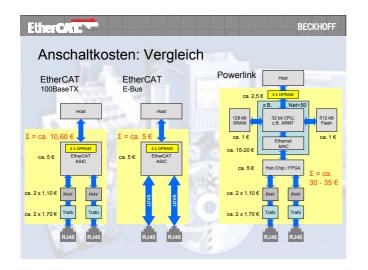


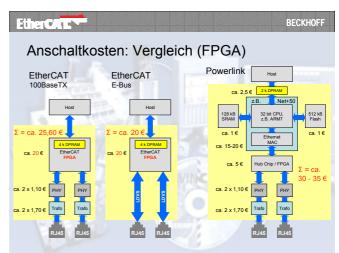






















# ETHERNET Powerlink SEI 30.03.2004

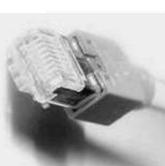


Wolfgang Schnurbusch, Lenze Drive Systems Leiter Automatisierungskomponenten und Industrielle Kommunikation



## **Warum Ethernet?**

- Einfacher Informationszugriff von Steuer- und Leitsystemen auf Automatisierungskomponenten
- Aufhebung der Trennung zwischen Office und Automatisierungsbereich
- Fernwartungsfähig für weltweiten Zugriff
- ► Einheitliche Kommunikationsstrukturen
- Einheitliche Verkabelungstechnik
- Weltweit akzeptierter Standard
- Nutzung der vielfach vorhandener Tools und Werkzeuge
- Zukunftssicher





# ... aber in der Automation muss gewährleistet sein:

- ▶ die industrielle notwendige Robustheit
- ▶ die Echtzeitanforderungen
- die einfache Handhabung bei der Projektierung und im Servicefall
- die einfache Integration von Systemen in die IT-Struktur des Endkunden
- der Zugriffschutz auf Daten



## ... und

- modulare autonome Module
- ► Zentrale- oder dezentrale Steuerungssysteme
- Flexibilität in der Systemfiguration



## gelöst mit Ethernet Powerlink

- Bereits erfolgreich im weltweiten Einsatz
- Hart Echtzeitfähig
- Einfache Handhabung
- Unterstützt Internet-Protokollsuite
- Integration von Basis-Zugriffschutzfunktion





## **Historie**

- ▶ Nov 2001 ETHERNET Powerlink von B&R eingeführt
- ► Apr 2002 Technologie geöffnet
- Nov 2002 EPSG Konsortium etabliert Hirschmann, Kuka Roboter, Lenze, B&R, ZHW
- Jun 2003 EPSG Verein gegründet Zusammenarbeit mit der CiA bzgl. CANopen vereinbart
- Nov. 2003 Verabschiedung des ETHERNET Powerlink Kommunikationsprofil V2.0 als Draft Standard Proposal
- ► Apr. 2004 Multivendoranlage auf der Hannover Messe Industrie



## **Offenheit**

- ► EPSG Verein mit derzeit ca. 30 Mitgliedsfirmen Stark wachsend
- Unabhängige Dienstleister (Stack/Hardware) IXXAT, SND, Hilscher, ZHW
- Kommunikationsprofil EPL V2.0 fertiggestellt. Basiert auf CANopen-Standards DS301 und DS302. Übernahme der Geräteprofilen von CiA (CANopen)
- ► EPL V2.0 ist zur internationalen Normung eingereicht (IEC SC65C WG1)





## Strategische Kooperationen





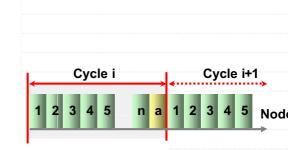


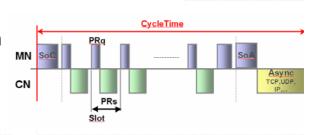
- CiA/CANopen:
  - ► EPL V2.0-Kommunikationsprofil basiert auf DS301; DS302
  - Gemeinsame Joint Task Force
  - Geräteprofile werden übernommen
- IAONA
  - Ethernet Harmonisierung
  - ► IEC Standardisierung
- ZHW
  - Geschäftsstelle
  - Dienstleistungen
  - Zertifizierung



- "Slot Communication Network Management" gesteuert durch zentralen Busmaster (Manageing Node)
- Direkter Querverkehr zwischen den Teilnehmern durch Multicast
- Synchronisierung per SoC
- Slot für asynchronen Kanal mit beliebigen Ethernet-Telegrammen (u.a. Internet-Protokoll Suite)
- Standard-Parametrierkanal auf Basis UDP/IP
- Basiert auf Standard-Ethernet (Komponenten, Werkzeuge usw.)

## Verfahren







# **EPL Verfahren Multiplexed Slots**

- Bandweitenoptimierung
  - ► Daten jeden Zyklus (z.B. Masterachse)
  - ► Multiplexed Daten (z.B. Slave-Achse)

    N Datentelegramme in M slots (N>M)
  - ► Ermöglicht eine verbesserte Lastverteilung

		Cycle i+2	Cycle i+3	
1 2 3 <mark>4 5 6 A</mark>	1 2 3 <mark>7 8 9 A</mark>	1 2 3 <mark>1011 A</mark>	1 2 3 4 5 6 A	Nodes
	2 3 4 5 6 A	2 3 4 5 6 A 1 2 3 7 8 9 A	2 3 4 5 6 A 1 2 3 7 8 9 A 1 2 3 1011 A	2 3 4 5 6 A 1 2 3 7 8 9 A 1 2 3 1011 A 1 2 3 4 5 6 A



## **Adressierung**

- ► EPL-Adressierung in V2:
  - EPL Node ID in EPL-Frames
  - EPL Node ID als IP-Adresse (192.168.100.EPL Node ID)
- Sehr einfache Adresseinstellung per Schalter möglich

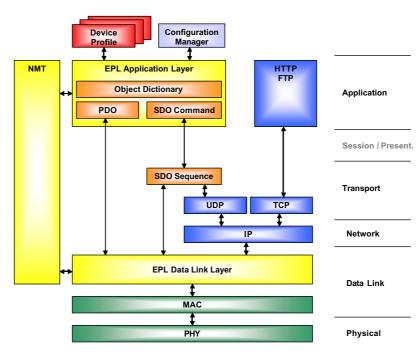


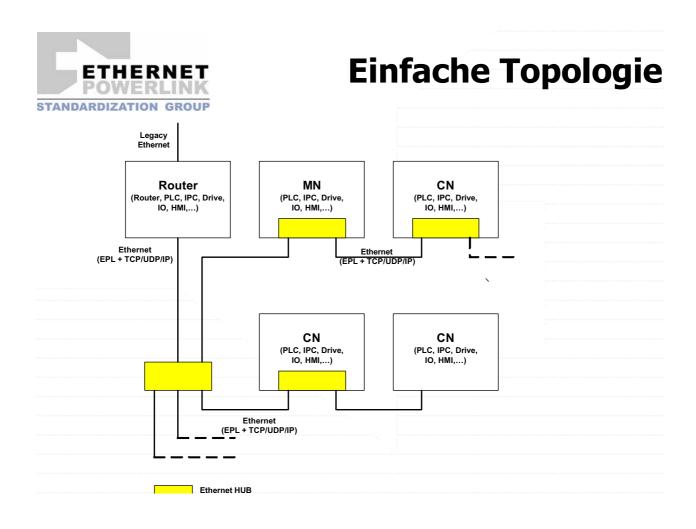
## **Harte Echtzeit**

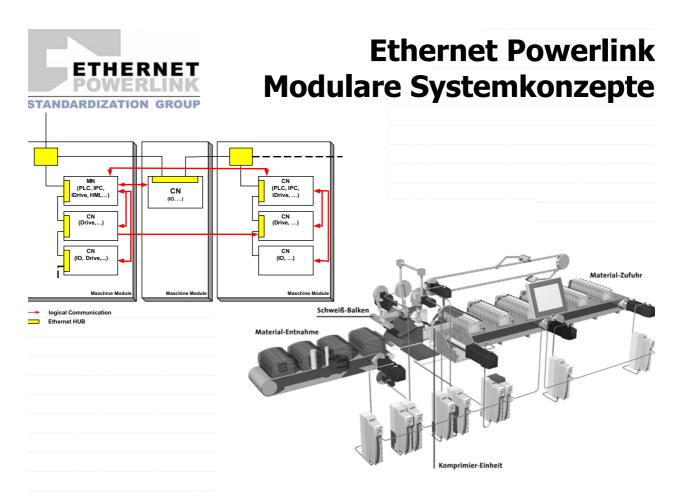
- ► Basiert auf Fast Ethernet
- Streng deterministisches System
- ► Zykluszeiten bis hinunter zu 200 µs
- ► Ultra Low Jitter bis hinunter zu < 1 µs

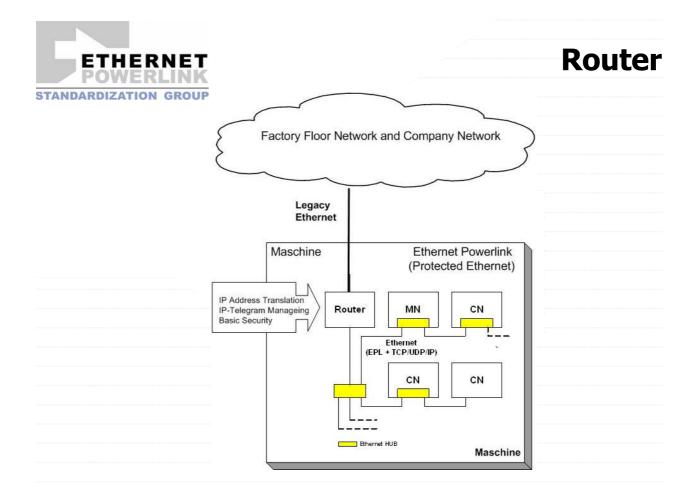


## **Stack-Architektur**











## **EPL Router**

► Trennung/Verbindung:

Trennung von geschützten und ungeschützten Ethernet. Verbindung durch IP-Routing

Adressumsetzung:

Anpassung der Maschinen IP-Adressierung an die IP-Adressierung des Endkunden (IT-Integration)

Security:

Basis-Schutz gegen unbefugten Zugriff in einer geschützten Umgebung



## **EPL Router Trennung/Verbindung**

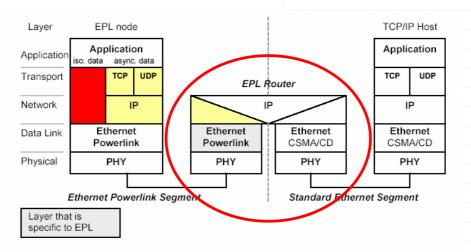
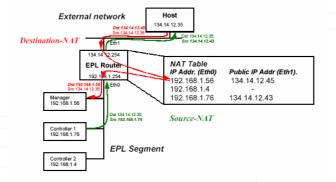


Fig. 96. EPL Router Reference Model



## **EPL Router Adressumsetzung**

▶ IP Adressumsetzung nach dem NAT-Verfahren.



## Vorteile:

- Systemhersteller ist unabhängig von der IT-Infrastruktur des Endkunden (IP-Adressbereiche)
- Anpassung nur an einer Stelle



## **EPL Router Security**

Basis-Security in der EPL-Spezifikation enthalten. Ansatz: Maschine befindet sich in einem relativ geschützten Umfeld z.B. in einem Fertigungsumfeld.

Basis Security durch Paketfilter

Data Link Layer Source MAC-Address

Network Layer Source/Destination IP-Address

**Protocol** 

Transport Layer Source/Destination Port

Weitergehende Sicherheitsmechanismen können durch Routerhersteller implementiert werden.

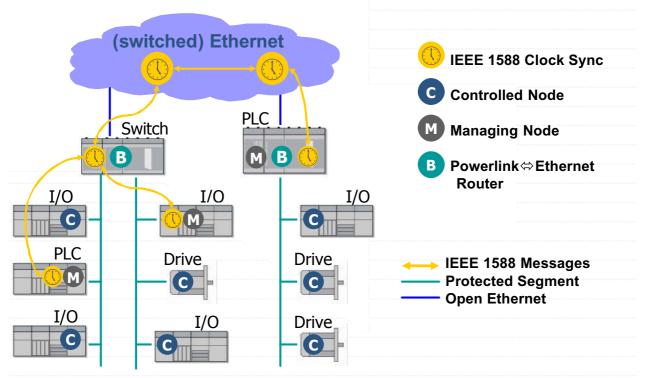


## **Einfachheit**

- Bekannte industrielle Infrastrukturkomponenten
- Einfache Adresseinstellung per Schalter
- Einfacher Gerätetausch (HotPlugfähig, Adresseinstellung)
- Einfache und klare Netzwerkdiagnose
- Einfache Projektierung und Vorinbetriebnahme von Modulen und Systemen
- Entkopplung zwischen Systemhersteller und IT-Abteilung des Endkunden



# Ausblick: IEEE 1588 Segment Synchronisation





# Zusammenfassung Warum ETHERNET Powerlink

- weil es auf IT-Standards basiert
- weil es "Hart-Realtime"-Anforderungen erfüllt
- weil es erprobt und zukunftssicher ist
- weil es einfach in der Handhabung ist
- weil es optimiert für modulare Systemarchitekturen ist
- weil es Basis-Zugriffsschutzfunktionen integriert
- weil es die Integration des Automatisierungssystems in die IT-Infrastruktur des Endkunden stark vereinfacht.



## **Herzlichen Dank**

## **Weitere Informationen unter**

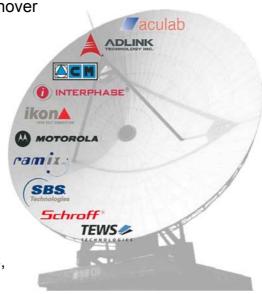
www.ETHERNET-Powerlink.org



## powerBridge Computer

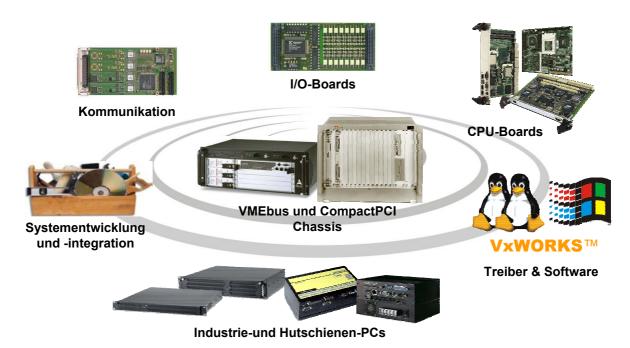
■ Gegründet 1993, Sitz in Burgwedel/Hannover

- Boards und Systemintegration für Applikationen in Luft- und Raumfahrt, Forschung, Industrieautomation, Telekommunikation und Telematik
- Führende Hersteller: Aculab, ADLINK, Interphase, Motorola Computer Group, RAMiX, SBS, Schroff, TEWS
- Produkte: Boards, Systeme, Systemintegration, Treiber, Protokolle, Betriebssysteme und OEM-Lösungen
- Standards: VMEbus, CompactPCI, PMC, IndustryPack und EBC





## **Boards & Systeme für Industrie und Forschung**







## Neue Standards für Bussysteme

#### PCI-X & PCI-Express

- Bandbreite heute bis 8 GB/s
- Abwärtskompatibel zu PCI
- Höhere Ausnutzung der PCI Brutto-Bandbreite
- Einheitliches System für Chip-zu-Chip Kommunikation

#### InfiniBand

- Bandbreite skalierbar von 2.5 bis 60 Gbit/s
- Geringe Latenzzeit (typ. 8μs)
- Anzahl der Nodes unbegrenzt
- Nicht blockierende Punkt-zu-Punkt Verbindungen

#### VME 2eSST

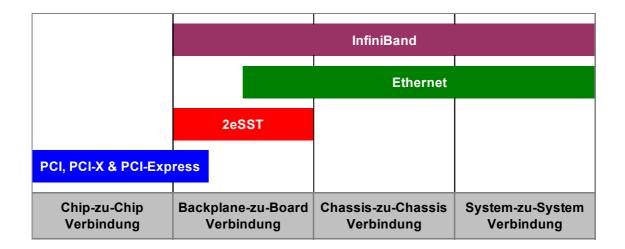
- Bandbreite 320 MB/s
- Abwärtskompatibel zu VMEbus und bestehenden Boards
- Kein SW-Protokoll-Overhead

**Neue Busstandards** 

PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## Einsatzgebiete für Bussysteme







## **PCI-Express**



- PCI-Express ist paket-orientiert und verwendet 1 bis 32 serielle Verbindungen mit jeweils 2.5 Gb/s Datenrate je Richtung
- Für 8 Bit Nutzdaten werden 10 Bit übertragen
- PCI-Express vereinheitlicht die I/O-Architektur für Grafik, Netzwerk, Massenspeicher..
- Erste Produkte in 2004 erwartet

PCI-Express Bandbreite					
PCI Express Lines	Bandbreite pro Stream	Bandbreite duplex			
1	256 MB/s	512 MB/s			
2	512 MB/s	1 GB/s			
4	1 GB/s	2 GB/s			
8	2 GB/s	4 GB/s			
16	4 GB/s	8 GB/s			
32	8 GB/s	16 GB/s			

PCI 32-bit Bus

PCI-Express x16

PCI-Express x1

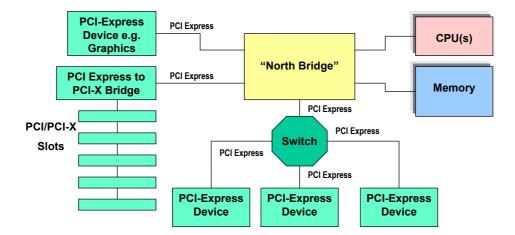


## **PCI-X** Standard





- PCI-X bietet bei 64-bit 33..133 MHz Bustakt zukünftig auch 266, 533, ...
- PCI-X 133 entspricht 1 GB/s Brutto-Übertragungsrate
- PCI-X wird bei neuen Board-Designs als On-Board Bus verwendet
- PMCX-Steckplätze (PMC-Modul + PCI-X) bringen hohe I/O-Performance

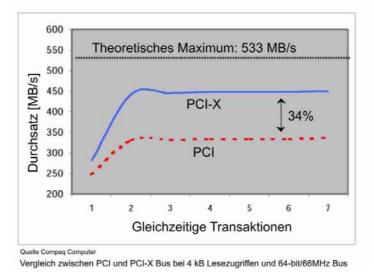


Neue Busstandards PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## **PCI-X** versus **PCI**

- PCI-X erlaubt Bus-Transaktionen zu Splitten wartende Prozesse blockieren nicht mehr den Bus – großer Vorteil für Multiprozessor-Systeme
- PCI-X hat eine optimierte Fehlerbehandlung ein "fehlerhaftes" I/O-Device kann nicht mehr das ganze System ausbremsen





## **PCI** Übersicht

#### Die aktuellen PCI und PCI-X Standards in der Übersicht

PCI-Versionen im Überblick							
PCI-Version	PCI 2.0	PCI 2.1	PCI 2.2	PCI 2.3	PCI-X-1.0	PCI-X-2.0	PCI-X-3.0
Max. Busbreite [Bit]	32	64	64	64	64	64	64
Max. Taktrate [MHz]	33	66	66	66	133	533	1066
Max. Bandbreite [GByte/s]	0,12	0,5	0,5	0,5	1	4	8
Slots pro Bridge	4	2	2	2	1	1	1
I/O Spannung	5 V	5 V/3.3 V	5 V/3.3 V	3.3 V	3.3 V	3.3 V/1.5 V	3.3 V/1.5 V
Einführung	1993	1994	1999	2002	1999	2002	2004

Neue Busstandards PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## **PCI-X** CPU-Boards



#### ■ cPCI-6840

- 6HE/4TE High-Performance Blade CPU-Board
- 1.6 GHz Pentium M, 2 GB ECC DDR
- VGA Grafik
- Zwei/vier serielle Ports, USB 2.0
- Zwei Gigabit Ethernet Ports
- Zwei 64-bit/100 MHz PMCX-Steckplätze
- PICMG 2.16 und 2.9 kompatibel

#### cPCI-6860A

- 6HE/8TE Dual-Prozessor System-Slot CPU-Board
- Zwei 2.4 GHz Low-Voltage Xeon® CPUs, 4 GB ECC DDR
- U320-SCSI, VGA Grafik
- Vier Gigabit und ein Fast Ethernet Port, 2.16 kompatibel
- Zwei serielle Ports USB 2.0
- PICMG 2.16 und 2.9 kompatibel







## Was ist InfiniBand

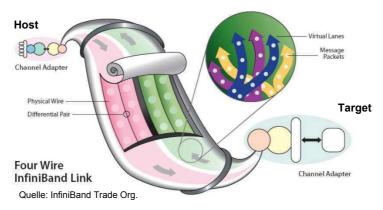


- InfiniBand ist ein "geswitchtes" Hochgeschwindigkeits-Netzwerk zur Kopplung von Rechnern und Massenspeichern
- Kapazität pro IB-Link 2.5..30 Gb/s Halb-Duplex und 5..60 Gb/s Voll-Duplex
- Aufbau als Switched-Fabric
  - Punkt zu Punkt Verbindungen
  - Nicht Bus-basiert Bandbreite muß <u>nicht</u> mit anderen Teilnehmern geteilt werden
  - "Unbegrenzte" Anzahl an Nodes (nur durch Größe des VC-Speichers begrenzt)
- InfiniBand Switches
  - Sehr geringe Latenzzeiten
  - Kein "Hub"
- InfiniBand Router
  - Verbindet IB-Subnetze
  - Lasttrennung
  - Schafft Übergänge in andere Netzwerke



## Was ist InfiniBand

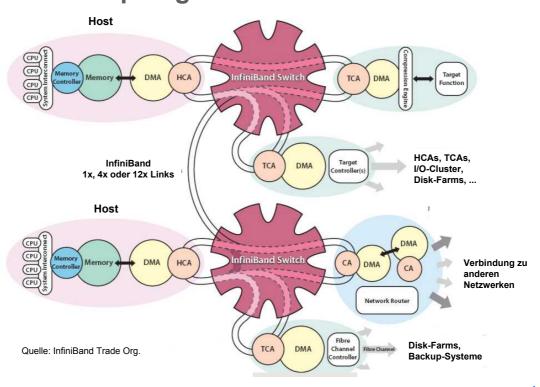
- Infiniband Adapter
  - HCA (Host Channel Adapter) = IB-Adapter am Hosts
  - TCA (Target Channel Adapter) = IB-Adapter an Massenspeichern, I/Os...
- Aufbau der Kupfer-basierten IB-Links
  - 100 Ohm Twisted-Pair Kabel mit doppelter Schirmung
  - 1..12 Aderpaare pro Übertragungsrichtung
  - Bis zu 16 virtuelle Verbindungen pro Aderpaar (davon 2 reserviert)



Neue Busstandards PCI-X, InfiniBand, 2eSST

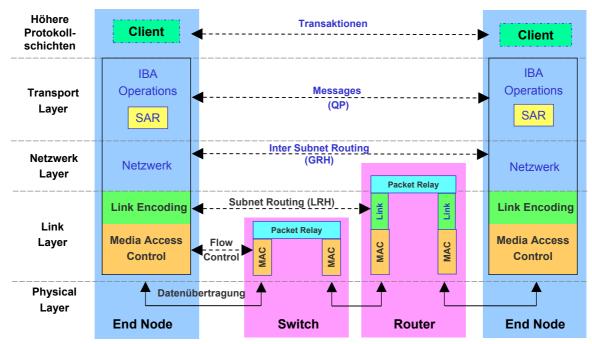


## **InfiniBand** Topologie





## **InfiniBand Layer-Modell**



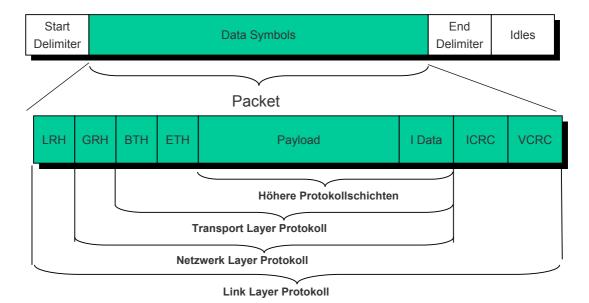
SAR = Segmentation and Re-assembly

Neue Busstandards PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## **InfiniBand** Datenpakete

- LRH = Local Route Header, GRH = Global Route Header, BTH = Base Transport Header, ETH = Extended Transport Header
- Payload = Bis zu 4096 Bytes, I Data = Immediate Data, ICRC = Invariant CRC, VCRC = Variant CRC





## InfiniBand höhere Protokollschichten

- TCP/IP over InfiniBand (IPoIB) mit IPv6 Adressierung
- Sockets Direct Protocol (SDP) Geringer Overhead und damit geringe CPU-Belastung
- SCSI Remote Protocol (SRP) TCA mit SCSI-Anschluss
- Message Passing Interface (MPI) Clustering Protokoll
- HIPPI Framing Protocol (FP) Bestandsschutz für bestehende HIPPI User



**Neue Busstandards** PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## InfiniBand Bandbreite und Kabel

#### IB-Bandbreite

InfiniBand	Datenrate Halb-Duplex		Datenrate Voll-Duplex	
Тур	Brutto	Netto	Brutto	Netto
IB 1x	2.5 Gb/s	250 MB/s	5 Gb/s	500 MB/s
IB 4x	10 Gb/s	1 GB/s	20 Gb/s	2 GB/s
IB 12x	30 Gb/s	6 GB/s	60 Gb/s	12 Gb/s

- Aktuell werden mit 4x InfiniBand ~ 800 MB/s erreicht der limitierende Faktor ist dabei der PCI-X Bus und nicht InfiniBand - IB-Adapter mit PCI-Express Interface sind in Entwicklung
- Im Vergleich bieten 10GigE ~500 MB/s (bedingt durch Kommunikations-Overhead) und Myrinet 320 MB/s
- Kupfer-Verbindungen
  - 4x Steckverbinder entspricht 10GigE
  - Maximal 20 m Kabellänge
- Glasfaser -Verbindungen
  - Multi-Mode Faser mit MPO Stecker
  - Maximale Kabellänge 300 m bei InfiniBand 4x
  - Maximale Kabellänge bei Mono-Mode bis zu 10 km







## InfiniBand Produkte



- Switches
  - 8 InfiniBand 4x Ports in 1HE Chassis
  - 24 InfiniBand 4x Ports in 1HE Chassis
  - 12..96 InfiniBand 4x Ports in 9HE Chassis
- PCI-X HCA 64-bit/66..133 MHz
  - Zwei 4x InfiniBand Ports
  - Verbindungsspeicher austauschbar (256 MB default)
- PMC HCA 32/64-bit/66..133 MHz
  - Zwei 4x InfiniBand Ports
  - 5..13 W Verlustleistung (Abhängig vom Durchsatz)
- Treiber
  - RedHat LINUX 7.3 verfügbar
  - Ab Q1/Q2 2004 : RedHat LINUX 9.0, VxWorks und IRIX





Neue Busstandards PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## InfiniBand Produkte



- Voll transparente Kopplung von PCI-Bussegmenten über IB-Link
- 2.5 Gb/s 1x InfiniBand LWL-Verbindung
- 64-bit/66Mhz Businterface
- Kein CPU-Overhead
- Verbindung zu Remote PCI, cPCI- oder VMEbus-Systemen

#### cPCI-to-cPCI/PCI Bridge over IB Fiber-Link

- Voll transparente Kopplung von PCI-Bussegmenten über IB-Link
- 2.5 Gb/s 1x InfiniBand LWL-Verbindung
- 64-bit/66Mhz Businterface
- Kein CPU-Overhead
- Verbindung zu Remote PCI, cPCI- oder VMEbus-Systemen

#### Infiniband Media Konverter

- 1x Kupfer-Infiniband zu Fiber-InfiniBand Konverter
- Multi-Mode und Single-Mode Version verfügbar
- ST LWL-Stecker
- 8..36 VDC Betriebsspannung











PCI-X, InfiniBand, 2eSST

## InfiniBand Anschlusstechnik



- InfiniBand 1x
  - 2.5 Gb/s
  - 2 Twisted-Pair Aderpaare





- InfiniBand 4x
  - 10 Gb/s
  - 4 Twisted-Pair Aderpaare
  - Stecker wie 10GbE





- InfiniBand 12x
  - 30 Gb/s
  - 12 Twisted-Pair Aderpaare

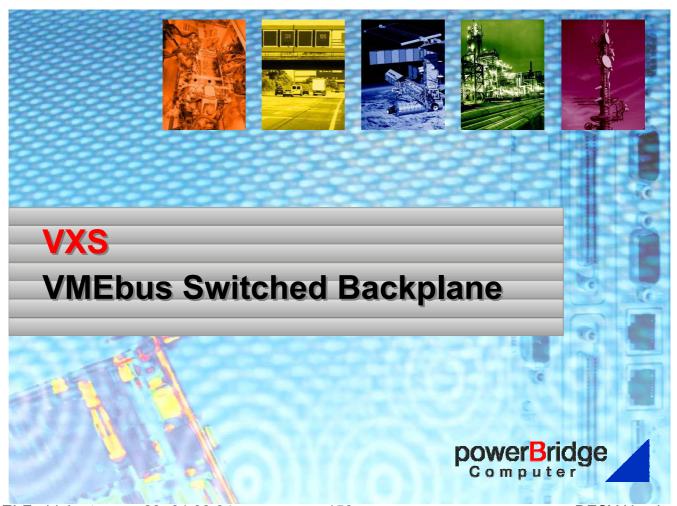


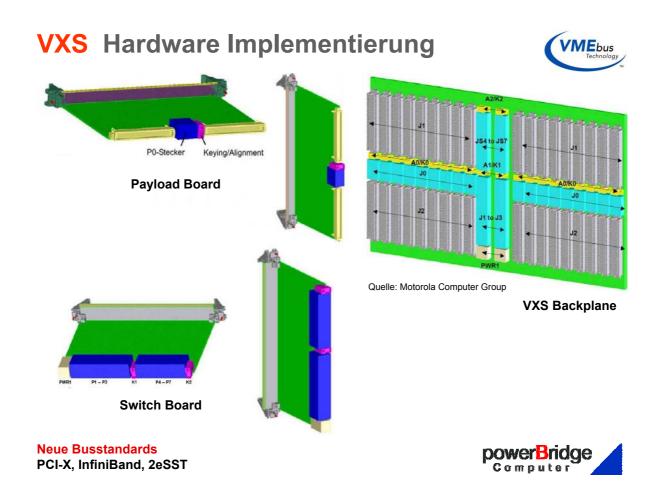


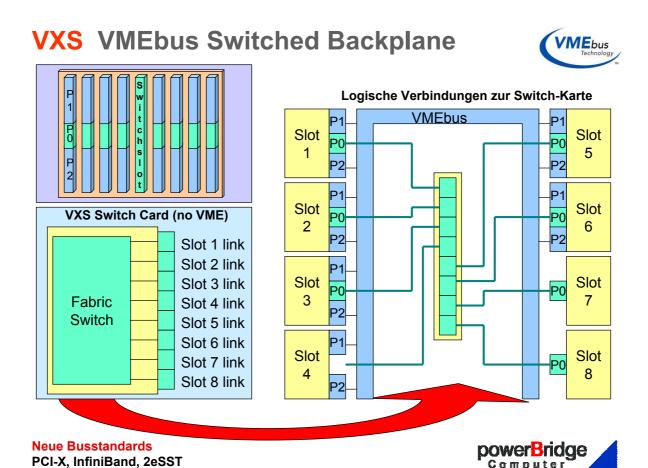
Neue Busstandards

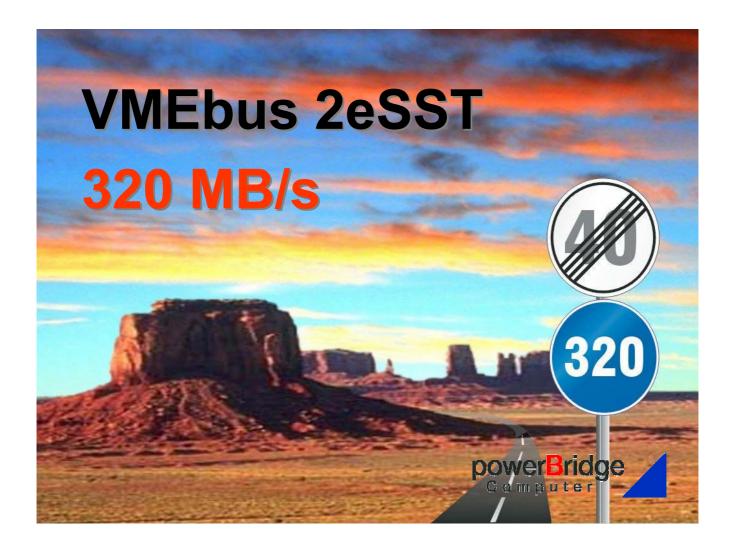
PCI-X, InfiniBand, 2eSST







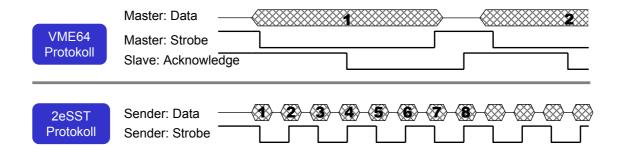




## **2eSST** Eigenschaften



- VMEbus 2eSST (Two edge Source Synchronous Transfer)
  - Bis zu 320 MB/s über bestehende Busplatinen real gemessen 305 MB/s
  - Mit angepassten Busplatinen werden h\u00f6here Datenraten m\u00f6glich sein
  - 2eSST ist kompatibel zu existierenden VMEbus CPU und I/O-Boards
  - 2eSST ist multimasterfähig und erlaubt weiterhin 21 VMEbus Steckplätze (ohne Bridges)
  - 2eSST Technologie und Chipsätze sind für alle Hersteller frei verfügbar

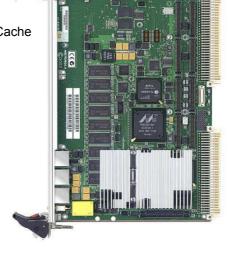




## MVME6100 VMEbus 2eSST CPU



- Key Features
  - 6HE/4TE High-Performance CPU-Board
  - 1.3 GHz MPC7457 PowerPC Prozessor
  - 32K/32K L1-Cache, 256K/256K L2-Cache, 2 MB L3-Cache
  - Bis 2 GB ECC DDR RAM
  - Zwei/vier serielle Ports
  - Zwei Gigabit Ethernet Ports
  - Zwei 64-bit/100 MHz PMCX-Steckplätze
  - Tempe 2eSST PCI-zu-VMEbus Bridge
- Software Support
  - LINUX
  - VxWorks
- Verfügbarkeit
  - Ab Mai 2004



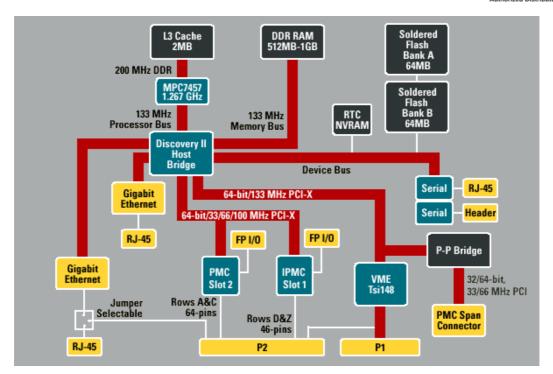
Neue Busstandards

PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## MVME6100 VMEbus 2eSST CPU









## cPCI & VMEbus Roadmap

April '04 Mai '04 Juni '04 Juli '04 Ende '04

#### **MVME6100**

- MPC7457 1.2+ GHz
- Discovery II + TempeDual GbE, Dual PMC
- Up to 2GB DDR RAM

#### **cPCI-6840**

- Pentium M 1.7 GHz
- 2 GbE, 2 PMC, PCI-X Up to 2GB DDR RAM

#### **CP9 / CR9**

- Pentium M 1.6 GHz
- 2 GbE, 2 PMC
- Up to 2GB DDR RAM

#### **VP9 / VR9**

- Pentium M 1.6 GHz
- 2 GbE, 2 PMC
- Up to 2GB DDR RAM

**Neue Busstandards** PCI-X, InfiniBand, 2eSST



7xxx

• MPC745x 1.5+ GHz

>= 2GB DDR RAM

 Discovery II + Tempe · Dual GbE, Dual PMC

## **Quellen und Links**

www.powerbridge.de

www.adlinktechnology.com

www.interphase.com

www.infinibandta.org

e-www.motorola.com

www marvell com

www.mcg.mot.com

www.pcisig.com

www.picmg.com

www.schroff.de

www.sbs.com

www.tews.com

www.vita.com

Stephan Hering

Marketing & Business Development

**Neue Busstandards** PCI-X, InfiniBand, 2eSST Datenblätter & Manuals zu cPCI und VMEbus Produkten

ADLINK CompactPCI und PCI CPUs, I/O-Boards und Chassis

Interphase Inc., PMC-Module, PCI und cPCI I/O-Boards,

cPCI Netzwerk Prozessor Boards

Infiniband Trade Organisation, InfiniBand Standards

Motorola Semiconductors, PowerPC CPUs

PowerPC Memory Controller Chipsätze

Motorola Embedded Computer Homepage

PCI Special Interest Group, PCI-Bus Weiterentwicklung

PCI Industrial Computer Manufacturers Group, PCI-Bus Standards

VMEbus und cPCI Chassis und Backplanes, Spezifikationen

SBS Technologies VMEbus und cPCI CPUs und I/O-Boards

TEWS Technologies, VMEbus CPUs, PMC und IP-Module,

VMEbus, cPCI und PCI Trägerkarten und I/O-Boards

VMEbus International Trade Association, VMEbus Standards

powerBridge Computer

Ehlbeek 15a • 30938 Burgwedel Tel: 05139 9980-0 • Fax: 05139 9980-49

powerBridge

#### Vertriebsleiter Telekommunikation stephan.hering@powerbridgfe.de thomas.holzapfel@powerbridge.de

Thomas Holzapfel











#### Standard Chassis

- RackPak VMEbus Chassis mit 5..20 Slots und Rear-I/O
- CompactPCI Chassis mit 2..21 Slots und Rear-I/O
- High-Available cPCI Chassis mit 12..16 Slots und Rear-I/O
- AC/DC Stromversorgungen 150..1500 W

#### Industrie-PCs

- Robuste Industriegehäuse mit PCI oder PCI-X passive Backplanes mit 2..15 Slots
- AC/DC Stromversorgungen 200..500 W, auch redundant

#### Kundenspezifische Chassis

- VMEbus Chassis mit 2..21 Slots
- CompactPCI Chassis mit 2..42 Slots
- CompactTCA und AdvancedTCA Chassis
- OEM-Chassis mit Single-Board Controllern
- Für erhöhte Anforderungen bei Schock- und Vibrationsfestigkeit, Betriebstemperaturbereich, EMC/EMV, ...







#### **Neue Busstandards**

PCI-X, InfiniBand, 2eSST

## **CPU-Boards**













- Architekturen: Intel X86, VIA-C3, PowerPC, 68K, MIPS, StrongARM, TMS320, Shark, Winpath, C-5, ...
- Standards:
   CompactPCI, CTCA, VMEbus,
   PCI-Bus, ProzessorPMC, EBC, ...
- Ausführungen: Standard, industrieller oder erweiterter Temperaturbereich, Conformal Coating, Wedge-Locks, ...





#### I/O-Boards







- Standards: VMEbus, CompactPCI, PCI, PMC- und IndustryPack-Module
- Ausführungen: Commercial, Industrial, Ruggedized
- I/O-Funktionen: Über 300 verschiedene Module
  - Analog-I/O, Digital-I/O, DRAM, EIDE, Flashdisk, Flash-Speicher, IP-Trägerkarten, Grafik & Video, Motorcontroller, PC-Card, PCMCIA, PMC-Trägerkarten, Prozessor PMCs, Quadraturdecoder, RAID, SCSI, RS170, RS343, SERCOS, Signalprozessoren, SDRAM-Speicher, Synchro/Resolver, Test- und Display, Video Frame-Grabber, Zähler
- Kundenspezifische I/O-Lösungen: Anpassung/Entwicklung





**Neue Busstandards** PCI-X, InfiniBand, 2eSST



## Kommunikations-Boards OINTERPHASE COMPIES







- Standards: VMEbus, CompactPCI, PCI, PMC- und IndustryPack-Module
- Ausführungen: Commercial, Industrial, Ruggedized
- Über 200 verschiedene Module:
  - ARCNET, ARINC, ATM, CAN Bus, E1/T1, E3/T3, EIDE, Fibre Channel, FireWire, Fast und Gigabit Ethernet Adapter und Switches, GPIB IEEE488, Infiniband, Interbus, LON, MIL-STD-1553, Profibus-DP, Prozessor-PMCs, RAID, SCSI, SERCOS, serielle Ports, Switches
- Kundenspezifische I/O-Lösungen: Anpassung/Entwicklung







#### Industrie-PCs



- Slot-CPU Karten mit VIA-C3, Pentium III, Pentium 4, Banias, Xeon CPUs ...
- Einbaumöglichkeit für Floppy, CD/DVD und Festplatten
- AC/DC Stromversorgungen 200..400W (optional redundant)
- 1HE, 2HE oder 4HE Chassis mit 2..15 Steckplätzen
- Passive Backplane mit PCI- oder PCIX-Bus
- Optimierte Luftführung







Neue Busstandards PCI-X, InfiniBand, 2eSST



#### **DIN-Rail PCs**





- Low-Power AMD Geode, VIA-C3 oder Pentium-III CPUs
- Einbaumöglichkeit für Floppy, CD/DVD und Festplatten
- AC/DC Stromversorgungen
- PMC/PC104 Steckplätze





Neue Busstandards PCI-X, InfiniBand, 2eSST



### Software/Dokumentation

- Unterstützte Betriebssysteme
  - LINUX, embedded LINUX
  - OSE
  - Microware OS-9
  - VxWorks
  - Windows NT/2000/XP, Embedded NT/XP
- Treiber/Support
  - BSPs
  - Treiber, Source Code
- Dokumentation
  - Datenblätter / Handbücher
  - Literatur
  - Schaltungs- und Wartungsunterlagen







Neue Busstandards

PCI-X, InfiniBand, 2eSST





### SEI

DESY-Hamburg march 29 to 31rst,2004

acqiris



### **Acqiris market today**

- Single/Dual channel applications
  - Served with PCI digitizer cards
- Large multi-channel systems
  - Up to several hundreds of channels
  - Covered with Compact-PCI digitizers
- Digitizers with Real Time Data processing (FPGA's)
  - Averagers, Pak Detectors in PCI
  - Analysers and Data Streamers in cPCI



### **DPxxx** Serie

#### **DP235**

2ch, 500MHz, 0.5-1 GS/s,
 128-256K, 2-4 Mpoint opt.

#### **DP240**

2ch, 1GHz, 1-2 GS/s, 128-256K, 8-16 Mpoint opt.

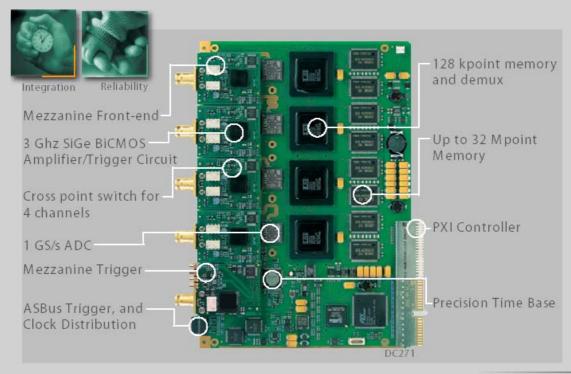


acqiris

----



### **Highly Integrated Technology**





### V-Class product family features

- Highest BW and SR in cPCI/PXI using SiGe technology
- Most compact design thanks to proprietary ASICs
- Lowest Power rating (<45 W) vs. Performance in modular platform
- 1 GHz Auto-Synchronous Bus (ASBus) for synchronizing clocks and triggers over multiple cards
- Unique "Control I/O" in/outputs for trigger in/out, clock in/out, many oher functions





### **DPU Technology and Next Generation**

- Increase measurement throughput
- Help capturing rare events



- [1.5, 2] GHz bandwidth
- 8-bit low power or 10-bit ADC with SR of 2 GS/s
- MAC200
- COS201
- Optional memory mezzanine up to 256 MS/ch
- Data transfer up to 64 bit and 66 MHz



### One size does not fit all...



acqiris



# Remote Control with the Instrument Server Remote Control Over LAN

- Control multiple systems from the same computer
- Easy to go over long distances





### A new Stand Alone Multichannel Acquisition System

#### Its aim:

- Bring a useful solution to multichannel data acquisition applications not well served by digital oscilloscopes
- Cover applications requiring from 8 to 16 channels
- No need to write software to use Acqiris digitizers
- Remote Operation
- Multiclient

acqiris



### A Bench Top, Stand Alone Multichannel Acquisition System that brings:

#### Unprecedented flexibility

- Modular concept permits the mixing of digitizers with sample rates from 500MS/s to 4GS/s, and resolutions from 8 bits to 12 bits
- With ASBus, all modules in the system are grouped in a single instrument with all channels synchronized (instruments of identical sample rates and resolution)
- A client server mode permits the remote control and display of the system from any PC on the network.
- Multiple user capability
- An Ethernet connection to your lap top can be used for portable applications



### A Bench Top, Stand Alone Multichannel Acquisition System that brings:

#### Small Size and low Power

- 5 slots cPCI crate housing up to 16 channels
- Typically less than 60 watts per 4-channels module

#### Ease of setting up multi-channel systems

- An EXCEL table facilitates the setting of all data acquisition parameters
- A tune mode is provided to troubleshoot unknown signals and facilitate the entry of acquisition parameters
- A system configuration graphic provides for an accurate identification of displayed channels versus instrument-channel-cable.

acqiris



# A Bench Top, Stand Alone Multichannel Acquisition System that brings:

#### Centralized control, comparison and analysis of multiple traces on a single display

- All traces can be displayed on a single, large and high resolution display
- Easy drag and drop selection of traces to be displayed and compared
- Bridge toward MATLAB® for data analysis

#### Eases budget constrains

- Scalable with time (system size and types of digitizers)
- Permits acquisition of sub-systems over budget periods
- Start small and end up with a large multipurpose system



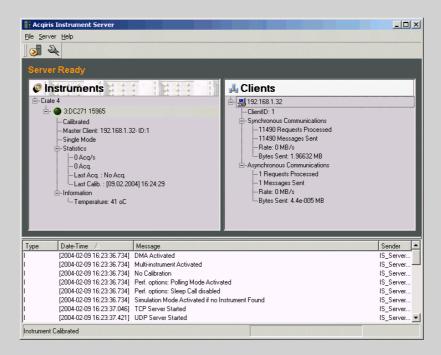
### acqirisMAQS



acgiris



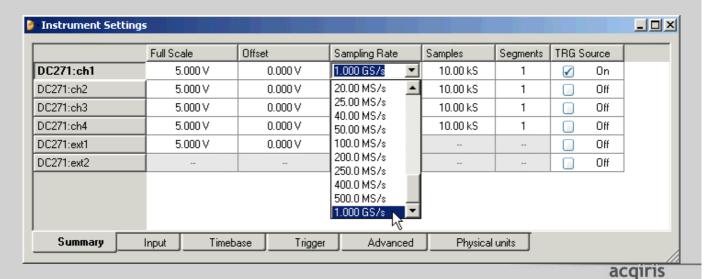
### **Client Server**





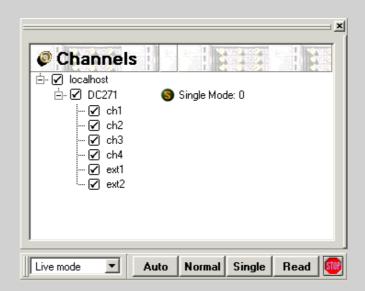
### **Instruments settings**

- Tabular (intuitive, best for large number of channels)
- Convenient value edition
- Fully customizable



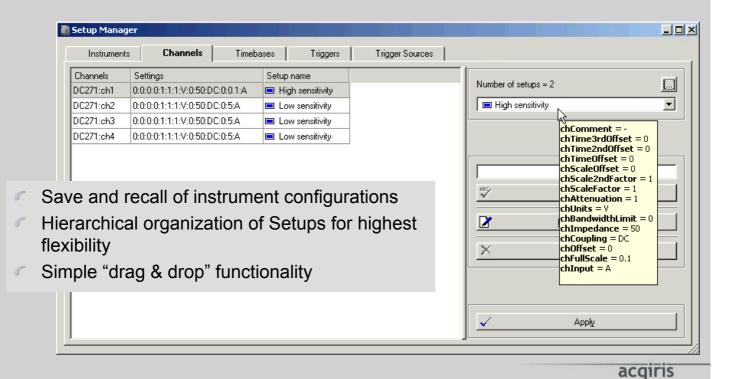


### **Run Control**



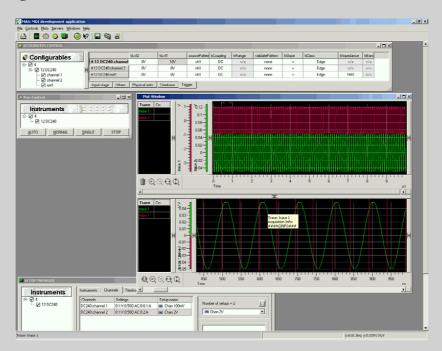


### **Setup Manager**



years Spirit of Acqiris

### **Display Ctrl**





## Messung des Echtzeitverhaltens von Simatic S7 Steuerungen im Kontext physikalischer Experimente

H. Kleines<sup>1</sup>, J. Sarkadi<sup>2</sup>, F. Suxdorf<sup>1</sup>, K. Zwoll<sup>1</sup>
<sup>1</sup>Zentrallabor für Elektronik (ZEL), Forschungszentrum Jülich
<sup>2</sup>Institut für Kernphysik (IKP), Forschungszentrum Jülich

- Einsatz von SPSen in Experiment-Kontrollsystemen im FZJ
- Programmiermodell für Siemens S7 Steuerungen
- Messungen des Echtzeitverhaltens von S7 Steuerungen

### SPSen in Experiment-Kontrollsystemen

- SPS-Technik etabliert in Infrastruktur-Systemen
  - niedriger Preis (Massenmarkt!)
  - Robustheit
  - langfristige Verfügbarkeit und Support vom Hersteller
- Zunehmende Verwendung in Experiment-Kontrollsystemen
  - Sicherheitsanforderungen
  - Leistungsfähige Entwicklungswerkzeuge
  - Kommunikationsfähigkeit => dezentrale Architektur
  - Echtzeit-Fähigkeit
- Weltmarkt wird durch wenige Anbieter dominiert:
  - Siemens (Marktführer, > 30 %)
  - Rockwell Automation (Allen Bradley)
  - Mitsubishi/Omron, GE Fanuc
  - Schneider Group (Modicon, Telemecanique)
- Standardisierung: IEC1131



### SPS-Familie Simatic S7

#### Ethernet, MPI, PROFIBUS

high end: S7-400



mid range: S7-300



OP + S7-300: C7



SoftSPS: WinAC



#### PROFIBUS + AS-Interface

#### Dezentrale Pheripherie: ET200L, ET200S,.....

mini: \$7-200







mini: IM151/CPU

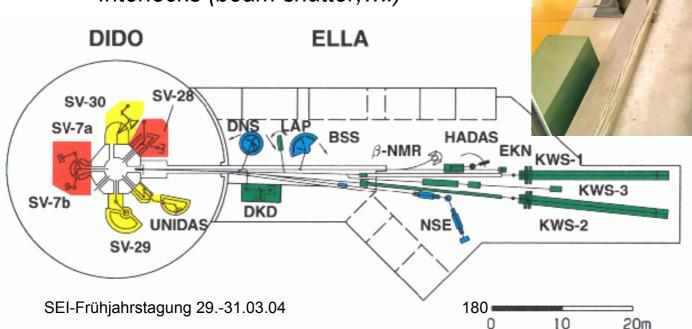


**AS-Interface** 

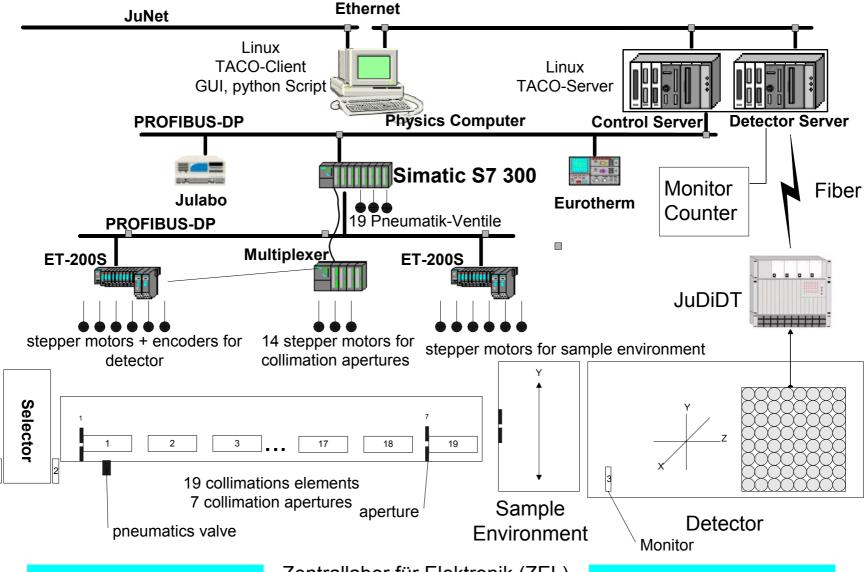
- Homogene, leistungsfähige Programmierumg.: Step7 (AWL, KOP,FP, SCL...)
- Modularität, Skalierbarkeit, Ausbaufähigkeit
- Leistungsfähige Kommunikation => Verteilte Systeme

### Beispiel 1: KWS1 (Neutronenstreuung)

- Kleinwinkelstreuanlage am FRJII
- Jülich-Münchener Standard:
  - Middleware: TACO (Linux)
  - Anwendungsschicht: Scripting + GUI
- Front-End: vollst. SPS-gesteuert
  - Ca. 25 mechanische Achsen
  - Vakuum System
  - Interlocks (beam shutter,....)

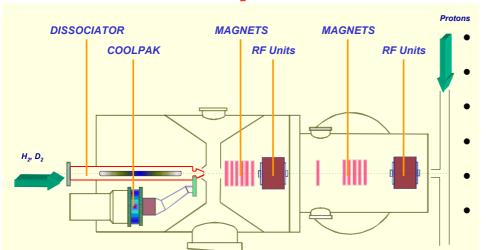


### Architektur des Kontrollsystems der KWS1





### Example 2: Atomic Beam Source

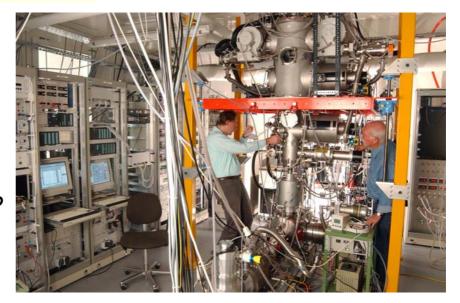


internes Gas-Target an ANKE (COSY) polarisierter Atom-Strahl(H oder D)

- Dissoziation durch Plasma-Entladung
- Polarisation durch inhomogene Felder
- Integrierte Diagnostiken (Polarimeter,..)
- ~ 10000 Prozess-Signale

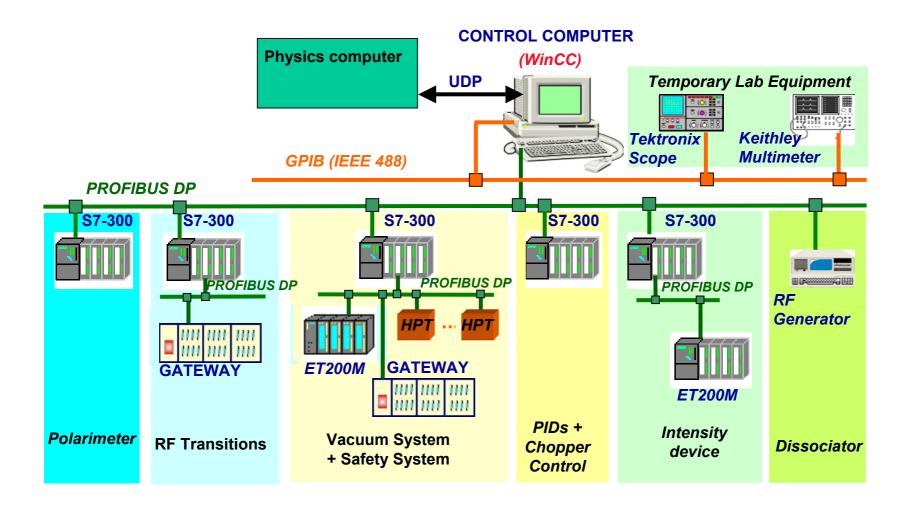
#### Architektur

- Leitrechner: PC mit Windows 2000
- SCADA: WinCC
- SPS-basiertes Frontend
- Kommunikation: PROFIBUS DP





### Architektur des Kontrollsystems der ABS





### RT Programmier-Modelle

### Asynchrone (parallele) Programmierung (POSIX)

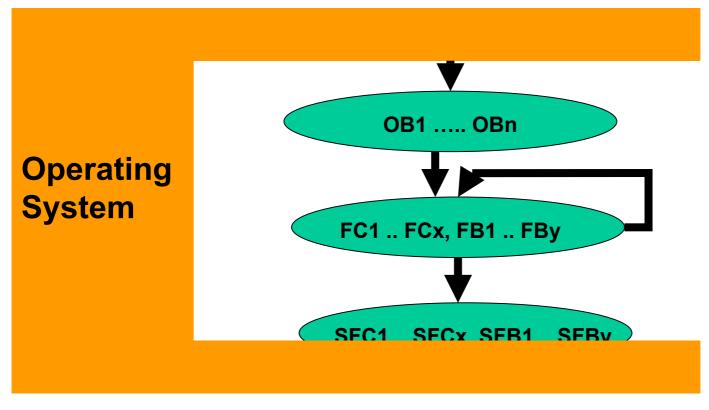
- Scheduling von Tasks während der Ausführung ("Marktwirtschaft")
- Ereignis-getriggered
- Quasi-parallele Ausführung von Tasks auf der Basis von Prioritäten
- Zeitlicher Ablauf der Programm-Ausführung intransparent

  Determinismus kann durch niederpriore Tasks verletzt werden

### Synchrone Programmierung (SPSen)

- Scheduling von zyklischen Tasks vor der Ausführung ("Planwirtschaft")
- Zeit-getriggered
- Tasks werden auf der Basis ihrer Scheduling-Zeit definiert
- Programmstruktur ist nicht konsistent mit der logischen Struktur Erhöhter Planungs-Aufwand

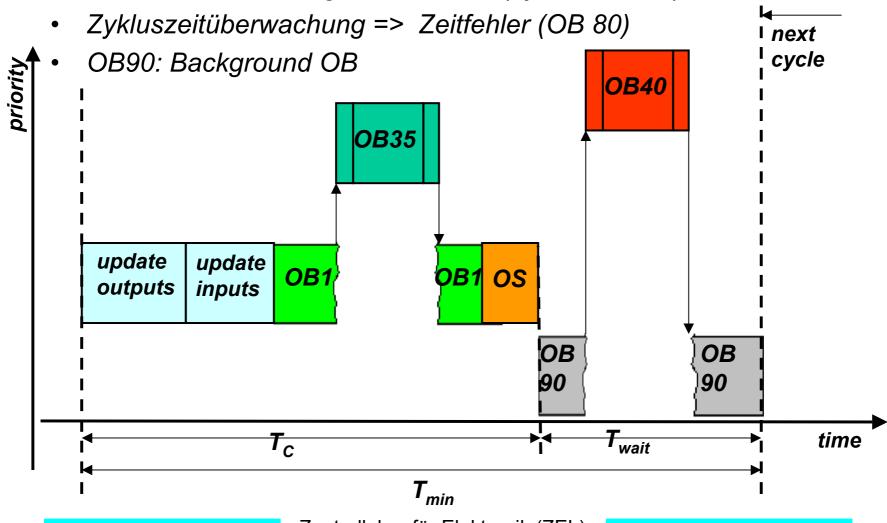
### Simatic S7 Programmier-Modell,



- OB: Organisations-Block (Scheduling-Objekt)
- FC: Funktion (vom Programmierer definiert)
- SFC: Systemfunktion ("system call")
- FB/SFB: FC/SFC mit statischen Daten ("instance data block")

### Freilaufender Zyklus

• "Standard" SPS-Programm in OB1 (zyklischer OB)





### OB-Typen

Uhrzeitalarme	OB10,,OB17
Verzögerungsalarme	OB20,,OB23
Weckalarme (zyklisch)	OB30,,OB38
Prozessalarme	OB40,,OB47
Multicomputing Alarm	OB60

Mullicomputing Alarm

OB80,..,OB87 Asynchron-Fehler

Anlauf OB100, OB101

Synchron-Fehler OB121,OB122

- Priorität steigt mit der Nummer des OB
- Prioritäten änderbar nur in WinAC und S7-400
- Verfügbarkeit von OBs abhängig vom CPU-Typ



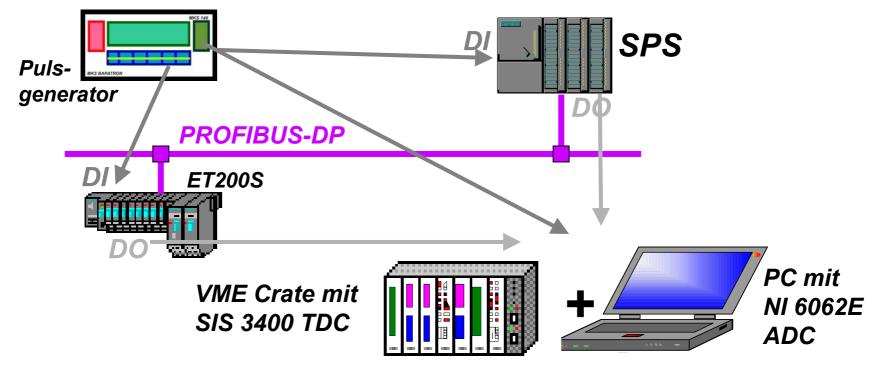
### Ziele der Leistungsbewertung

- "Rechtzeitigkeit":
  - T<sub>C</sub>: Zykluszeiten: frei laufender Zyklus OB1 konstanter Zyklus OB35
  - T<sub>R</sub>: Reaktionszeit auf externe Ereignisse => OB40 (HW)
- Determinismus
  - Jitter der obigen Metriken
- Verteilte Struktur von SPS-Systemen
  - zusätzliche Kommunikations-induzierte Delays (PROFIBUS)
  - zusätzlicher Kommunikations-induzierter Jitter
- Skalierbare SPS-Familie
  - Analyse unterschiedlicher SPS-Typen
- Externe Last: nicht relevant für SPS-Systeme



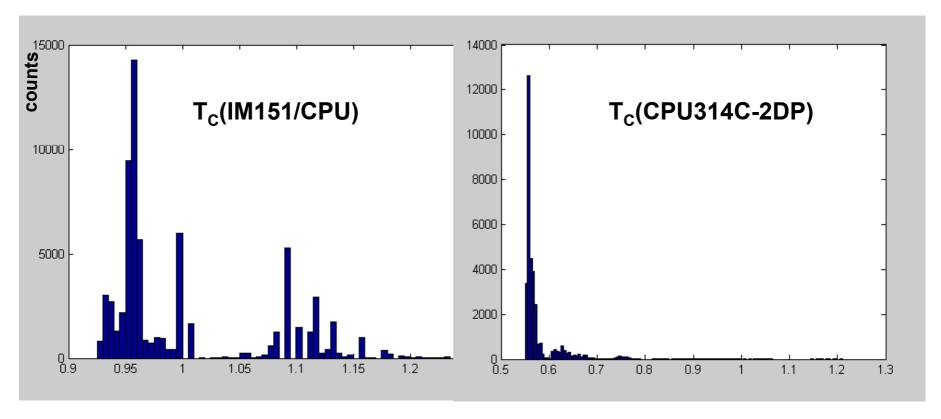
### Mess-Szenario

SPS	IM151/CPU	CPU314C- DP	CPU412-2	CPU 414-1
T(float addition)	~42 µs	~4 µs	~0,6 µs	~0,7 µs
Cyclic Interrupts	OB35	OB35	OB32,OB35	OB32,33,34,35
HW Interrupts	OB40	OB40	OB40,OB41	OB40,41,42,43





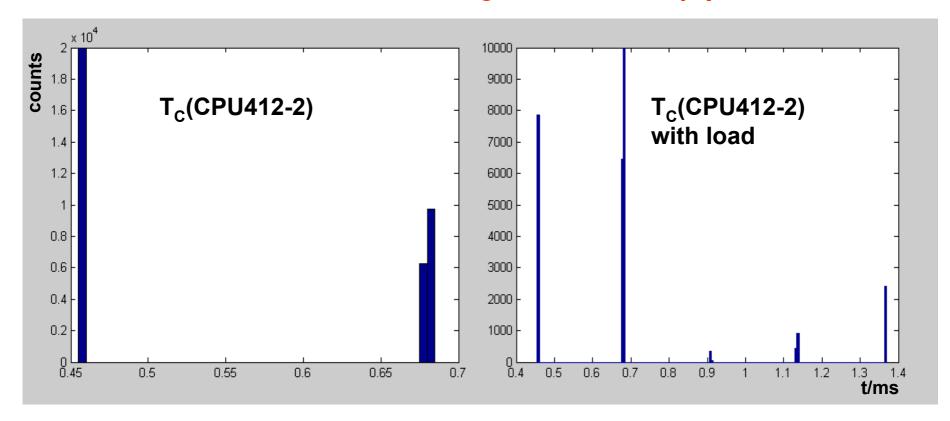
### Freilaufender Zyklus OB1 (1)



- Zykluszeit-Histogramm des "leeren" OB1 (nur Code zum Toggeln eines digitalen Ausgangs) ohne andere Aktivität
- => Minimale Zykluszeit + Jitter durch Betreibssystem



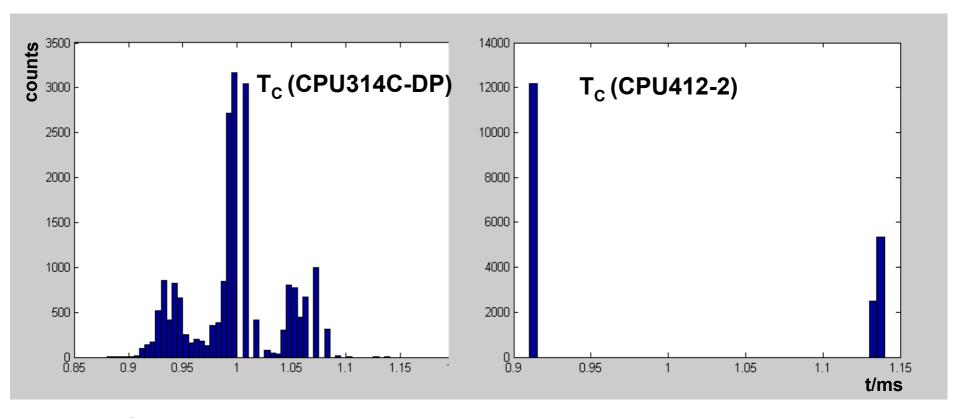
### Freilaufender Zyklus OB1 (2)



- Geschwindigkeit der I/Os ist limitierener Faktor => Artefakte
- CPU414-1: ~0.2 ms

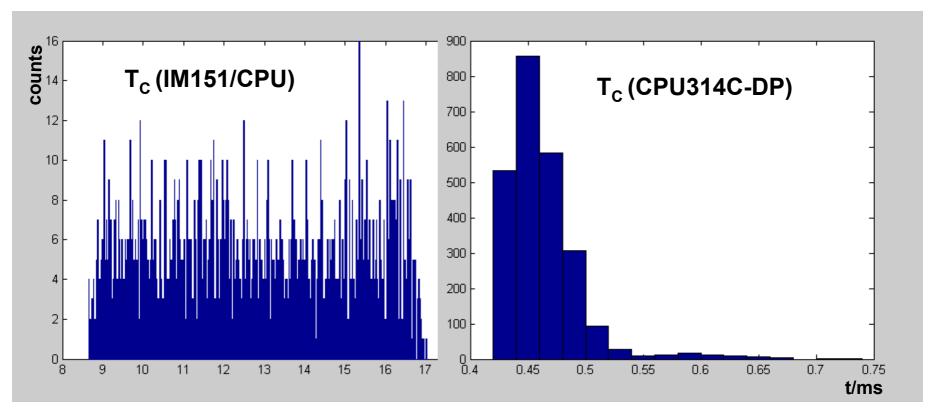


### Konstanter Zyklus OB35



- Granularität der Zykluszeit: 1ms,
   Genauigkeit: ~ 100 μs
- Spezifisches Merkmal von SPSen

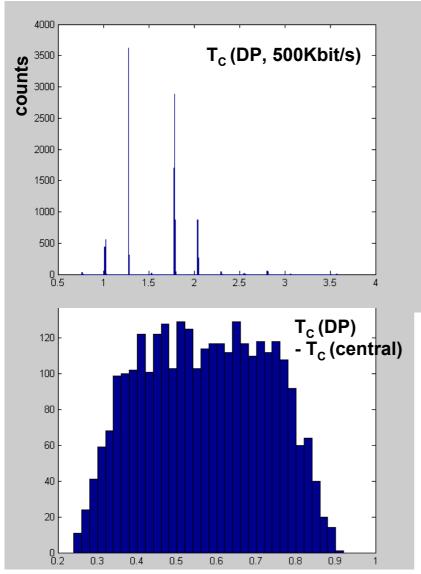
### Asynchronous Reaktionszeit (OB40)

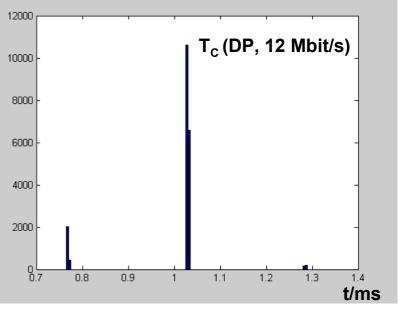


- IM151/CPU: "low end"
- S7-300 ca 5mal langsamer als ein Pentium II basiertes POSIX system



### ET200S dezentrale Peripherie

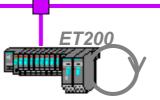




- OB35 mit 1 ms, output auf ET200S
- 500 kBit/s => DP Zyklus 1.2ms
- 12 MBit/s => DP Zyklus 0.1ms
- Äquidistanz ohne Auswirkung
- ET200S Zyklus: ~0,3ms
- Jitter vergrößert: ~2 \* (DP + ET200S Zykluszeiten)

### Zusammenfassung und Ausblick

- SPS: Synchroner zyklischer Ablauf mit hoher Deterministik
- Deterministische Reaktion in einigen ms notwendig: PLCs sind geeigent, sogar mit dezentraler Peripherie
- Deterministische Reaktion in < 1ms: möglich mit speziellen I/O-Moduln and "High-End" CPUs
- Zukünftige Arbeit:
  - Untersuchung der SoftSPS WinAC (WindowsNT, Venturecom RTX, WindowsCE)
  - Untersuchung der Isochroniität (10 μs??)
     (durch Zyklus-Synchronisation)



Zentrallabor für Elektronik (ZEL)

**PROFIBUS-DF** 

Tel.: 07247-82-5635

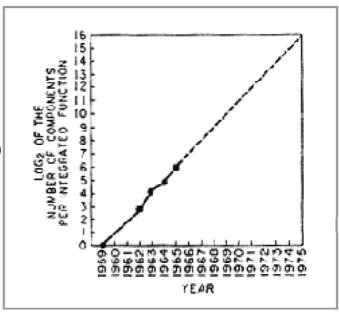
# Roadmap und Grenzen der Halbleitertechnik?

Moore's Law und die Zukunft der Halbleiterentwicklung Brauchen wir diese Entwiclung? Prozess-Technologie Was bringt "Nano"? Design-Technologie Resümee

### Die Geburt des "Moore'schen Gesetzes"

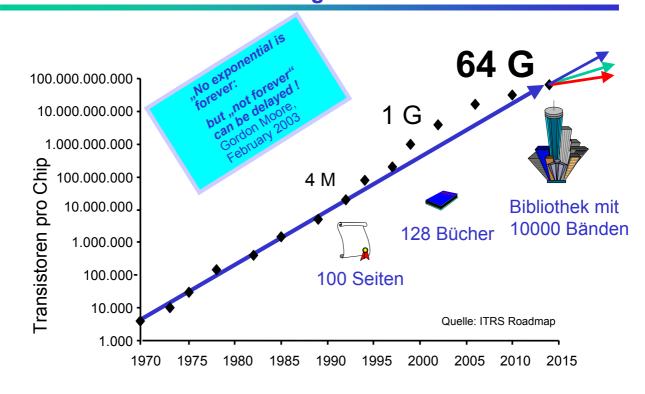


- 1965 Gordon Moore (Fairchild)
- alle 12 Monate verdoppelt sich Anzahl der Komponenten pro Chip (zumindest bis 1975)
- ▼ Moore'sches Gesetz



"Cramming more components onto integrated circuits" Quelle: Electronics, Vol. 38, No. 8, 1965

# 40 Jahre danach, kommen die Grenzen der Halbleitertechnologie ins Blickfeld?



07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

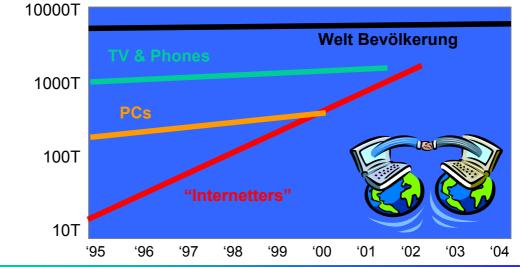
.

### Brauchen wir das?

- In geographisch limitierten Märkten gibt es zwar Sättigung, aber
  - die Zahl neuer Applikationen ist ungesättigt.



Quelle: Osten



07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

#### Fundamentale Grenzen der Halbleitertechnik I

• Unschärferelation: 
$$E > \frac{h}{\tau}$$
  $\qquad \qquad \Psi P = \frac{E}{\tau} > \frac{h}{\tau^2}, \quad f = \frac{1}{\tau} = 10^{11} Hz \quad \Psi P > 10^{-12} W$ 

für MOSFET 
$$\frac{U_v^2}{R} = \frac{0.7V^2}{10^{13} \Omega} > 5 \cdot 10^{-12} W$$
 keine Limitierung

- Si-Gate-Dicke: Tunneleffekt ≈ nm
- kritische Feldstärke:  $E_{krit} = \frac{\Delta U}{\Delta z} \approx 5 \cdot 10^5 \ V/cm$ 
  - $\Delta U = 0,7 \ V$   $\Delta z > 14 \ nm$
- minimale Schaltzeit:  $\tau = \frac{\Delta x}{v_{sat}}$ ,  $v_{sat} \approx 10^7 \ cm/s$  in Si

$$\Delta x > \Delta U / E_{krit}$$
,  $\Delta U > 0.7 V$ 

$$\tau_{\min} > \frac{\Delta U}{E_{krit} \cdot v_{sat}} = \frac{0.7 V}{5.10^5 V/cm \cdot 10^7 cm/s} \approx 1.4 \cdot 10^{-13} s$$
 kein Limit

07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap Halbleitertechnologie

5

#### Fundamentale Grenzen der Halbleitertechnik II

• Widerstand:  $\rho_{Al} \approx 2.9 \cdot 10^{-8} \Omega m, \qquad \rho_{Cu} \approx 1.8 \cdot 10^{-8} \Omega m$ 

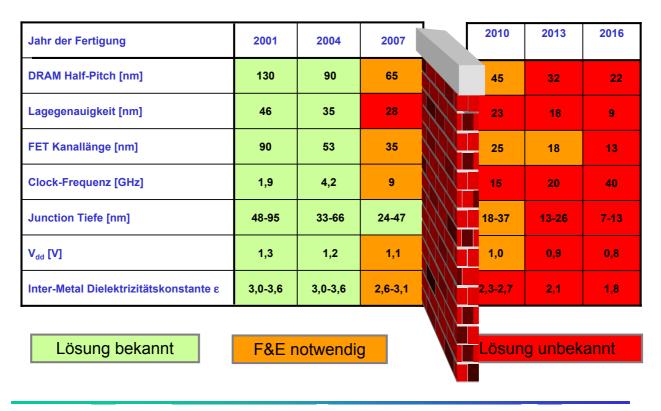
 $50nm \times 50nm \qquad \frac{R}{l} = 1, 2 \cdot 10^4 \Omega / mm \approx 0, 72 \cdot 10^4 \Omega / mm$ 

- ♥ RC-Verzögerung, Leistungsverluste (km Leitungen!)
- **∨** Nano Tubes
- Kapazität: C ≈ 1 5 fF ♥ RC ≈ 10 ps/mm
  - Aufbaumaterialien mit niedrigem ε
- Induktivität: L ∞ -ln r
- Leistungsverbrauch:  $P_{schalten} \approx \frac{1}{2}C \cdot U^2 \cdot n \cdot f \leq 40 \, W$   $\rightarrow U \approx 1 \, V$   $\rightarrow C \approx 4 \, fF$   $\rightarrow f = 1 \, GHz$

 $\rightarrow n \approx 10^8$ , aber nur 20% der Transistoren sind aktiv

• Schwelle (Abschnürspannung):  $U_P < 0.15 \ V \ \downarrow ? \ \bullet \ Leistungsverbrauch \ \uparrow$ 

### Barrieren auf der ITRS Roadmap 2003



07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

-

### Wie geht es weiter?

Potenzial der Mikroelektronik bestimmt durch Fortschritte in der:

**Prozess-sowie** 

**Design-Technologie** 

- Bis 2013 wird CMOS auf Si-Basis die dominierende Technologie bleiben
- Einfache Skalierung wird nicht mehr funktionieren
- Neue Bauteile- und Integrations-Konzepte sind notwendig
- Grundlegende Innovationen in Lithographie und Materialien sind notwendig.

### Neues Problem: Gate Leckströme

Produktions- jahr	Technologie [nm]	Gate Dicke [nm]	Gate Bias [V]	Leckstrom [A/cm <sup>2</sup> ]
2001	130	1,3 - 1,6	1,1	>0,1
2004	90	0,9 - 1,4	1,0	>1
2007	65	0,6 - 1,1	0,9	>10
2010	45	0,5 - 0,8	0,8	>100
2013	32	0,4 - 0,6	0,7	?
2016	22	0,4 - 0,5	0,6	??

Dazu kommen noch die Leistungsverluste in der wachsenden Zahl von Leitungen (km) auf dem Chip

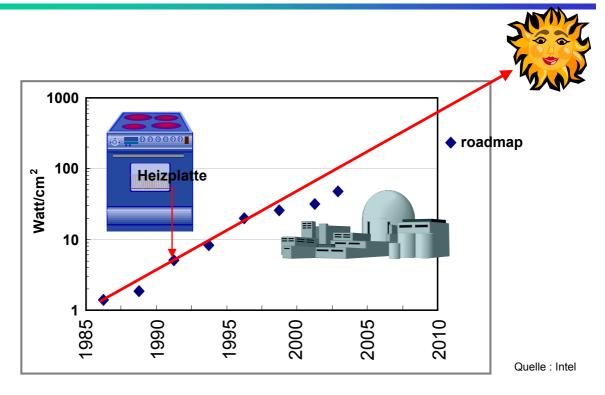
Source: ITRS Roadmap 2001

07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

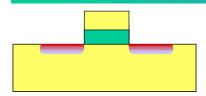
9

### Leistungsdichte für Transistorschaltungen



07.04.2004

#### Läßt sich das Leckstrom-Problem lösen?



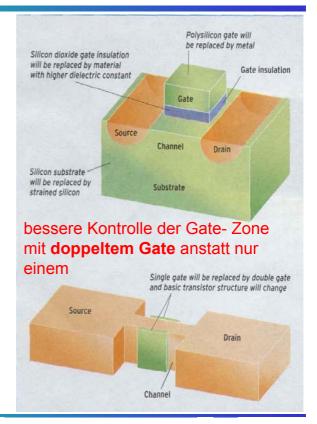
Um die Leckströme zu reduzieren muss die Isolationsdicke der Gates vergrößert werden.

Die Kapazität, darf nicht reduziert werden!

Sonst wird das Feld zu klein um das Gate zu steuern

**C** ~ ε **A** / **d** 

Lösung: Materialien mit großem ε



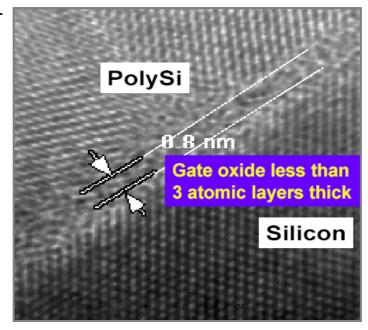
07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

11

### Das Ende der Skalierung?

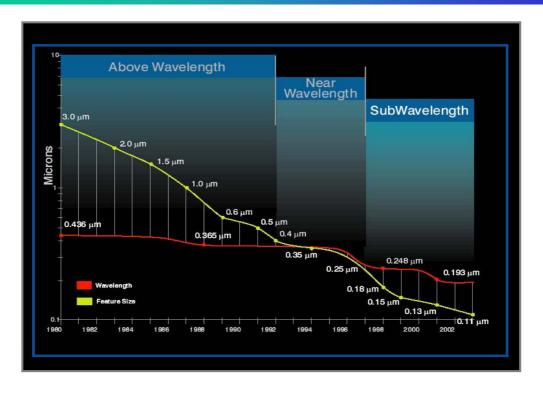
30 nm FET



Quelle: Intel

07.04.2004

# Lithographie: Was ist möglich?



Quelle: Osten

07.04.2004

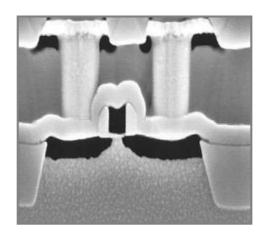
Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

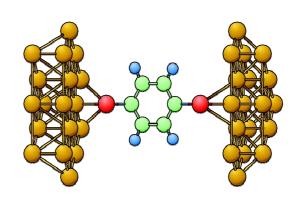
13

## **Die Nano-Hypothese**

- Eines Tages
   vielleicht nach 2013 wird das Zeitalter der CMOS Transistoren dahinschwinden....
- Das wird das Ende des "Moore's Law" und der traditionellen Mikroelektronik sein?
- Die Ära der Nanoelektronik wird beginnen .... ???
- Es könnte auch ein Märchen sein, das ein Märchen bleibt. Tot geglaubte leben länger.

# Skalierung erreicht seine physikalischen Grenzen





10 nm MOSFET

VS.

Moleküle

Quelle: Osten

07.04.2004

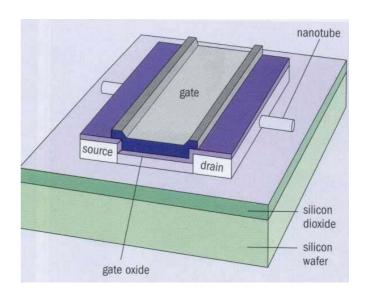
Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

15

# Nanotube Transistoren (IBM, ...)

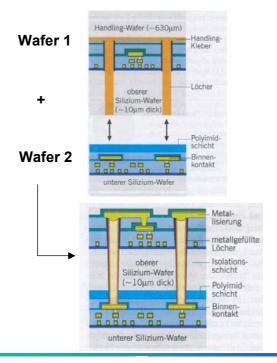
- Logische Schaltkreise aus halbleitenden Kohlenstoff-Nanoröhrchen
- Herstellung noch m

  ühsam
- Selbstorganisierte Anordnung der Nanostrukturen?
- Technische Reife in 10 Jahren?
- Dann ist Halbleitertechnik auch schon "NANO" -Komplexitätsvorsprung so nicht einholbar
- Aber Nanotubes als vertikale Leiter für 3D-Strukturen



# 3D-Chips in Stapeltechnik (Infineon, ...)

 Wafers werden zusammengeklebt und über Leitkleberdurchkontaktierungen oder Nanotubes verbunden:

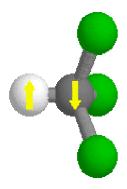


07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

17

# **Quanten-Computer?**



Kern-Spins von Chloroform Molekülen wurden als Bausteine für einen Quanten-Computer (<sup>1</sup>H bzw. <sup>13</sup>C) genutzt.

Noch sehr weit weg von einer regulären NANO-Anwendung im technischen Großeinsatz - wenn überhaupt in 30 Jahren?

Quelle: Osten

## **Fehlertoleranz**

#### **Neues Paradigma:**

- Nicht mehr 100 % fehlerfreie Fertigung für Bauteile und Verbindungen kann dramatisch die Kosten der Fertigung, Verifikation und Tests senken
- · Bisher gilt und ist noch gültig:
  - Ein- oder zweistufiges Design mit nicht fehlerfreier Software
- Die Herausforderungen des neuen Chip-Designs
  - Robustes Design mit "fuzzy" Randbedingungen

#### Wie kann das funktionieren?

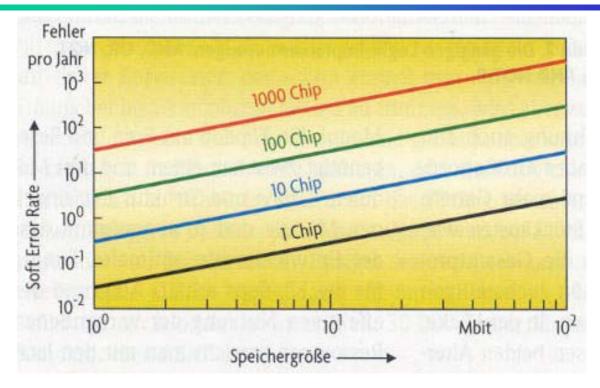
 Reprogrammierbare Logik mit vielen Sektionen (redundant), die sich z.T. im Falle eines Defektes abschalten und durch andere ersetzen lassen.

07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

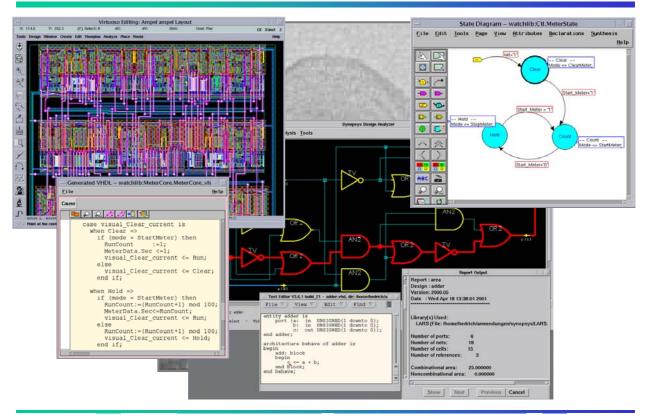
19

# Soft-Error-Rate in Speicher-Bausteinen



1 GByte Speicher = 8 Gbit ♥ ≈ 1 Fehler / 24 h ♥ 1 Bit Fehlerkorrektur hilfreich (Hamming Code)

# Von der Prozess- ... zur Design Technologie

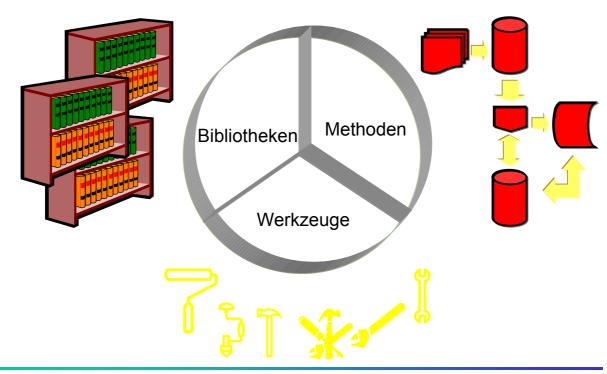


07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

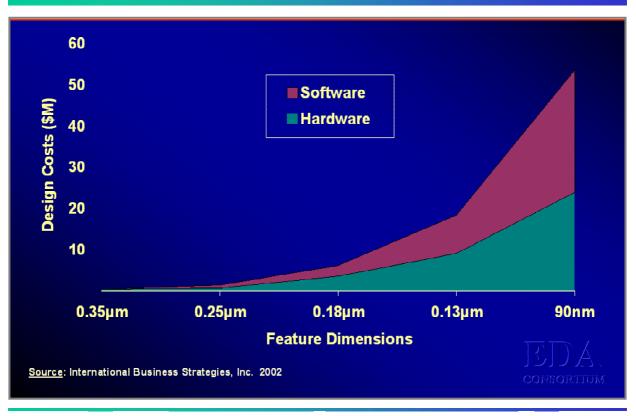
21

# Was ist die Design-Technologie?



07.04.2004

# Schnell steigende Designkosten



07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

23

## Was brauchen wir?

- Unser Problem 2013,
  - wir wollen in einem Jahr (200 Arbeitstage) einen neuen 8 GTr. Chip entwickeln,
  - wir haben ein Team von 500 Ingenieuren,
- Dann.
  - Brauchen wir eine Produktivität von 80 kTr. pro Ingenieur und Tag.
- D.h., da heutige Produktivität 0,4 kTr. pro Ingenieur und Tag,
  - ▼ Produktivität muss um ca. 80 % jährlich steigern,
  - ▼ Oder wir brauchen mehr und mehr Ingenieure !!!
- Kostenfalle

das größte Damoklesschwert



#### über der weiteren Halbleiterentwicklung oder Roadmap

## Drastische Steigerung der Design-Produktivität

#### Hauptsächlich durch neue Designmethoden

- nicht durch neue Werkzeuge:
- Höheren Abstraktionslevel für das Design
- Wiederverwendung von Designs (Intellektual Properties (IP))
- Bessere und schnellere Optimierungs und Analyse-Algorithmen
- Bessere Schätzer für Verluste und Verhalten der Schaltung
- Formale Methoden, damit Design automatisch durch Konstruktion richtig ist
- Bauteile, Verbindungen, Schaltungen und Systeme müssen fehlertolerant werden

07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

25

## **ENDE: 4 Thesen zu Mikro-Nano**

- Die Si-Mikroelektronik wird in den n\u00e4chsten 20 Jahren ein fast unersch\u00f6pfliches Innovationspotenzial bieten
  - Problem: Effektive Nutzung
- NANO hat schon längst begonnen eben auch in der Standard-Halbleiterindustrie
- Neue Nano-Transistorstrukturen (z.B. auf Basis von Nano-Röhrchen) sind zur Zeit zu wirtschaftlichen Bedingungen überhaupt nicht absehbar
- Die Aufbau und Verbindungstechnik wird in den nächsten
   5 10 Jahren von der Nano-Technologie großen Nutzen haben:
  - Elektrische Verbindungen mit C-Nano-Röhrchen haben kleinere Widerstände als Cu-Verbindungsleitungen

07.04.2004

### Dank an:

- Prof. Erich Barke, Institut f
  ür Mikro-Elektronische Systeme, UNI Hannover,
- IMS Institute of Microelectronic Systems University of Hannover
- Prof. Siegmar Roth, MPI für Festkörperphysik Stuttgart,
- Altera,
- · EDA Consortium,
- IBM,
- · Infineon,
- Intel,
- International Technology Roadmap for Semiconductors 2003 (ITRS 2003) ...
- Motorola
- Texas Instruments,
- Xilinx,

für ihre Daten und Bilder

07.04.2004

Hartmut Gemmeke, Roadmap\_Halbleitertechnologie

27

#### Ein Messplatz für laserinduzierte HF-Leitfähigkeit

G. Richter, Abt DH, Hahn-Meitner-Institut Berlin

Zweck: Charakterisierung von Halbleitereigenschaften durch nichtdestruktive Analyse (keine Materialveränderungen durch zerstörende Prüfungen, z.B. wegen Kontaktierung der Prüflinge, keine Änderungen der Materialeigenschaften durch das Prüfverfahren).

Verfahren: Generierung von Elektronen-Löcher-Paaren in Halbleiter-Gittern durch Laser-Pulse hoher Energie und sehr kleiner Zeitdauer, Messung der Rekombination der Paare durch Aufzeichnung des darauf folgenden zeitlichen Verlaufes der Leitfähigkeit im HF-Frequenzbereich.

Einsatz: In der Forschung zur Analyse von Eigenschaften von verschiedenen Halbleitermaterialien (auch Mischformen), in der Produktion bei der Qualitätskontrolle, überwiegend an Si (Fotovoltaik-Elemente), allgemein zur Feststellung von Verunreinigungen.

#### 1. Verschiedene aktuell verwendete Verfahren

Anregung durch elektrische Pulse, Blitzlampen, Laser verschiedener Wellenlänge Messung des Kapazitätsverlaufs durch schnelle C-Meter [1], Messung der Reflexion von Mikrowellen, Analyse der HF-Eigenschaften im Volumen der Prüflinge in verschiedenen Frequenzbereichen (Mhz...GHz) [2]

Prüflingsgestaltung: Ganze Wafer, Zuchtkristalle, Schichten auf anderen Trägern

#### 2. Forderungen an den behandelten Messplatz

Hohe zeitliche Auflösung (Laser-Anregungspuls << 1 ns), Zeitauflösung des Messergebnisses < 3 ns, Zeitmessbereich bis Unendlich (DC-fähiger Detektor). Ein Probensortiment mit großem Leitfähigkeitsumfang sollte bearbeitet werden können. Entwicklung einer geeigneten Aufnahme für die Proben. Funktionsfähigkeit auch an kleinen Probenstücken < 1 cm² Hohe Empfindlichkeit, da bei frequenzvariablen Lasern die Anregungsenergien niedrig sind.

#### 3. Messtechnische Grundlagen

Die zeitabhängige Leitfähigkeitsänderung im Sample wird ausgewertet, indem die Phasenverschiebung zwischen anregender Frequenz (Referenzzweig) und im Resonator angeregter Schwingung (Messzweig) in einem Phasendetektor (hier ein Ringmischer) ermittelt wird.

Für einen Schwingkreis, der unbedämpft ist oder verschwindend geringe Dämpfung hat, ist die Resonanz-Kreisfrequenz

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L * C}}$$

Ein bedämpfter Schwingkreis, der alle seine Verluste in R konzentriert hat, hat eine nach unten abweichende Resonanz mit

$$\omega = \sqrt{(\frac{1}{L * C} - \frac{R^2}{4 * L^2})}$$

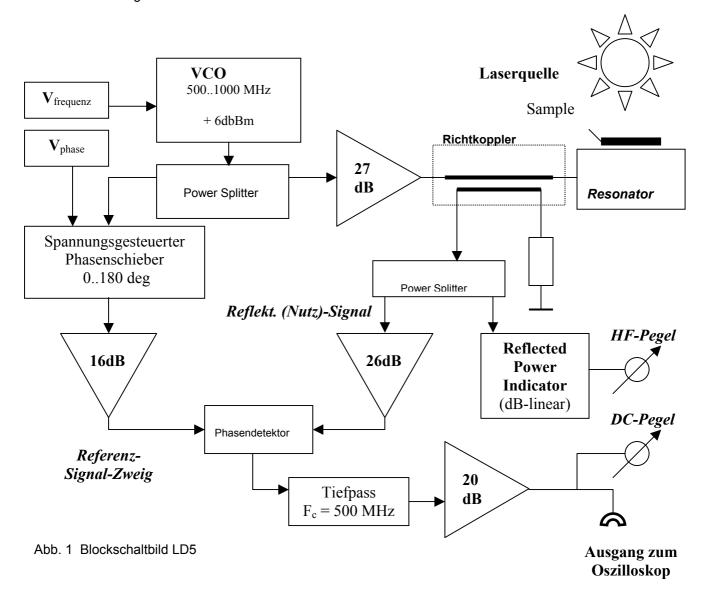
R sind die Gesamt-Verluste, die hier als  $R=R_0+R(t)$  aufzufassen sind , wobei t die Zeit nach der Anregung des Samples ist, während R(t) die freien Ladungsträger repräsentiert, die HF-technisch die Verluste des Samples während der Rekombinationszeit beschreiben und damit die Güte des Gesamt-Resonator-Gebildes ausmachen. Ist die Güte des Resonators und des Samples im Falle der Nichtanregung von Ladungsträgern hoch, so gilt mit damit kleinem Verlust-  $R_0$  eine andere Phase  $\phi_0$  als während in der Zeit t nach der Anregung, wenn die Phase durch das zusätzliche R(t) einen anderen Verlauf nimmt und damit am Mischerausgang das Differenzsignal liefert.

Für die Phase bei so erzwungenen Schwingungen folgt

$$\tan \varphi = \frac{R * \omega}{L(\omega_0^2 - \omega^2)},$$

was für das Messverfahren wie folgt ausgenutzt wird.

#### 4. Blockschaltung



Im Blockschaltbild erkennt man links den Referenzsignalzweig und rechts den Resonator mit dem zu charakterisierenden Sample. Im Leerlauf, also bei Nichtanregung des Samples, ist durch Wahl der Frequenz der Resonator an den Treiberverstärker ideal angepasst und die Rücklaufleistung am Richtkoppler ist nahe Null. In diesem Falle werden die Leerlaufverluste des Resonators durch die reaktiven Anpassglieder genau auf die Quellimpedanz des Treiberverstärkers (hier 50 Ohm reel) transformiert. Am Richtkoppler ergibt sich ein Signal nahe Null. Die Referenzphase wird vom Experimentator über den Phasenschieber im Referenzzweig so eingestellt, dass am Phasendetektor die beiden Signale um 180 Grad verschoben erscheinen und das Ausgangssignal folglich Null wird

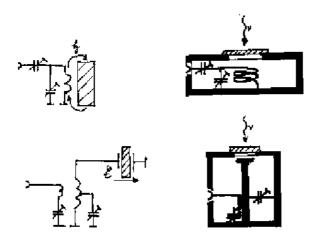
Die Messphase wird aus dem rücklaufenden Signal über einen Richtkoppler entnommen, wenn der Resonator durch die Anregung und das dadurch stärker verlustbehaftete Sample verstimmt wird, da in diesem Falle die genaue Anpassung nicht mehr gegeben ist. Die Spannung am Rücklaufweig des Richtkopplers ist jetzt entsprechend höher und diese Messphase entsprechend verschoben, so dass der Phasendetektor ein Ausgangssignal liefern kann.

Im praktischen Betrieb wird das Sample auf den Resonator gelegt, die Frequenz von Hand so eingestellt, dass der Resonator ideal angepasst ist (die sehr unterschiedlichen Sample-Größen und – Eigenschaften verstimmen den Resonator unterschiedlich stark, z.T. bis zu 50 MHz), indem die rücklaufende Leistung an einem Instrument beaobachtet wird und anschließend die Referenzphase so eingestellt, dass der Ausgang den DC-Pegel Null zeigt. Da die Abklingzeiten z.T in den ms-Bereich gehen und bei Photoleitung sogar gegen :, ist eine DC-Ausgang-Kopplung erforderlich.

Der ideale Double-Balanced-Mixer als Phasendetektor liefert theoretisch nur Summen- und Differenzfrequenz (als Ableitung der Summen- und Differenzphasen an seinen Eingängen) am Ausgang, wobei uns hier auch nur die Differenzphase interessiert. Wegen der nur endlichen (i.A. nur >25 dB) Unterdrückung der Messfrequenz und ihrer Oberwellen sowie des Summensignales ist hinter dem Phasendetektor ein Tiefpass erforderlich, um den Eingang des Oszilloskopes nicht mit diesen Störsignalen zuzustopfen resp. zu überlasten. Dieser Tiefpass ist als 10-poliger Bessel-Tiefpass entworfen, um Phasenreinheit auch bei hohen Signalkomponenten des Leitfähigkeitssignal zu erreichen, also den zeitlichen Verlauf der Leitfähigkeit nicht zu verfälschen. Er bestimmt wesentlich die erreichbare Zeitauflösung im Ausgangssignal.

Der Laser, der zur Anregung benutzt wird, liefert eine Master-Clock (etwa 108 kHz), die zur Triggerung des Oszilloskopes benutzt wird. Wegen der Kleinheit der Signale und zur Rauschbeseitigung wird im Betrieb meist über 500 Samples integriert.

Die Ankopplung der Samples an die Resonator-Schwingkreise kann induktiv (Wirbelstrom-Prinzip über magnetische Verkopplung mit H-Komponente der Spule) oder kapazitiv (Sample als Teil der E-Komponente in der Schwingkreiskapazität) erfolgen.



Basis-Resonatortypen

Während bei großen Wafern und Einkristallen das induktive Verfahren dominiert, hat sich bei den kleinen und sehr kleinen (z.T. nur Bruchstücken von Wafern) bei uns das kapazitive Verfahren

bewährt, das einen möglichst großen Anteil der Schwingkreiskapazität aus dem Dielektrikum des Samples gewinnt.

#### 5. Störeinflüsse

Externe Störeinflüsse (Fernsehfunk, Bündelfunk, GSM900, andere Funk-Dienste) sind wegen der hohem Empfindlichkeit der Anordnung nur dadurch zu vermeiden, dass man im Spektrum eine geeignete Messfrequenz dazwischen wählt. Ebenso kann bei photoempfindlichen Samples das Fremdlicht der Raumbeleuchtung stören.

Interne Störeinflüsse (Versorgungsspannungen, Felder von Netzteilen, Fremdeinstreuungen, Schaltnetzteiljitter, mechanische Schwingungen) machten eine Umkonstruktion der Netzversorgung (konsequenter Einsatz analog geregelter Netzteile, aufwendige HF-Verdrosselung bei Lüftermotoren) notwendig. Da schon geringe mechanische Lageänderungen des Samples Störsignale produzieren, wird in praxi der Resonator vom Gerät über ein flexibles Koax-Kabel abgekoppelt.

Verfahrensbedingte Fehler entstehen sowohl bei den Samples als auch bei den Resonatoren durch HF-Erwärmung im Betrieb, da rund 100 bis 200 mW an den Ruheverlusten in Wärme umgesetzt wird, so dass sich mechanische Ausdehnung beim Resonator und thermische Effekte auch am Sample selbst bemerkbar machen.

- [1] Sinton Consulting, WCT-100 Silicone Lifetime Tester
- [2] Ahrenkiel and Jonston; Contactless Measurement of Recombination Lifetime in Photovaltaic Materials; National Renewable Energy Labaratory (NREL), Golden CO, USA

## Parallelkursregelung schneller mobiler Roboter

#### **Gerd Nowack**

Labor für Präzisions- und Datenmesstechnik, c/o Lehrstuhl für Netz- und Datensicherheit, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Ruhr-Universität Bochum, IC 4/146, D-44780 Bochum <u>Gerd.Nowack@rub.de</u>

#### **Abstracts**

Ein mobiler Roboter muss sich kontrolliert fortbewegen können. Die Steuerung der Lenkung ist das Ergebnis einer Bahnplanung, die die Kenntnis der Start- und Zielposition sowie der frei verfügbaren Flächen im Raum voraussetzt. Zusätzliche Sensorik ist erforderlich, um die aktuelle Verfügbarkeit eines Weges festzustellen. Abgestellte Gegenstände und natürlich der Mensch müssen vor einer Kollision geschützt werden.

Der gegenwärtiger Stand der Technik ist der, dass mobile Roboter sehr langsam fahren: 10 bis 40cm/s. Diese Geschwindigkeit ist meist konstant und auf das kritischste Wegstück abgestimmt: die engste Kurve und die erforderliche schnellste Reaktion auf unerwartete Ereignisse. Eine ca. zehnmal höhere Robotergeschwindigkeit könnte bei Geradeausfahrt erreicht werden, z.B. entlang langer Gänge oder zwischen zwei Werkshallen. Dabei tritt vor allem das Problem auf, den geraden Kurs genau zu halten. Lösungen sind hier z.B. eine schnelle Parallelfahrt zu einer Wand mit Hilfe einer berührungslosen Abstandsmessung oder auch der Einsatz eines Kreiselkompasses.

In diesem Beitrag wird eine berührungslose Abstandsmessung vorgestellt. Eine Videokamera wird an den vier Seiten zusätzlich mit Lasern ausgerüstet. Die Justierung erfolgt so, dass das Punktmuster bei dem kleinsten vorgesehenen Abstand dem Bildrand möglichst nahe liegt. Bei Vergrößerung des Abstandes von Messsystem und Wand verkleinert sich das Punktmuster. Dabei wird die Auflösung immer geringer, da auch die Leuchtpunkte immer kleiner werden und das Intensitätsmaximum nur noch über eine geringe Pixelanzahl gemittelt werden kann. Zur seitlichen Abstandsbestimmung zwischen Roboter und Wand hätten zwei Leuchtpunkte gereicht. Mit Hilfe des dritten Leuchtpunktes kann festgestellt werden, ob die Wand zur Laufrichtung des Roboters schräg steht. Dies ist für die schnelle Parallelfahrt des Roboters wichtig zu wissen. Mit dem vierten Leuchtpunkt könnte sogar die Krümmung der Wand bestimmt werden. Aus den vier Signalen lassen sich folgende Ergebnisse ableiten: Nachweis, dass eine ebene Wand seitlich vorhanden ist, Nachweis, dass diese Wand zur Roboterrichtung parallel steht und last not least, dass diese Wand einen messbaren, also regelbaren Abstand hat.

#### 1. Einleitung/Historischer Überblick

1950: Dr. Grey Walter baut die "kybernetische Schildkröte" (ähnlich einem Dreirad), Vorläufer der heutigen Roboter, "Steuerung" durch einen 1-Röhren-"Computer", Sensorik: Lichtempfänger, Besonderheit: kehrte wieder an den Startpunkt (Lichtquelle) zurück, wenn Batterien leer waren.

1954: Patentanmeldung von George C. Devol für: "Programmiertes Umsetzen von Teilen". Hierbei wird Manipulatorarmen das Montieren mit visueller Sensorik beigebracht.

1955: Omnivac-Roboter mit visuellem System, Funksteuerung, rotatorische Kinematik und Wirkorgane, stabiler Rumpfteil, aber geringe Belastbarkeit des "Wirkteils" (Roboterarme)

1958: Jack Kilby (Texas Instruments) erfindet die integrierte Schaltung

≈1965: KHG, Deutschland, baut einen fahrbaren Manipulator für Wartungsarbeiten in Kernenergieanlagen

1960: Unimate mit hydraulischem Antrieb von Unimation Corp.

1967: Das Atomforschungszentrum in Harwell baut "Rivet"

1970: UdSSR, Lunochod: Einsatz auf dem Mond, Betrieb 10 Monate Erkundungsfahrten

1979: Roboter "Hermann": Einsatz in Three Mile Island

1986: Braitenberg-Vehikel mit NN: Eingangsinformationen sind Sensorsignale, z.B. Helligkeit und Abstand, sie werden gewichtet (w<sub>i+</sub> oder w<sub>i-</sub>) und addiert. Zwei Motoren ergeben einen gelenkten mobilen Roboter, der auf verschiedene Reaktionen trainiert werden kann: Zu/Wegfahrt auf/von einer Lichtquelle (Geschwindigkeit helligkeitsgesteuert) und Bremsung über Abstandssensoren. Man interpretiert menschliche Reaktionen: Aggression, Feigheit, ... 1993: Robotereinsatz im Weltraum durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR)

1995: Kuka-Roboter mit PC-Programmierung

1997: Sojourner, der erste mobile Roboter auf dem Mars 6-rädrig

2004: Mars Exploration Rover (MER), Nasa, 6-rädrig

2004: Asimo, der Android der Fa. Honda

#### 2. Aussichten für zukünftige Roboteranwendungen

Roboter-Unterseeboote, Roboter-Landmaschinen: Waldarbeit durch 6-beinige Schreitroboter, Roboteraffe zum Pflücken hoch hängender Früchte, z.B. Früchte der Macauba-Palme mit stacheligem Stamm

Baurobotic: Roboter bauen Hochhäuser, sukzessiv Etage um Etage

Bohrroboter: bohrt dünne programmierbare Löcher durch die Erde zur Leitungsverlegung,

Vermeidung von Schäden an vorhandenen Einrichtungen wie Gas-/Wasserleitungen

Putzroboter: Bahnhöfe, Flughäfen ... Skywash für Flugzeuge, Schiffsrumpfreinigung

Büroroboter: automatische Bodenreinigung, Papierkorbentleerung und Botendienste

Werkschutzroboter: fährt gezielt bestimmte Positionen an und überträgt Videoaufnahmen

Aufklärungsroboter: Roboterflugzeuge, Miniflugzeuge, Spannweite 7,5 cm, Videokamera in

Größe eines Zuckerwürfels, mit Übertragungshardware: 6 g Gewicht

Feuerwehrroboter: ziehen den Wasserschlauch in gefährliche Positionen, Ausrichtung der Düse wird fern- oder Infrarot gesteuert

Roboterschafe zum Rasenmähen, Roboterballjunge beim Tennis

Tankroboter (Wasserstoff kann nicht mehr manuell getankt werden.)

Minenräumroboter, Fernreisen durch den Weltraum mit Roboterbesatzung

Androiden als Modelle z.B. erkrankter Menschen: Diagnosetraining für Ärzte

#### 3. Grundprobleme der Roboter

Orientierung des Roboters:

Wo bin ich? Ortung der Position, GPS

Wo will ich hin? Koordinaten des Zielpunktes, Vorgabe

Wie komme ich dahin? Wegeplan aus dem Raummodell, Korrekturen on Board

Kollisionsfreie Wege nach dem Potentialfeldverfahren (spezielle Expansionsmethode):

Weg über die Linie minimalen Potenzials

#### Intelligente Funktionen für die Orientierung des Roboters:

- (1) Umgebungserfassung mit Sensorik: Abstandsmessung: Alternativen US, 2D-/3D-Laserscanner oder CCD-Kamera. Daraus: Warnabstand (mögliche Reaktion planen) und Schutzabstand (Reaktion notwendig)
- (2) Raummodell, aus dem Start- und Zielpunkt, sowie Wegeplanung bestimmt werden

#### Gesetze der Robotik von Isaac Asimov, Science Fiction Autor

- (1) Der Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
- (2) Ein Roboter muss dem ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit dem ersten Gesetz in Konflikt geraten.

(3) Ein Roboter muss seine eigene Existenz beschützen, solange dieser Schutz mit dem ersten und zweiten Gesetz in Konflikt gerät.

Diese Gesetze gelten ohne Zweifel nicht nur für fiktive Roboter.

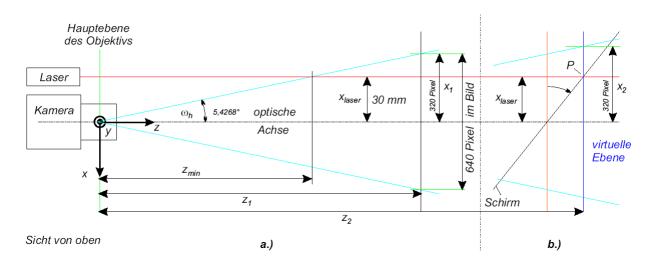
Technische Daten von Roboterplattformen: (aus: /1/)

- (1) Roboterbaukästen von Lego bzw. Fischertechnik: nicht entwicklungsfähig
- (2) RWI- (heute: iRobots, vertrieben über Activmedia) Plattformen, verwendet durch einige Teams beim Robocup, der Fußballweltmeisterschaft der Roboter
- (3) K-Team, Schweiz, bietet Khepera oder Koala an
- (4) Fraunhofer-Institut für Autonome intelligente Systeme AiS, Sankt Augustin, bietet KURT2 (Kanal-Untersuchungs-Roboter-Testplattform) nunmehr als universelle Plattform (2) an: Antrieb: 90 W Motor, 21,6 V, 5Ah, Betriebszeit: 3-4 h, 10 Entfernungssensoren: US und IR, außerdem ein Laserscanner, Geschwindigkeit bis 3,5m/s. Entwicklungsstand: koordinierte Kurvenfahrt mehrerer Roboter ohne gegenseitige Kollision

#### 4. Das Konzept der punktgenauen, berührungslosen Abstandsmessung

Parallel zur optischen Achse eines CCD-Kamera-Systems (Kappa Typ DX1-1394a mit Firewire-Schnittstelle, 15-30 Bilder/s) werden die Lichtstrahlen von vier Laserdioden abgestrahlt. Das Laserpunktmuster wird von der Kamera aufgenommen. Je weiter der Reflexionsschirm (oder die Wand) entfernt ist, umso kleiner ist der Punktabstand auf dem Bildsensor. Die Genauigkeit der Abstandsmessung (besser: der Abstandsberechnung) ist von der Bildauflösung des CCD-Sensors (640x480 Pixel à 7,4 µm x 7,4 µm auf 4,75mm x 3,6mm) abhängig. Die digitale Schnittstelle macht eine eindeutige Zuordnung der Helligkeit und der Ortskoordinaten möglich. Die Kamera besitzt einen c-Mount-Anschluß, der für Wechselobjektive geeignet ist. Im Projekt wurde das Objektiv: Tevidon 1,4/25mm der Fa. Carl Zeiss Jena verwendet. Die äquivalente Kleinbildformatbrennweite beträgt ca. 180mm. Die verschiedenen Öffnungswinkel betragen: horizontal: 10,85°, vertikal: 8,24° und diagonal: 13,60°. Die Achsenwinkel und ihr jeweiliger Tangens betragen:  $\omega_h$  = 5,427° (tan  $\omega_h$  = 0,095),  $\omega_v$  = 4,12° (tan  $\omega_v$  = 0,072),  $\omega_d$  = 8,30° (tan  $\omega_d$  = 0,1458).

Um das Laserpunktmuster hervorzuheben wird zusätzlich ein Rotfilter mit  $\lambda_g$  = 620nm verwendet. Als Laserdioden werden TIM-203-Dioden mit einer Leistung von 3mW verwendet. Die Berechnungsmethode für die Entfernung wird in der folgenden Abbildung erläutert.



Angenommen der Laserstrahl läge in der Horizontalebene mit 30mm Abstand von der optischen Achse und sein Reflexionspunkt würde auf Pixel 100 gemessen, dann ist die Entfernung:

$$z_1 = \frac{30 \text{ mm}}{0.095} \cdot \frac{320 \text{ pixel}}{100 \text{ pixel}} = 1010,53 \text{ mm}$$

Die Entfernung bei Messung auf Pixel 90 ist entsprechend größer:

$$z_2 = \frac{x_{laser}}{\tan \omega_h} \cdot \frac{x_{2,px}}{x_{laser,px}} = \frac{30 \text{ mm}}{0,095} \cdot \frac{320 \text{ pixel}}{90 \text{ pixel}} = 1122,81 \text{ mm}$$

#### 5. Justierung der Laser bzw. Kalibrierung des Abstandes

Eine mechanische Justierung der Laser hat sich als unmöglich herausgestellt, weil die Laserstrahlen nicht einmal parallel zur Gehäusewand austreten. Da Justierungsfehler mit dem Abstand zunehmen, war es notwendig, für den Abstand einen Berechnungsweg zu finden, der keine parallelen Laserstrahlen zur optischen Achse voraussetzt. Die Laserstrahlen werden als allgemeine Geraden im Raum betrachtet. Projiziert man die allgemeine Gerade auf die (x,z) bzw. (y,z)-Ebenen erhält man:

$$x = m_h \cdot z + b_h$$
$$y = m_v \cdot z + b_v$$

Aus beiden Gleichungen kann der Abstand z bestimmt werden, wenn die Geradensteigungen  $(m_h, m_v)$  bzw. die Achsenabschnitte  $(b_h, b_v)$  bekannt sind. Damit folgt:

$$z = \frac{b_h}{k_h \cdot x_{px} - m_h}$$

mit:

$$k_h = \frac{\tan \omega_h}{320}$$

bzw.:

$$z = \frac{b_{v}}{k_{v} \cdot y_{px} - m_{v}}$$

mit den Pixelkoordinaten für  $x_{px}$  und  $y_{px}$ . Das sind ganzzahlige Größen für die Pixelnummer des Lichtschwerpunktes der Laserpunkte. Die Bestimmung der Geradensteigungen  $(m_h$ ,  $m_v$ ) bzw. der Achsenabschnitte  $(b_h$ ,  $b_v$ ) erfolgt über zwei bekannte Punkte  $P_{1,2}(x_{1,2}, y_{1,2}, z_{1,2})$  der Raumgeraden. Es ergeben sich folgende Lösungen:

$$m_h = k_h \left( \frac{\Delta x_{px}}{\Delta z} z_1 + x_{2,px} \right)$$
 
$$b_h = -k_h z_1 \Delta x_{px} \left( 1 + \frac{z_1}{\Delta z} \right)$$

und abgekürzt:

$$m_{_h} = k_{_h} m_{_h}^\prime \qquad \qquad b_{_h} = k_{_h} \ b_{_h}^\prime \label{eq:bh}$$

Das Ergebnis ist:

$$z = \frac{b_h'}{x_{px} - m_h'}$$

Analog gilt natürlich auch:

$$z = \frac{b'_{v}}{y_{px} - m'_{v}}$$
  $m'_{v} = \frac{\Delta y_{px}}{\Delta z} z_{1} + y_{2,px}$   $b'_{v} = -z_{1} \Delta y_{px} \left(1 + \frac{z_{1}}{\Delta z}\right)$ 

Dieses Ergebnis wäre für Kalibrierung des Abstandes geeignet, wenn denn die z-Koordinaten der beiden Punkte bekannt (also messbar) wären. Die Lage der Hauptebene des Objektivs ist aber tatsächlich nicht bekannt. Die fehlende Information kann ersetzt werden, wenn man drei Punkte der Raumgeraden betrachtet. Nun erhält man zwei messbare Differenzen zwischen den Punkten P<sub>1</sub> und P<sub>2</sub> bzw. P<sub>2</sub> und P<sub>3</sub>.

Die z-Koordinaten der drei Punkte können wie folgt berechnet werden:

$$z_{1} = \frac{-\Delta x_{px}^{'} \Delta z (\Delta z' + \Delta z)}{\Delta z \Delta x_{px}^{'} - \Delta z' \Delta x_{px}}$$

$$z_{2} = z_{1} + \Delta z$$

$$z_{3} = z_{1} + \Delta z + \Delta z'$$

mit:

$$\Delta x_{px} = x_{2,px} - x_{1,px}$$
  $\Delta x'_{px} = x_{3,px} - x_{2,px}$ 

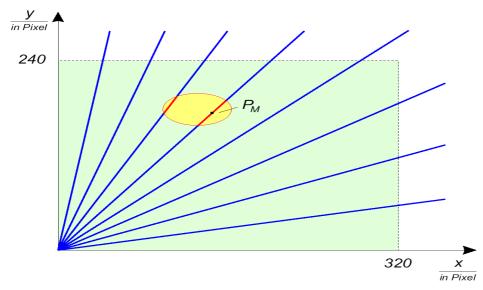
Die Kalibrierung des Abstandes kann noch weiter verbessert werden durch Verwendung vieler Punkte (also mehr als drei) auf der Raumgeraden. Durch Mittelung und Regression kann der Fehler genügend genau reduziert werden.

#### 6. Messaufbau und Kalibrierung

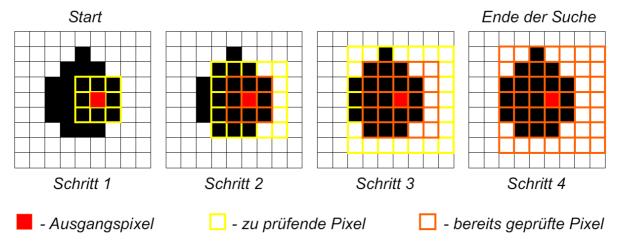
Der Messaufbau besteht aus einer optischen Bank mit einem fest montierten, aber um die xund z-Achse drehbaren Schirm. Die Kamera, zusammen mit ihren vier Laserstrahlern, ist auf einem Wagen montiert, der längst der optischen Bank verschoben werden kann, um verschiedene Abstände zum Schirm einstellen zu können. Zunächst wird die Kamera auf den kürzesten Abstand gestellt. Die Laserpunkte haben dann im Bild den größten sinnvollen Abstand voneinander. Danach wird die Entfernung in 100 mm Schritten vergrößert. Außerdem werden in jeder Position 100 Abstandsmessungen durchgeführt, über die gemittelt wird.

Die Auswertung des Kamerabildes erfolgt wie folgt:

- 1. Der Bildraum wird in 4 Segmente aufgeteilt, also für jeden Laserpunkt eins.
- 2. Zur schnellen Suche des Pixelbildes wird nicht abgescannt, sondern auf Zentralstrahlen gesucht, ob die Helligkeit über einem vorgegebenen Grenzwert liegt. Das ist sinnvoll, weil bei großen Abständen die Abbildung des Laserpunktes immer kleiner wird und auf die Mitte zurückt.



Jetzt werden alle weiteren Pixel des Pixelbildes gesucht. Dazu wird die Nachbarschaft in einer 9-er, 16-er, 25-er usw. Matrix untersucht, bis alle Pixel über dem Schwellwert gefunden sind.

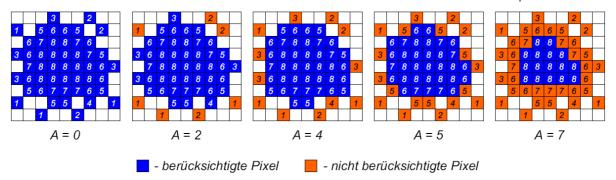


Der mit der Helligkeit ω gewichtete Mittelpunkt des Pixelbildes ergibt sich zu:

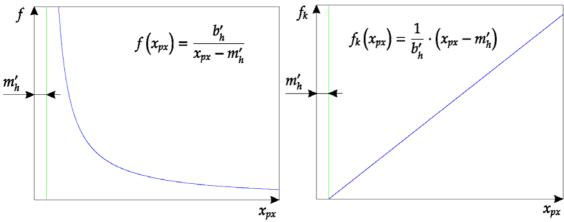
$$P_{\text{mittel}} = \left(x_{\text{m}}, y_{\text{m}}\right) \qquad \text{mit:} \qquad x_{\text{m}} = \frac{\sum_{i} \omega_{i} x_{i}}{\sum_{i} \omega_{i}} \qquad \text{und} \qquad y_{\text{m}} = \frac{\sum_{i} \omega_{i} y_{i}}{\sum_{i} \omega_{i}}$$

Eine besondere Schwierigkeit tritt im Randbereich auf. Dort haben die Helligkeitswerte der Pixel in etwa die Größe des vorgegebenen Schwellwertes. Da nun die Kamera automatisch einen Helligkeitsabgleich durchführt, bilden sich keine stabilen Randpixel. Dieser stochastische Fehler wird nicht sinnvoll durch Mittelung ausgeglichen. Erfolgreich wird durch Auswertung gesetzter bzw. nicht gesetzter Pixel per Software festgestellt, wie viel Nachbarn ein Pixel hat. Verwendet man nur Pixel mit 8-er Umgebung, so sind die stochastischen Fehler ausreichend stark unterdrückt.

Die Zahl in den einzelnen Pixeln steht für die Anzahl ihrer "schwarzen" Nachbarpixel



Mit Hilfe der aufgenommenen Daten aus 20 Abständen können die Parameter:  $m'_h$ ,  $b'_h$  bzw.  $m'_v$ ,  $b'_v$  nach Ausgleichung der Messwerte mit einer linearen Umkehrfunktion bestimmt werden.



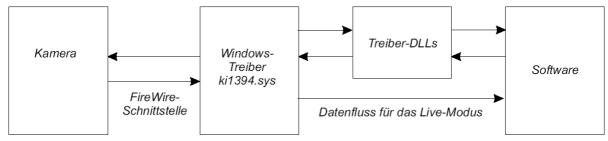
Aus den Werten der Ausgleichsgeraden: m<sub>a</sub> und b<sub>a</sub> folgen die Parameter des betrachteten Laserstrahls:

$$b_h' = \frac{1}{m_a} \qquad m_h' = -\frac{b_a}{m_a}$$

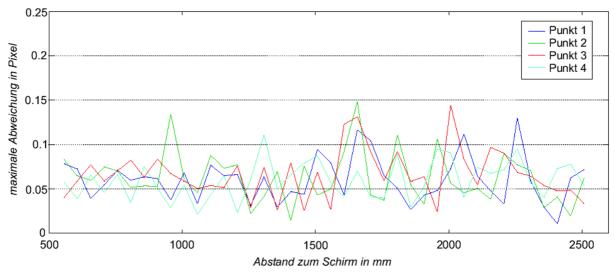
Entsprechende Formeln gelten für die m'<sub>v</sub>, b'<sub>v</sub>. Wie man leicht sieht, kann die Entfernung entweder aus der x- oder der y-Koordinate des Pixelschwerpunktes bestimmt werden. Sinnvoll ist die Verwendung der x-Koordinate, da sie eine größere Pixelauflösung hat.

#### 8. Ergebnisse der Abstandsmessung

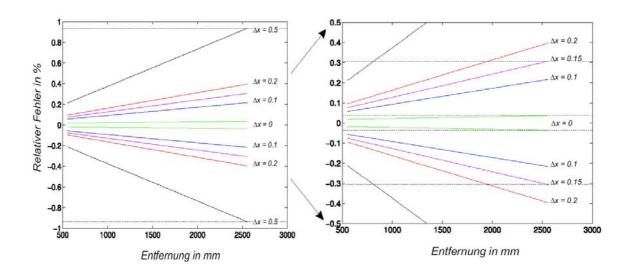
Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung von Kamera und Bediensoftware:



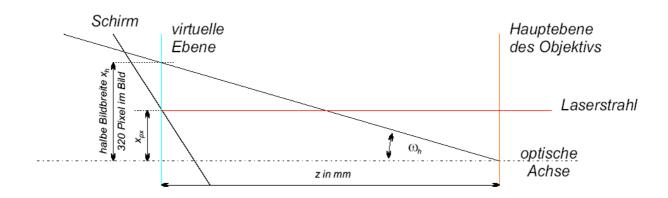
Aufgrund von stochastischen Schwankungen tritt eine maximale Abweichung in Pixel auf:



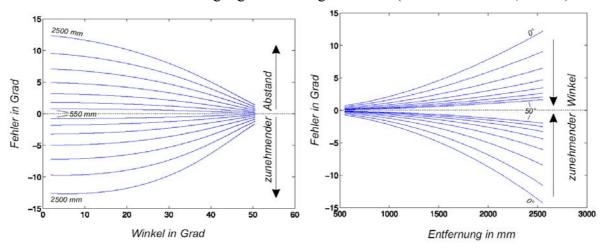
Der maximale Fehler beträgt  $\Delta x = 0.15$  Pixel. Für den relativen Fehler der Entfernungsmessung folgt in Abhängigkeit vom Abstand und dem stochastischen Fehler  $\Delta x$ :



Last not least sollten auch die Neigungswinkel der Projektionsebene bestimmt werden. Der Fehler der Abstandsmessung überträgt sich sehr effektiv in einen Fehler der Winkelmessung. Die betrachtete Anordnung zeigt folgende Abbildung:



Der Fehler des horizontalen Neigungswinkels ergibt sich zu (Annahme:  $\Delta x = 0.2$  Pixel):



#### 9. Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Herrn Arpad Krakovszki, der im Rahmen seiner Diplomarbeit dieses Thema bearbeitet hat. Wir standen in einem ständigen, produktiven Dialog, so dass die gestellte Aufgabe mit großer Zufriedenheit gelöst werden konnte.

Verglichen mit den neuen Arbeitsgebieten der Universität im Bereich der Elektrotechnik nimmt die Bedeutung der Präzisionsmesstechnik leider rapide ab. Weltweit kann man einen solchen Trend allerdings nicht feststellen.

#### 10. Literatur

- /1/ Worst, Rainer und Kirchner, Frank: KURT2, eine mobile Plattform für die Robotikforschung, Robotik 2002, VDI-Bericht 1679, S. 389 394
- /2/ Braitenberg, V.: Künstliche Wesen, Verhalten kybernetischer Vehikel, Vieweg 1986
- /3/ Arkin, R.: Behavior-Based Robotics, MIT Press 1998
- /4/ Veerbeck, Christian: Reaktive Steuerung autonomer mobiler Roboter, Dissertation Gerd.Nowack@rub.de



# Datentransfer für Multidetektor

## **DE147 / DE148**

Entwicklung & Aufbau einer 16 Bit Datenübertragungsstrecke mit mind. 8 MHz Abtastgeschwindigkeit

Ersatz für DE118- DE129

Autor: Waldemar Przybilla

Mitwirkender: Winfried Altmann





## Gliederung

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER- Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung

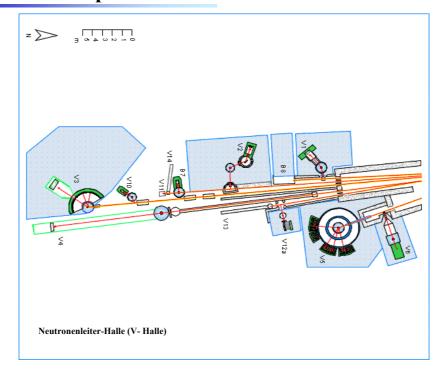




# Übersicht Experiment V5

#### • Übersicht Experiment V5

- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung



Waldemar Przybilla

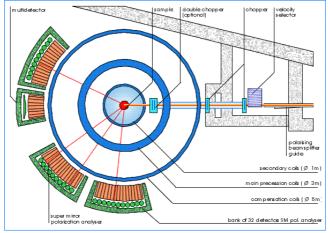


## Übersicht Experiment V5

#### • Übersicht Experiment V5

- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung

The Neutron Spin Echo (NSE) precession field, is created by three pairs of coils with diameters 1, 3 and 4.8 m respectively. Each pair is mounted in a Helmholtz like fashion with one coil above and one coil below the horizontal scattering plane. The centers of all coils are placed on the same vertical axis, which crosses the sample position. In each pair of coils the electric currents are oriented oppositely to each other. In the NSE configuration the double chopper is removed and the other two discs are blocked in open position.



#### Time of Flight

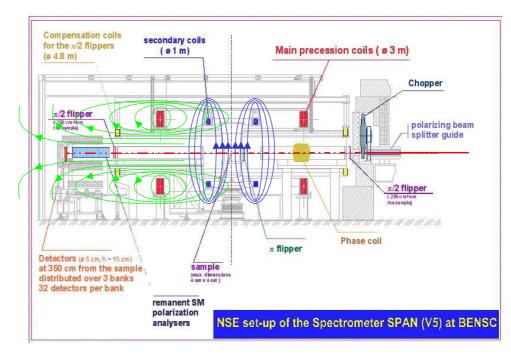
In the TOF configuration, after the velocity selector, the neutrons pass through 2 single and one double chopper. The discs have a diameter of 700 mm and rotate at a maximum speed of 10 000 rpm. The double chopper is located just before the sample and is made up of two counter rotating discs, which offers the possibility to choose between two different sets of windows. The resulting TOF resolution is typically 0.1 meV at 0.7 nm.

Waldemar Przybilla



# Übersicht Experiment V5

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung



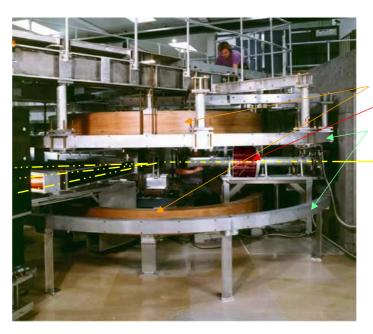
Waldemar Przybilla



# hm

# Übersicht Experiment V5

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- $\bullet \ Entwicklungsziel \\$
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung



The coils in an aluminum housing have  $\theta$  4.8 m and the brownish coils are the main precession coils with  $\theta$  3 m

The phase coil around the incoming beam and the flipper coils

Waldemar Przybilla



## Übersicht Experiment V5

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung
- An dem Experiment V5 werden jeweils vier Zählrohre in einem IV83 Verstärker/Diskriminator Modul zusammengefaßt.
- IV83 übernehmen das Puls-shaping und die Pegelwandlung auf TTL
- Je vier IV83-Module werden an einem Leitungstreiber DE118 (insgesamt also 16 Kanäle) zusammengefaßt und die Daten über ein 50-adriges Datenkabel als differentielle Stromsignale an das Empfängermodul CRL16 bzw. DE129 übertragen.
- Am Empfängermodul CRL16 werden die Level wieder in TTL konvertiert und die Signale über ein 34-poliges Flachbandkabel an die X11 Module der DAU weitergereicht. An den DE129 stehen außerdem Testbuchsen und LED's zur Kontrolle der Signale zur Verfügung.
- An V5 werden 96 Zählrohre betrieben.

Waldemar Przybilla

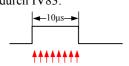




## Übersicht Experiment V5



Detektorsignal aufbereitet durch IV83:



Abtastfrequenz: CLK (min 125 ns = 8 MHz) Benutzt: 50 MHz

\* Alle Änderungen bzw. Erneuerungen sind in rot gehalten





#### **Probleme**

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung
- Die DE118 Module am V5 sind vor einigen Jahren im HMI gründlich überarbeitet worden (Masseverbindungen anders gelegt und verstärkt, ca. ein Dutzend Entkopplungs-C's eingelötet), da sie sehr störanfällig waren
- An den DE118 Module die noch im Urzustand sind, so wie sie aus Frankreich
  (ILL) geliefert wurden traten in letzter Zeit vermehrt Störungen der Art auf, das
  einzelne Kanäle für weniger als eine Sekunde mit extrem hoher Zählrate
  gefeuert haben und das Spektrum verfälschten.
- Da dieser Effekt nur sehr selten (alle paar Stunden) und nicht reproduzierbar auftritt, ist der Fehler nur sehr schwer zu analysieren
- Das **Experiment muß** nach Fertigstellung in die Neutronenleiterhalle II **umziehen** und sollte dort modernisiert wieder aufgebaut werden
- Eine Verlängerung der Übertragungsstrecke würde zusätzliche Störungen einbringen
- Die 50-poligen Steckverbindungen an den 25 CAMAC Modulen (analog zu DE129) ist sehr schlecht zu handhaben und zudem unzuverlässig.

Waldemar Przybilla



## Entwicklungsziel

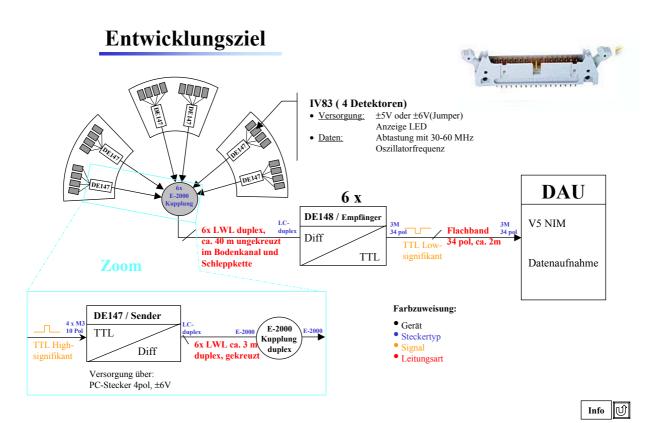
- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung
- elektromagnetische Störungen von Außen werden durch den Einsatz einer Glasfaser unterbunden.
- Handhabbarkeit des Verbindungskabels wird verbessert. Eine Glasfaser (serieller Datentransfer) ersetzt ein unflexibles, schweres 50-adriges Kupferkabel (paralleler Datentransfer)
- Kompatibilität mit der restlichen Elektronik (IV83 bzw. Modul X11 der DAU) ist durch den Ersatz der Strecke DE118- DE129 mit pinkompatiblen Eingängen am DE118 und Ausgängen am DE129 gewährleistet
- unterbrechungsfreihe Signale aus dem Empfänger im "High"-Level Zustand (Ausgang nicht durch Glitches unterbrochen, da dies von der DAU als neues Ereignis gewertet wird)

Waldemar Przybilla



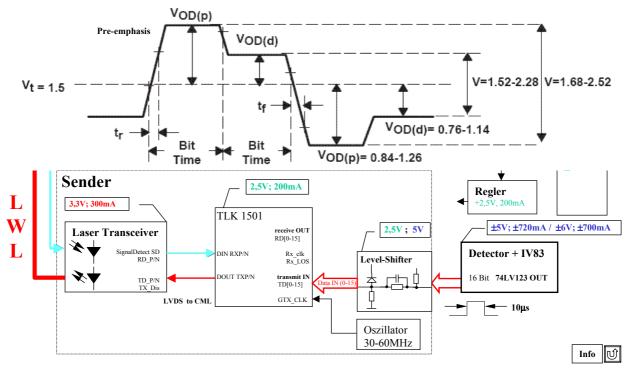
**DESY Hamburg** 







# LASER- Übertragung



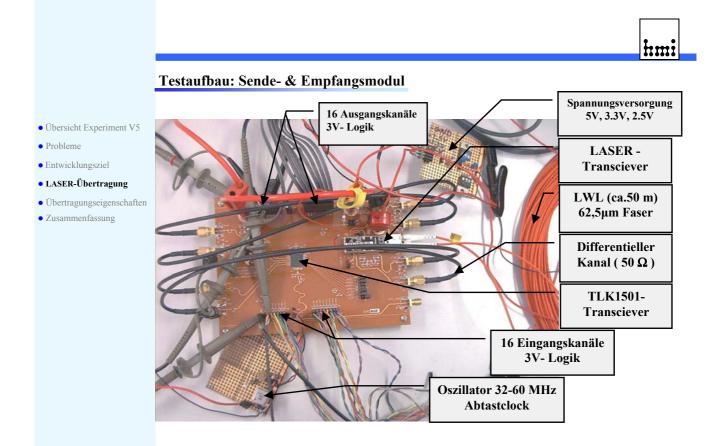


#### **Funkionsweise**

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragung
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung
- Die 16 Detektorsignale aus den Zählrohren werden über 4
   *IV83 Verstärker/Diskriminator* zusammengefasst und in TTL- Pegel
   (5 V Logik) gewandelt.
- Das Sendemodul DE147 (Ersatz für Leitungstreiber DE118) wandelt diese 5V-TTL in 3V –TTL, tastet diese 16 Kanäle mit mind. 8 MHz (hier 50 MHz) ab, codiert diese mit 8B/10B-Fehlerkorrekturcode auf ein 20bit Wort und sendet dieses mit der 20-fachen Geschwindigkeit seriell über einen diffenenziellen Kanal zum LASER.
  - \* Stellt zusätzlich die Spannungsversorgung der IV83 her
- Das *Empfängermodul DE148 (Ersatz für CRL16/DE116)* empfängt diese Signale per LWL, deseriallisiert und decodiert sie und sendet sie <u>negiert</u> und in 5V TTL-Logic auf die Ausgangsseite zur *DAU*
- \* Fehler bei der Decodierung sowie Leitungsbruch der Glasfaser werden mittels LED angezeigt
- \* Alle Kanäle haben eine LED zur Anzeige des ankommenden Signals

Waldemar Przybilla





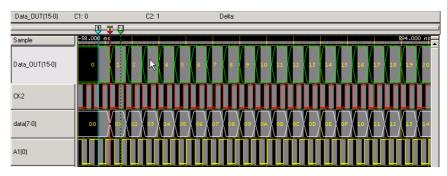
Waldemar Przybilla





## Übertragungseigenschaften

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragung
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung
- Nach anlegen eines "Counter- Patterns" an die 16 Eingangskanäle zeigt der 16 Bit-Ausgang der Übertragungsstrecke ebenfalls ein Hochzählen (hier im Dezimal-Format Dargestellt)
- Das rote Signal CK2 ist die aus der am Eingang angelegten Abtastfrequenz generierte Clock, die mittig zum Datensignal die pos. Flanke besitzt.



=> die generelle Funktion ist gegeben.

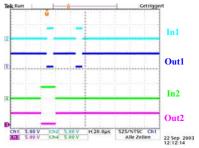
Waldemar Przybilla

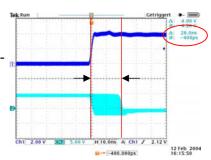


## Ein und Ausgangssignale



- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragung
- ÜbertragungseigenschaftenZusammenfassung
- Messung der Ein- und Ausgangssignale zweier Kanäle mit erwarteten Eingangsimpulsen der Pulsbreite 10µs:
- Die gegenseitige Verschiebung benachbarter Signale mittels Pulsgenerator hatte keinen negativen Einfluss auf die Ausgangssignale
- Der Jitter des Ausgangsimpulses, hier um 395 ns verschoben, beträgt  $\Delta t \approx 20$  ns bei einer Abtastfrequenz von  $f_t$ =50 MHz ( $\Delta t \approx 40$  ns bei  $f_t$ =32 MHz) Der Jitter hat eine rechteckige Verteilungsfunktion mit leicht ansteigenden Flanken (Labormessung mit statistischen unabhängigen Signalen an einem Zählrohr)
- Da die DAU nur 125 ns genau abtastet ist dieser Jitter ohne Bedeutung





Waldemar Przybilla





#### **Delay Messung und Berechnung**

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragung
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung

• Messung der Zeitdifferenz zwischen den Ein- und Ausgangssignalen ergibt im mittel ca. 396 ns

Diese Zeit entspricht ca. der Summe aus:

t1 = Wandel- und Codierzeit Sender

= 34..38 Bit times

 $\mathbf{t1}_{\text{max}} = 38 / (20*50 \text{ MHz})$ 

= 38 ns

= Decodierzeit = 76 .. 107 Bit times

 $\mathbf{t2_{max}} = 107 / (20*50 \text{ MHz})$ 

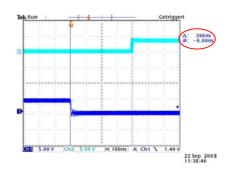
= 107 ns

= Laufzeit des Lichts im Medium Glas

 $= s / c_1 = 50 \text{ m} / 199,9*10^6$ 

= 250,17 ns

 $t_{ges} = t_{1_{max}} + t_{2_{max}} + t_3 = 395,17 \text{ ns}$ 



n.b.

- Brechzahl von Glas eines LWL entspricht ca. n1=1,5
- Brechzahl für das Vakuum (bzw. Luft)  $n_0 = 1$ .
- Für zwei verschiedene Stoffe mit den Brechzahlen n1 und n2 gilt:  $c_0 / c_1 = n_0 / n_1$
- $\bullet$  c<sub>1</sub> = c<sub>0</sub> /n<sub>1</sub> = 299.792.000 m/s / 1,5 = 199.861.333 m/s



eis: Die Vervielfachung

gnals innerhalb des

Waldemar Przybilla

#### Messung: CLK auf allen 16 Kanälen



Probleme

• Entwicklungsziel

• LASER-Übertragung

• Übertragungseigenschaften

Zusammenfassung

In dieser Messung wird die CLK  $(f_{CLK} = 2 -20 \text{ MHz})$  auf alle 16 Eingangskanäle gelegt. Hier sind zwei Kanäle jeweils Ein- und Ausgang dargestellt:

· Das Delay zwischen ein und Ausgangssignal sowie der Jitter am Ausgang sind hier unabhängig von Breite der Eingangsimpul und dessen Taktfrequenz.

mervalls bei den Periodendauern 50 - 200 ns ist begründet durch die Laufzeit von ca.350 ns und der Periodizität des Eingangssignals.  $t_{CLK} = 50 \text{ ns}$ in 1  $t_{CLK} = 10\overline{0} \text{ ns}$ out1 in2  $t_{CLK} = 200$ ns out2  $(f_T=60 \text{ MHz})$ 

Waldemar Przybilla

 $t_{CLK} = 500$ ns

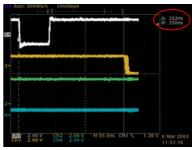


#### Messung: Walking zeros

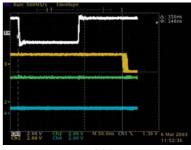
- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragung
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung

Das Verhalten der Schaltung wird zusätzlich bei unterschiedlichen Eingangsbitmuster untersucht:

- Bei einem Null-Impuls der zeitversetzt über alle Kanäle geht (walking-zero) ist das Delay und der Jitter unabhängig von Breite der Eingangsimpulse, und dessen Taktfrequenz ( hier t<sub>clk</sub>=100 ns und 200 ns )
- Auch andere Eingangsbitmuster wie "Johnson Counter", "Greycode Counter", und "Walking ones" auf den 16 Kanälen beeinflußten die Messung des Delays sowie des Jitters nicht.



 $t_{CLK} = 100 \text{ ns}$ 



 $t_{CLK} = 200 \text{ ns}$ 

t<sub>CLK</sub>— Z



Waldemar Przybilla

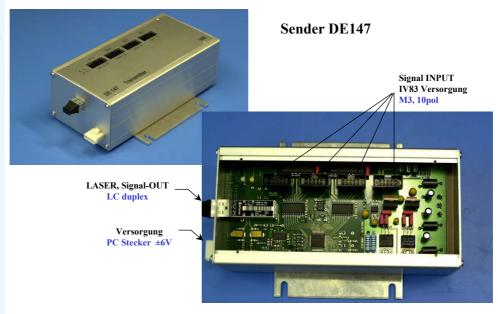
## Zusammenfassung

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- Übertragungseigenschaften
- Zusammenfassung
- Die Wandelzeit von insgesamt 110- 145 Bit Times im Datenblatt ist Bauteilspezifisch und unabhängig vom Codierungsaufwand bei unterschiedlichen Eingangsbitmustern
- Die **8B/10B Codierung** im Baustein TLK1501 **gewährleistet eine ausreichend sichere Übertragung** (BER=10<sup>-10</sup>) ohne Glitches im Signal
- Störung von Außen auf der Übertragungsstrecke durch elektrische oder magnetische Felder werden durch die Übertragung per LWL ausgeschlossen
- Handhabbarkeit der 6 Glasfaser (3cm Biegeradius) ist gegenüber den 96-poligen Kupferadern deutlich verbessert



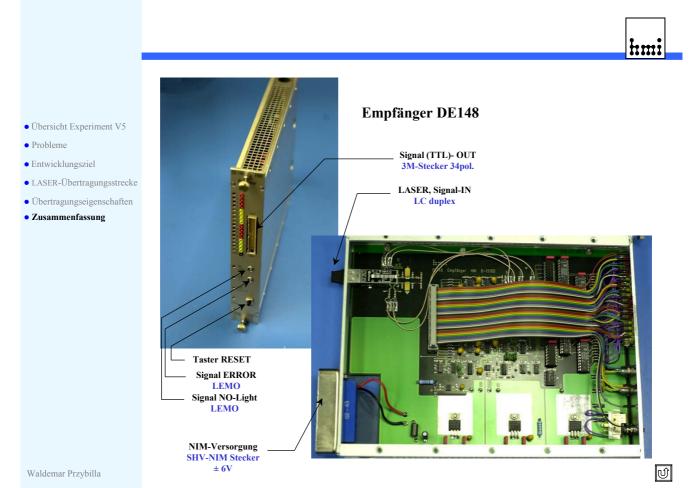
#### Ansicht von Sender und Empfänger

- Übersicht Experiment V5
- Probleme
- Entwicklungsziel
- LASER-Übertragungsstrecke
- $\bullet \ \, \ddot{\textbf{U}} bertragungseigenschaften$
- Zusammenfassung



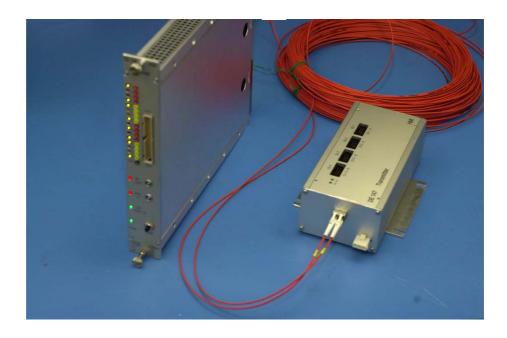
Waldemar Przybilla







# Fragen und Anregungen?



Waldemar Przybilla

